

RECORDING METHOD FOR OPTICAL INFORMATION AND DEVICE THEREFOR

Patent Number: JP7225947
Publication date: 1995-08-22
Inventor(s): ISHIDA TAKASHI; others: 02
Applicant(s):: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Requested Patent: JP7225947
Application Number: JP19940055876 19940325
Priority Number(s):
IPC Classification: G11B7/00
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To highly accurately recording marks having desired lengths at desired positions by changing drive starting times with the recording power of a light source according to the length of the recording mark of this time at the time of forming recording marks.

CONSTITUTION: A recording signal 104 is generated from a recording signal generator 103 in synchronism with the rise of a channel clock signal 102 from a clock generator 101 and outputted to an H level length measuring circuit 105. The circuit measures the length of the period of the H level of the signal 104 and outputs a recording signal 106 and a measurement result 107. The measurement result 107 is outputted at the rise of the measured H level of the signal 106 to a memory 109 of a delay circuit 108. Values corresponding to mark lengths to be recorded are stored in the memory 109 and a stored value corresponding to the measurement result is outputted to a variable delay unit 111. The unit 111 delays the signal 106 according to a memory output 110 and inputs an output signal 112 to an AND circuit 113 together with the signal 106 to drive a laser driving circuit 115.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-225947

(43) 公開日 平成7年(1995)8月22日

(51) Int.Cl.⁹

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

G 1 1 B 7/00

L 9464-5D

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 81 頁)

(21) 出願番号 特願平6-55876

(22) 出願日 平成6年(1994)3月25日

(31) 優先権主張番号 特願平5-318593

(32) 優先日 平5(1993)12月17日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 石田 隆

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 東海林 衛

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 大原 俊次

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

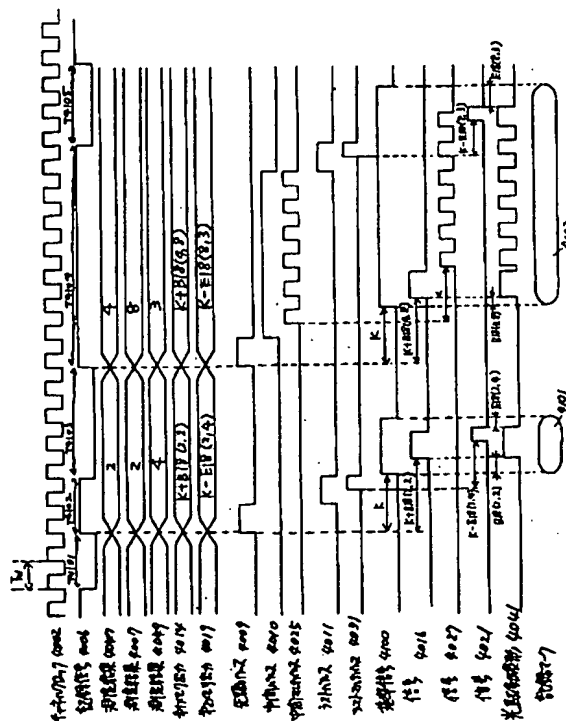
(74) 代理人 弁理士 岡田 和秀

(54) 【発明の名称】 光学情報の記録方法および記録装置

(57) 【要約】

【目的】 所望の長さの記録マークを精度良く形成するための光学情報の記録方法を提供することを目的とする。

【構成】 光駆動波形4041を、基準信号4100に対して駆動開始時刻がB18(2, 2)だけ遅延し、駆動終了時刻がE18(2, 4)だけ早く終了するように構成する。B18(2, 2)は、マーク始端部分での熱的状态が記録パターンによらず一定になるように、直前の無記録部分のあるべき長さT4101と記録マークのあるべき長さT4102の関数として決定される。E18(2, 4)は、マーク終端部分での熱的状态が記録パターンによらず一定になるように、記録マークのあるべき長さT4102と直後の無記録部分のあるべき長さT4103の関数として決定される。したがって、マークの始端終端とも所望の位置に形成できる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 2】 記録信号を発生する記録信号発生手段と、今回の記録マークの記録のための記録信号出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる遅延手段と、前記遅延手段で遅延させた記録信号の立ち上がりから、遅延前の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 3】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 4】 記録信号を発生する記録信号発生手段と、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間にはさまれた無信号期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録マークの記録のための記録信号出力期間を測定する第 2 の測定手段と、

前記第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる遅延手段と、

前記遅延手段で遅延させた記録信号の立ち上がりから、遅延前の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 5】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さおよびその無記録部分をはさむ状態である前回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 6】 記録信号を発生する記録信号発生手段と、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間にはさまれた無信号期間を測定する第 1 の測定手段と、

前記無信号期間の直前の前回の記録信号の出力期間を測定する第 2 の測定手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 3 の測定手段と、

前記第 1、第 2、第 3 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる遅延手段と、

前記遅延手段で遅延させた記録信号の立ち上がりから、遅延前の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 7】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 8】 記録信号を発生する記録信号発生手段と、今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる遅延手段と、遅延前の記録信号の立ち上がりから、前記遅延手段で遅延された記録信号の立ち下がりまで光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 9】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 10】 記録信号を発生する記録信号発生手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

今回の記録信号出力から次の記録信号出力までの無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、

前記第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる遅延手段と、

前記遅延手段での遅延前の記録信号の立ち上がりから前記遅延手段での遅延後の記録信号の立ち下がりまで光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 11】 レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、

光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 1 2】記録信号を発生する記録信号発生手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、

前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから、前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 1 3】レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動の終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 1 4】記録信号を発生する記録信号発生手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

今回の記録信号出力から次の記録信号出力までの間の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、

前記第 1、第 2 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、

前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから、前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 1 5】レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 1 6】記録信号を発生する記録信号発生手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、

前記第 1、第 2 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、

前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、

前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから、前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項 1 7】レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する方法であって、

今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更することを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項 1 8】記録信号を発生する記録信号発生手段と、

今回の記録マークを形成するための記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、

前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、

今回の記録信号出力から次の記録信号出力までの間の無信号期間を測定する第 3 の測定手段と、

前記第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回

の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第1の遅延手段と、

前記第1、第3の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録マークの記録のための記録信号を遅延させる第2の遅延手段と、

前記第1の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから、前記第2の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで、光源を記録パワーで駆動する駆動手段と、

を備えることを特徴とする光学情報の記録装置。

【請求項19】変調データの反転間隔 T に相当する記録マークを形成するための記録波形を、第1番目のパルスとそれにつづく $(T-T_{\min})/T_w$ 個(T_{\min} は最小反転間隔、 T_w は検出窓幅)の後続パルスからなる複数のパルス列で構成し、

前記変調データの立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔を x ($0 < x$)、前記変調データの立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔を $T_{\min}+y$ ($y < 0.5T_w$)とすると、最大反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように前記 x を設定し、また、最小反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように前記 y を設定する、

ことを特徴とする光学情報の記録方法。

【請求項20】変調データの立ち上がりと第 n 番目(n は整数、 $1 \leq n \leq (T-T_{\min})/T_w$)の後続パルスの立ち上がりとの間隔を $\{T_{\min}+nT_w-0.5T_w-z$ ($0 \leq z < 0.5T_w$)とし、

前記変調データの立ち上がりと第 n 番目(n は整数、 $1 \leq n \leq (T-T_{\min})/T_w$)の後続パルスの立ち下がりとの間隔を $\{T_{\min}+nT_w\}$ と、することを特徴とする請求項37記載の光学情報の記録方法。

【請求項21】周期が検出窓幅のクロックを発生するクロック発生器と、入力データを変調する変調器と、前記変調器の出力から最小反転間隔のパルスを出力するパルス発生回路と、前記パルス発生回路の出力パルスの立ち上がりエッジを遅延させたパルスを出力する第1の遅延回路と、前記第1の遅延回路の出力パルスの立ち下がりエッジを遅延させたパルスを出力する第2の遅延回路と、前記変調器の出力と前記パルス発生回路の出力と前記クロックとを用いて複数パルス列を出力するマルチパルス発生回路と、前記第2の遅延回路の出力と前記マルチパルス発生回路の出力との論理和を出力する論理和回路と、前記論理和回路の出力を用いて光学ヘッドのレーザを駆動するレーザ駆動回路と、そのレーザ駆動回路によって、記録可能な領域を有した光ディスクに信号の記録を行う光学ヘッドとを備えたことを特徴とする光学情報の記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、光学的に記録再生を行

うための光学情報の記録方法および記録装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

レーザ光線を利用して情報の記録をおこなう光ディスクはすでに実用化されているが、一層の高密度化が求められている。高密度化の手段として、記録マークのエッジに情報を持たせるPWM(パルス幅変調)記録が提案されている。

【0003】従来の記録方法を図57に示す。記録信号

(48a)に対して、おなじ駆動波形(48b)でレーザが駆動される。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の方法では、以下の問題点があった。

【0005】従来の方法では、光駆動波形(48b)の立ち上がり、立ち下がり、記録信号(48a)の立ち上がり、立ち下がりと一致しているが、記録光スポット5701は大きさがあるので、記録光スポットの照射される範囲(48c)の長さ W_{5701} は所望の時間 T_{5701} より長くなる。

【0006】従って、形成される記録マーク(48d)において、マーク始端部分は所望の位置より、 d_{5701} だけ長くなってしまい、マーク終端部分は所望の位置より d_{5702} だけ長くなってしまう。

【0007】また、長さの異なる記録信号 T_{5702} を記録するときにも、同様にマーク始端部分で d_{5703} 、マーク終端部分で d_{5704} だけ長くなるが、マーク始端についてはマーク長さによりマーク始端部分での熱履歴、特に昇温後の冷却条件が異なるので、 $d_{5703} \neq d_{5701}$ となり、マーク終端についてはマーク長さにより熱蓄積が異なるので、 $d_{5704} \neq d_{5702}$ となる。

【0008】さらに、 T_{5701} と同じ長さの記録信号 T_{5703} でも、前のマークとの間隔が異なる($B_{5703} \neq B_{5701}$)と、前回の記録パワーが今回のマーク始端部分へ及ぼす熱の影響が異なるので、マーク始端の伸びは異なり($d_{5705} \neq d_{5701}$)、さらに、次のマークとの間隔が異なる($A_{5703} \neq A_{5701}$)と、マーク終端部での熱履歴が異なるので、マーク終端の伸びが異なる。($d_{5706} \neq d_{5702}$)

このように、従来の方法では、所望の長さとは異なる記録マークが形成され、さらに、その差異の量は、マークの長さ、前後のマークとの間隔によって異なるという問題点を有していた。

【0009】本発明は上記問題点に鑑み、所望の長さの記録マークを所望の位置に、精度よく形成するための光学情報の記録方法および記録装置を提供するものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を

解決するために、レーザ等の光源からの光照射によって、記録媒体上に多数の記録マークを形成することにより、光学情報を記録する場合に、次のように構成する。

【0011】第1の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更する。

【0012】この第1の発明の実現手段として、今回の記録信号出力期間を測定する第1の測定手段と、この第1の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延された記録信号の立ち上がりから遅延前の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0013】第2の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークの記録すべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうち少なくとも最初の駆動開始時刻を変更する。

【0014】この第2の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、今回の記録信号出力期間を測定する第1の測定手段と、この第1の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段を設ける。

【0015】第3の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更する。

【0016】この第3の発明の実現手段として、光学情報の記録のための前回の一つの記録信号出力から今回の記録信号出力までの間に挟まれた無信号期間を測定する第1の測定手段と、今回の記録信号出力期間を測定する第2の測定手段と、この第1、第2の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延後の記録信号の立ち上がりから遅延前の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0017】第4の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうち少なくとも最初の駆動開始時刻を変更する。

【0018】この第4の発明の実現手段として、光学情

報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、前回の一つの記録信号出力から今回の記録信号出力までの間に挟まれた無信号期間を測定する第1の測定手段と、今回の記録信号出力期間を測定する第2の測定手段と、この第1、第2の測定手段の両測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0019】第5の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、その記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよびその無記録部分をはさむ状態で位置する前回形成の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更する。

【0020】この第5の発明の実現手段として、光学情報の記録のための前回の一つの記録信号出力から今回の記録信号出力までの間に挟まれた無信号期間を測定する第1の測定手段と、無信号期間の直前の前回の記録信号の出力期間を測定する第2の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第3の測定手段と、この第1、第2、第3の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延後の記録信号の立ち上がりから遅延前の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0021】第6の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよびその無記録部分をはさむ状態で位置する前回形成の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうち少なくとも最初の駆動開始時刻を変更する。

【0022】この第6の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、前回の一つの記録信号出力から今回の記録信号出力までの間に挟まれた無信号期間を測定する第1の測定手段と、無信号期間の直前の前回の記録信号出力期間を測定する第2の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第3の測定手段と、この第1、第2、第3の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設け

る。

【 0 0 2 3 】 第 7 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、その記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 2 4 】 この第 7 の発明の実現手段として、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、この第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる遅延手段と、遅延前の記録信号の立ち上がりから前記遅延手段で遅延後の記録信号の立ち下がりまで

前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 2 5 】 第 8 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 2 6 】 この第 8 の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、この第 1 の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 2 7 】 第 9 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 2 8 】 この第 9 の発明の実現手段として、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の直後の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、この第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる遅延手段と、遅延前の記録信号の立ち上がりから前記遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 2 9 】 第 1 0 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 3 0 】 この第 1 0 の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定

手段と、今回の記録信号の直後の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、この第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる遅延手段と、この遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 3 1 】 第 1 1 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 3 2 】 この第 1 1 の発明の実現手段として、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 3 3 】 第 1 2 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最初の駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 3 4 】 この第 1 2 の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、第 1 の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる第 1 の遅延手段と、第 1 の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる第 2 の遅延手段と、この第 1、第 2 の遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 3 5 】 第 1 3 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記

録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 3 6 】 この第 1 3 の発明の実現手段として、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の直後の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、前記第 1 の測定手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、前記第 1 と第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 3 7 】 第 1 4 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最初の駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 3 8 】 この第 1 4 の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の直後の無信号期間を測定する第 2 の測定手段と、第 1 の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる第 1 の遅延手段と、第 1、第 2 の両測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる第 2 の遅延手段と、この第 1、第 2 の遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 3 9 】 第 1 5 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 4 0 】 この第 1 5 の発明の実現手段として、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間には含まれた無信号期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 2 の測定手段と、前記第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、前記第 2 の測定

手段の測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから前記第 2 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 4 1 】 第 1 6 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最初の駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 4 2 】 この第 1 6 の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間には含まれた無信号期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 2 の測定手段と、この第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる第 1 の遅延手段と、第 2 の測定手段の測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる第 2 の遅延手段と、この第 1、第 2 の遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【 0 0 4 3 】 第 1 7 の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するための前記光源の記録パワーでの駆動終了時刻を変更する。

【 0 0 4 4 】 この第 1 7 の発明の実現手段として、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間には含まれた無信号期間を測定する第 1 の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第 2 の測定手段と、今回の記録信号出力から次の記録信号出力までの間には含まれた無信号期間を測定する第 3 の測定手段と、前記第 1、第 2 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 1 の遅延手段と、前記第 2、第 3 の測定手段の両測定結果に応じて、今回の記録信号を遅延させる第 2 の遅延手段と、前記第 1 の遅延手段による遅延後の記録信号の立ち上がりから前記第 2 の遅延手段に

よる遅延後の記録信号の立ち下がりまで前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0045】第18の発明では、今回の一つの記録マークの形成に際して、前記光源を時分割で複数回にわたって記録パワーで駆動する。また、その際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最初の駆動開始時刻を変更し、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録領域のあるべき長さに応じて、光源の複数回の駆動のうちの少なくとも最後の駆動終了時刻を変更する。

【0046】この第18の発明の実現手段として、光学情報の記録のための各々一つの記録信号を、複数のパルスからなるパルス列信号に変換するパルス列信号変換手段と、前回の記録信号出力から今回の記録信号出力までの間にはさまれた無信号期間を測定する第1の測定手段と、今回の記録信号の出力期間を測定する第2の測定手段と、今回の記録信号出力から次の記録信号出力までの間にはさまれた無信号期間を測定する第3の測定手段と、この第1、第2の測定手段の両測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最初のパルスを遅延させる第1の遅延手段と、第2、第3の測定手段の両測定結果に応じて、前記パルス列信号変換手段でえられたパルス列信号に含まれる各パルスのうちの少なくとも最後のパルスを遅延させる第2の遅延手段と、この第1、第2の遅延手段で遅延されたパルスを含むパルス列信号に基づいて、前記光源を記録パワーで駆動する駆動手段とを設ける。

【0047】第19の発明では、変調データの反転間隔Tに相当する記録マークを形成するための記録波形を、第1番目のパルスとそれにつづく $(T - T_{min}) / T_{w}$ 個 $(T_{min}$ は最小反転間隔、 T_w は検出窓幅)の後続パルスからなる複数のパルス列で構成し、前記変調データの立ち上がりとは前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔を x ($0 < x$)、前記変調データの立ち上がりとは前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔を $T_{min} + y$ ($y < 0.5 T_w$) とするとき、最大反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように前記 x を設定し、また、最小反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように前記 y を設定することを特徴とする。

【0048】この第19の発明の実現手段として、周期が検出窓幅のクロックを発生するクロック発生器と、入力データを変調する変調器と、前記変調器の出力から最小反転間隔のパルスを出力するパルス発生回路と、前記パルス発生回路の出力パルスの立ち上がりエッジを遅延させたパルスを出力する第1の遅延回路と、前記第1の遅延回路の出力パルスの立ち下がりエッジを遅延させたパルスを出力する第2の遅延回路と、前記変調器の出力

と前記パルス発生回路の出力と前記クロックとを用いて複数パルス列を出力するマルチパルス発生回路と、前記第2の遅延回路の出力と前記マルチパルス発生回路の出力との論理和を出力する論理和回路と、前記論理和回路の出力を用いて光学ヘッドのレーザを駆動するレーザ駆動回路と、そのレーザ駆動回路によって、記録可能な領域を有した光ディスクに信号の記録を行う光学ヘッドとを備える。

【0049】

【作用】第1発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、記録マークの長さによるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正できるので、記録マークの始端部分を正しい位置に形成することが可能になる。

【0050】第2発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、記録マークの長さによるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正できるので、記録マークの始端部分を正しい位置に形成することが可能になる。

【0051】第3発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、前回の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【0052】第4発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、前回の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【0053】第5発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび前回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の

記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、前回の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 4 】第 6 発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび前回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、前回の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 5 】第 7 発明では、今回の記録マークを形成する際に、この記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 6 】第 8 発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異が補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 7 】第 9 発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異と、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 8 】第 1 0 発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さによ

じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異と、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 5 9 】第 1 1 発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 6 0 】第 1 2 発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異が補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異が補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 6 1 】第 1 3 発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【 0 0 6 2 】第 1 4 発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、前回の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回

の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0063】第15発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0064】第16発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0065】第17発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領

域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次のマークとの間隔によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0066】第18発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次のマークとの間隔によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0067】第19発明では、第1番目のパルスの立ち上がりエッジを遅延させることで最大反転間隔に相当する記録マークを所望の長さに形成でき、第1番目のパルスの立ち下がりエッジを遅延させることで最小反転間隔に相当する記録マークを所望の長さに形成できる。

【0068】

【実施例】

(実施例1) 図2の光駆動波形116は、本発明の実施例1における光駆動波形である。

【0069】光駆動波形116は、記録信号106に対して、駆動開始時刻が遅延している。

【0070】その遅延量は、(1、7)変調を例にとれば、表1に示すように、記録マークのあるべき長さに対応して決められる。

【0071】

【表1】

10

20

30

40

記録マークの あるべき長さ (× Tw)	駆動開始時刻遅延量	メモリ 109 の格納値
2	d 1 (2)	d 1 (2)
3	d 1 (3)	d 1 (3)
4	d 1 (4)	d 1 (4)
5	d 1 (5)	d 1 (5)
6	d 1 (6)	d 1 (6)
7	d 1 (7)	d 1 (7)
8	d 1 (8)	d 1 (8)

【0072】たとえば、記録マーク201のあるべき長さは $T201 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、 $d1(2)$ だけ遅延し、記録マーク202のあるべき長さは $T202 = 8Tw$ であるので、 $d1(8)$ だけ遅延する。

【0073】記録マーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場合には、短いマークほど始端の伸びが大きい。従って $d1(2) > d2(3) > \dots > d1(8)$ の関係がある。

【0074】その結果、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異が補正でき、記録マーク201、202の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0075】なお、ここでは光駆動波形116は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0076】図1は、本発明の実施例1の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0077】図1において101はクロック発生回路、102はチャネルクロック信号、103は記録信号発生回路、104は記録信号発生回路103から出力される記録信号、105はHレベル期間長測定回路、106はHレベル期間長測定回路105を通過後の記録信号、107はHレベル期間測定結果出力、108は遅延回路で、メモリ109と可変遅延器111で構成される。112は遅延回路出力、113はアンド回路、114はその出力、115はレーザ駆動回路、116は光駆動波形である。

【0078】上記構成の動作について、図2のタイミングチャートを参照して説明する。

【0079】クロック発生回路101は、周期が検出窓幅 Tw のチャネルクロック102を出力する。 $duty$ (デューティ) は可変である。

【0080】クロック発生回路101からのチャネルクロック信号102の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路103から出力された記録信号104は、Hレベル期間長測定回路105に入力される。Hレベル期間長

測定回路105は記録信号104のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号106と、測定結果107を出力する。測定結果107は、記録信号106の測定したHレベルの立ち上がりで出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間 $T201$ の長さは2であり、測定結果107は $T201$ の立ち上がりで2になる。Hレベル期間 $T202$ の長さは8であり、測定結果107は $T202$ の立ち上がりで8になる。

【0081】そして、測定結果107は、遅延回路108に入力する。

【0082】遅延回路108内で、測定結果107はメモリ109に入力され、メモリ109からメモリ出力110が出力される。ここでメモリ109には、表1のように、記録すべきマーク長に対応して値が格納されており、測定結果107に対応した格納値が出力される。

【0083】可変遅延器111はメモリ出力110に従って、記録信号106を遅延して信号112を出力する。

【0084】記録信号106と信号112はAND回路113に入力し、信号114として出力する。

【0085】この出力信号114は、レーザ駆動回路115に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形116となり、記録マーク201、202が形成される。

【0086】このように、実施例1においては、記録マーク201あるいは202を形成するに際して、記録マークの記録すべき長さに応じて、光源の記録パワーでの駆動開始時刻を遅らせるので、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正することができ、記録マークの始端部分を正しい位置に形成することができる。

【0087】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0088】(実施例2) 図4の光駆動波形323は、本発明の実施例2における光駆動波形である。

【0089】光駆動波形323は、先頭パルスとマルチ

パルスの複数のパルスからなる。さらに、光駆動波形 3 2 3 の先頭パルスの開始時刻は、記録信号 3 0 6 に対して、遅延している。

【0090】その遅延量は、(1、7)変調を例にとれ

記録マークの あるべき長さ (×Tw)	駆動開始時刻遅延量	メモリ 3 0 9 の格納値
2	d 2 (2)	d 2 (2)
3	d 2 (3)	d 2 (3)
4	d 2 (4)	d 2 (4)
5	d 2 (5)	d 2 (5)
6	d 2 (6)	d 2 (6)
7	d 2 (7)	d 2 (7)
8	d 2 (8)	d 2 (8)

【0092】たとえば、記録マーク 4 0 1 のあるべき長さは $T 4 0 1 = 2 Tw$ (Tw は検出窓幅) なので、d 2 (2) だけ遅延し、記録マーク 4 0 2 のあるべき長さは $T 4 0 2 = 8 Tw$ なので、d 2 (8) だけ遅延する。

【0093】記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場合には、短いマークほど始端の伸びが大きいの。従って $d 2 (2) > d 2 (3) > \dots > d 2 (8)$ の関係がある。

【0094】その結果、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異が補正でき、記録マーク 4 0 1、4 0 2 の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0095】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワー再生パワーの間、記録パワーと 0 の間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0096】図 3 は、本発明の実施例 2 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0097】図 3 において 3 0 1 はクロック発生回路、3 0 2 はチャネルクロック信号、3 0 3 は記録信号発生回路、3 0 4 は記録信号発生回路 3 0 3 から出力される記録信号、3 0 5 は H レベル期間長測定回路、3 0 6 は H レベル期間長測定回路 3 0 5 を通過後の記録信号、3 0 7 は H レベル期間長測定結果出力、3 0 8 は遅延回路、3 0 9 はメモリ、3 1 0 はメモリ出力、3 1 1 は可変遅延器、3 1 2 はパルス分割回路、3 1 3 は先頭パルス信号、3 1 4 は後半パルス信号、3 1 5 はマルチパルス生成回路で、本例では、反転回路 3 1 6 とアンド回路 3 1 7 から構成される。3 1 8 はマルチパルス信号、3 1 9 は遅延回路 3 0 8 の出力、3 2 0 はオア回路、3 2 1 はその出力信号、3 2 2 はレーザ駆動回路、3 2 3 は光駆動波形である。

【0098】上記構成の動作について、図 4 のタイミン

ば、表 2 に示すように、記録マークのあるべき長さに対応して決められる。

【0091】

【表 2】

グチャートを参照して説明する。

【0099】クロック発生回路 3 0 1 は、周期が検出窓幅 Tw のクロック 3 0 2 を出力する。duty は可変である。

【0100】クロック発生回路 3 0 1 からのチャネルクロック信号 3 0 2 の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路 3 0 3 から出力された記録信号 3 0 4 は、H レベル期間長測定回路 3 0 5 に入力される。H レベル期間長測定回路 3 0 5 は記録信号 3 0 4 の H レベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号 3 0 6 と、測定結果 3 0 7 を出力する。測定結果 3 0 7 は、記録信号 3 0 6 の測定した H レベルの立ち上がりで出力される。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 $T 4 0 1$ の長さは 2 であり、測定結果 3 0 7 は $T 4 0 1$ の立ち上がりで 2 になる。H レベル期間 $T 4 0 2$ の長さは 8 であり、測定結果 3 0 7 は $T 4 0 2$ の立ち上がりで 8 になる。

【0101】そして、測定結果 3 0 7 は、遅延回路 3 0 8 に入力する。

【0102】遅延回路 3 0 8 内で、測定結果 3 0 7 はメモリ 3 0 9 に入力され、メモリ 3 0 9 からメモリ出力 3 1 0 が出力される。ここでメモリ 3 0 9 には、表 2 のように、記録マークのあるべき長さに対応して値が格納されており、測定結果 3 0 7 に対応した格納値が出力される。

【0103】メモリ出力 3 1 0 は可変遅延器 3 1 1 に入力される。

【0104】一方、H レベル期間長測定回路 3 0 5 から出力された記録信号 3 0 6 は、パルス分割回路 3 1 2 に入力され、先頭パルス信号 3 1 3 と、後半パルス信号 3 1 4 とに分割される。

【0105】先頭パルス 3 1 3 は記録信号 3 0 6 の立ち上がりで立ち上がり、 Tw 後に立ち下がる信号である。

【0106】後半パルス 3 1 4 は記録信号 3 0 6 の立ち

上がりからTw後に立ち上がり、記録信号306の立ち下がりて立ち下がる信号である。

【0107】先頭パルス信号313は遅延器311に入力され、遅延されて信号319として出力される。

【0108】後半パルス信号314は、マルチパルス生成回路315に入力され、マルチパルス318として出力される。

【0109】信号319とマルチパルス318はオア回路320で加算され、信号321として出力される。

【0110】信号321はレーザ駆動回路322に入力され、光駆動波形323となり、記録マーク401、402が形成される。

【0111】このように、実施例2においては、記録マーク401、402を形成するに際して、光源を複数回にわたってパルス発光するとともに、記録マークのあるべき長さに応じて、複数回のパルス発光のうちの最初の

パルス発光の時刻を遅らせるので、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、記録マークの始端部分を正しい位置に形成できる。また、パルス状に発光するので、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0112】（実施例3）図6の光駆動波形518は、本発明の実施例3における光駆動波形である。

【0113】光駆動波形518は、記録信号508に対して、駆動開始時刻が遅延している。

【0114】その遅延量は、(1, 7)変調を例にとれば、表3に示すように、今回の記録マークのあるべき長さとその直前の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0115】

【表3】

直前の無記録部分の あるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マークの あるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻 遅延量	メモリ511の 格納値
2	2	d3 (2, 2)	d3 (2, 2)
2	3	d3 (2, 3)	d3 (2, 3)
2	4	d3 (2, 4)	d3 (2, 4)
2	5	d3 (2, 5)	d3 (2, 5)
2	6	d3 (2, 6)	d3 (2, 6)
2	7	d3 (2, 7)	d3 (2, 7)
2	8	d3 (2, 8)	d3 (2, 8)
3	2	d3 (3, 2)	d3 (3, 2)
3	3	d3 (3, 3)	d3 (3, 3)
.	.	.	.
N	M	d3 (N, M)	d3 (N, M)
.	.	.	.
8	5	d3 (8, 5)	d3 (8, 5)
8	6	d3 (8, 6)	d3 (8, 6)
8	7	d3 (8, 7)	d3 (8, 7)
8	8	d3 (8, 8)	d3 (8, 8)

(N, Mは2から8の整数)

【0116】たとえば、マーク601のあるべき長さは $T602 = 5Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直前の無記録期間は $T601 = 2Tw$ であるので、光駆動波形はd3 (2, 5)だけ遅延し、マーク602のあるべき長さは $T604 = 8Tw$ であり直前の無記録期間は $T603 = 6Tw$ であるので、光駆動波形はd3 (6, 8)だけ遅延する。

【0117】記録すべきマーク長がおなじならば、直前の無記録部分のあるべき長さが小さいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、始端の伸びが大きくなる。従って、 $d3 (2, N) > d3 (3, N) > \dots > d3 (8, N)$ (Nは2から8の整数)の関係がある。

【0118】また、直前の無記録部分のあるべき長さが同じならば、今回の記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場

合には、短いマークほど始端の伸びが大きい。従って $d3 (N, 2) > d3 (N, 3) > \dots > d3 (N, 8)$ (Nは2から8の整数)の関係がある。

【0119】その結果、ひとつ前の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク601、602の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0120】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0121】図5は、本発明の実施例3の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0122】図5において501はクロック発生回路、502はチャネルクロック信号、503は記録信号発生

回路、504は記録信号発生回路503から出力される記録信号、505はLレベル期間長測定回路、506はその測定結果出力、507はHレベル期間長測定回路、508はHレベル期間長測定回路507を通過後の記録信号、509はHレベル期間長測定結果出力、510は遅延回路、511はメモリ、512はメモリ出力、513は可変遅延器、514は遅延器出力、515はアンド回路、516はその出力、517はレーザ駆動回路、518は光駆動波形である。

【0123】上記構成の動作について、図6のタイミング10
グチャートを参照して説明する。

【0124】クロック発生回路501は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック502を出力する。dutyは可変である。

【0125】クロック発生回路501からのチャンネルクロック信号502の立ち上がりで同期して、記録信号発生回路503から出力された記録信号504は、Lレベル期間長測定回路505と、Hレベル期間長測定回路507に入力する。

【0126】Lレベル期間長測定回路505は記録信号20
504のLレベル期間長を測定し、測定したLレベルの次のHレベルの立ち上がりで測定結果506を出力する。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T601の長さは2であり、T602の立ち上がりで測定結果506は2になり、Lレベル期間T603の長さは6であり、T604の立ち上がりで測定結果506は6になる。

【0127】Hレベル期間長測定回路507は記録信号30
504のHレベル期間長を測定し、測定した当該Hレベルの立ち上がりで測定結果509を出力する。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T602の長さは5であり、T602の立ち上がりで測定結果509は5になり、Hレベル期間T604の長さは8であり、T604の立ち上がりで測定結果509は8になる。

【0128】そして測定結果506、509は遅延回路510に入力される。

【0129】遅延回路510内で、測定結果506、5

09はメモリ511に入力され、メモリ511からメモリ出力512が出力される。ここでメモリ511には表3のように、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果506に対応）と今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果509に対応）の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0130】可変遅延器513はメモリ出力512に従って、記録信号508を遅延して信号514を出力する。

【0131】記録信号508と信号514はAND回路515に入力し、信号516として出力する。

【0132】この出力信号516は、レーザ駆動回路517に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形518となり、記録マーク601、602が形成される。

【0133】このように、実施例3においては、記録マーク601あるいは602を形成するに際して、直前にあるべき無記録部分の長短と今回の記録マークの記録すべき長さとはに応じて、光源の記録パワーでの駆動開始時刻を遅らせる。その結果、ひとつ前の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク601、602の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0134】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0135】（実施例4）図8の光駆動波形725は、本発明の実施例4における光駆動波形である。

【0136】光駆動波形725は、先頭パルスとマルチパルスからなる。さらに、駆動開始時刻は記録信号708から遅延している。その遅延量は、（1、7）変調を例にとれば、表4に示すように、今回の記録マークのあるべき長さとその直前の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0137】

【表4】

直前の無記録部分 あるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マークの あるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻 遅延値	メモリ 711 の 格納値
2	2	d 4 (2, 2)	d 4 (2, 2)
2	3	d 4 (2, 3)	d 4 (2, 3)
2	4	d 4 (2, 4)	d 4 (2, 4)
2	5	d 4 (2, 5)	d 4 (2, 5)
2	6	d 4 (2, 6)	d 4 (2, 6)
2	7	d 4 (2, 7)	d 4 (2, 7)
2	8	d 4 (2, 8)	d 4 (2, 8)
3	2	d 4 (3, 2)	d 4 (3, 2)
3	3	d 4 (3, 3)	d 4 (3, 3)
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	d 4 (N, M)	d 4 (N, M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	5	d 4 (8, 5)	d 4 (8, 5)
8	6	d 4 (8, 6)	d 4 (8, 6)
8	7	d 4 (8, 7)	d 4 (8, 7)
8	8	d 4 (8, 8)	d 4 (8, 8)

(N、Mは2から8の整数)

【0138】たとえば、マーク801のあるべき長さは $T802 = 5Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直前の無記録期間は $T801 = 2Tw$ であるので、光駆動波形は d 4 (2, 5) だけ遅延し、マーク802のあるべき長さは $T804 = 8Tw$ であり直前の無記録期間は $T803 = 6Tw$ であるので、光駆動波形は d 4 (6, 8) だけ遅延する。

【0139】記録すべきマーク長がおなじならば、直前の無記録部分のあるべき長さが小さいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、始端の伸びが大きくなる。従って、 $d 4 (2, N) > d 4 (3, N) > \dots > d 4 (8, N)$ (Nは2から8の整数)となる傾向がある。

【0140】また、直前の無記録部分のあるべき長さが同じならば、今回の記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場合には、短いマークほど始端の伸びが大きい。従って $d 4 (N, 2) > d 4 (N, 3) > \dots > d 4 (N, 8)$ となる傾向がある。

【0141】その結果、ひとつ前の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク801、802の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0142】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0143】図7は、本発明の実施例4の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0144】図7において701はクロック発生回路、

702はチャネルクロック信号、703は記録信号発生回路、704は記録信号発生回路703から出力される記録信号、705はLレベル期間長測定回路、706はその測定結果出力、707はHレベル期間長測定回路、708はHレベル期間長測定回路707を通過後の記録信号、709はHレベル期間長測定結果出力、710は遅延回路ブロック、711はメモリ、712はメモリ出力、713は可変遅延器、714はパルス分割回路、715は先頭パルス信号、716は後半パルス信号、717はマルチパルス生成回路で、反転回路718とアンド回路719で構成される。

【0145】720はマルチパルス、721は遅延器出力、722はオア回路、723はその出力、724はレーザ駆動回路、725は光駆動波形である。

【0146】上記構成の動作について、図8のタイミングチャートを参照して説明する。

【0147】クロック発生回路701は、周期が検出窓幅 Tw のチャネルクロック702を出力する。dutyは可変である。

【0148】クロック発生回路701からのチャネルクロック信号702の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路703から出力された記録信号704は、Lレベル期間長測定回路705と、Hレベル期間長測定回路707に投入する。

【0149】Hレベル期間長測定回路707は、あらためて記録信号708を出力する。

【0150】Lレベル期間長測定回路705は記録信号704のLレベル期間長を測定し、測定したLレベルの次のHレベルの立ち上がりで測定結果706を出力する。すなわち、Lレベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間 $T801$ の長さは2であり、 $T802$ の立ち上がりで測定結果706は2になり、Lレベル期間 $T803$ の長さは6であ

り、T 8 0 4 の立ち上がりで測定結果 7 0 6 は 6 になる。

【0151】Hレベル期間長測定回路 7 0 7 は記録信号 7 0 4 のHレベル期間長を測定し、測定した当該Hレベルの立ち上がりで測定結果 7 0 9 を出力する。すなわち、Hレベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間 T 8 0 2 の長さは 5 であり、T 8 0 2 の立ち上がりで測定結果 7 0 9 は 5 になり、Hレベル期間 T 8 0 4 の長さは 8 であり、T 8 0 4 の立ち上がりで測定結果 7 0 9 は 8 になる。

【0152】そして測定結果 7 0 6、7 0 9 が遅延回路 7 1 0 に入力される。

【0153】遅延回路 7 1 0 内で、測定結果 7 0 6、7 0 9 はメモリ 7 1 1 に入力され、メモリ 7 1 1 からメモリ出力 7 1 2 が出力される。ここでメモリ 7 1 1 には表 4 のように、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 7 0 6 に対応）と今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 7 0 9 に対応）の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0154】一方、記録信号 7 0 8 は、パルス分割回路 7 1 4 に入力し、パルス幅が T_w の先頭パルス 7 1 5 と、後半パルス 7 1 6 に分割される。

【0155】先頭パルス 7 1 5 は、可変遅延器 7 1 3 によりメモリ出力 7 1 2 に従って遅延され、信号 7 2 1 となる。

【0156】後半パルス信号 7 1 6 は、マルチパルス生成回路 7 1 7 に入力し、マルチパルス 7 2 0 となる。

【0157】信号 7 2 1 とマルチパルス 7 2 0 はOR回路 7 2 2 に入力し、信号 7 2 3 として出力する。

【0158】この出力信号 7 2 3 は、レーザ駆動回路 7 3 0

2 4 に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形 7 2 5 となり、記録マーク 8 0 1、8 0 2 が形成される。

【0159】このように、実施例 4 においては、記録マーク 8 0 1 あるいは 8 0 2 を形成するに際して、先頭パルスとマルチパルスからなる複数のパルス状に記録パワーを駆動し、直前にあるべき無記録部分の長短と今回の記録マークの記録すべき長さに応じて、先頭パルスの駆動開始時刻を遅らせる。その結果、ひとつ前の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク 8 0 1、8 0 2 の始端部分は、正しい位置に形成される。また、パルス状に駆動することで、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もめる。

【0160】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0161】（実施例 5）図 1 0 の光駆動波形 9 2 0 は、本発明の実施例 5 における光駆動波形である。

【0162】光駆動波形 9 2 0 は、記録信号 9 1 0 に対して、駆動開始時刻が遅延している。

【0163】その遅延量は、（1、7）変調を例にとれば、表 5 に示すように、前回の記録マークのあるべき長さと、今回のマークの直前の無記録部分のあるべき長さと、今回の記録マークのあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0164】

【表 5】

前回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T_w$)	直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times T_w$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T_w$)	駆動開始時刻 遅延量	メモリ 9 1 3 の 格納値
2	2	2	d5 (2, 2, 2)	d5 (2, 2, 2)
2	2	3	d5 (2, 2, 3)	d5 (2, 2, 3)
2	2	4	d5 (2, 2, 4)	d5 (2, 2, 4)
2	2	5	d5 (2, 2, 5)	d5 (2, 2, 5)
2	2	6	d5 (2, 2, 6)	d5 (2, 2, 6)
2	2	7	d5 (2, 2, 7)	d5 (2, 2, 7)
2	2	8	d5 (2, 2, 8)	d5 (2, 2, 8)
2	3	2	d5 (2, 3, 2)	d5 (2, 3, 2)
2	3	3	d5 (2, 3, 3)	d5 (2, 3, 3)
.
.
.
N	M	L	d5 (N, M, L)	d5 (N, M, L)
.
.
8	8	4	d5 (8, 8, 4)	d5 (8, 8, 4)
8	8	5	d5 (8, 8, 5)	d5 (8, 8, 5)
8	8	6	d5 (8, 8, 6)	d5 (8, 8, 6)
8	8	7	d5 (8, 8, 7)	d5 (8, 8, 7)
8	8	8	d5 (8, 8, 8)	d5 (8, 8, 8)

(N, M, L は 2 から 8 の整数)

【0165】たとえば、マーク 1 0 0 1 のあるべき長さは T 1 0 0 3 = 5 T_w (T_w は検出窓幅) であり、直前

の無記録期間は T 1 0 0 2 = 2 T_w であり、前回の記録マークは T 1 0 0 1 = 3 T_w であるので、光駆動波形は

d 5 (3 , 2 , 5) だけ遅延し、マーク 1 0 0 2 のあるべき長さは $T 1 0 0 5 = 8 T w$ であり直前の無記録期間は $T 1 0 0 4 = 6 T w$ であり、前回の記録マークは $T 1 0 0 3 = 5 T w$ であるので、光駆動波形は d 5 (5 , 6 , 8) だけ遅延する。

【 0 1 6 6 】記録すべきマーク長がおなじで、直前の無記録部分の長さがおなじならば、前回の記録マークが大きいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、始端の伸びが大きくなる。従って、 $d 5 (8 , N , M) > d 5 (7 , N , M) > \dots > d 5 (2 , N , M)$ (N , M は 2 から 8 の整数) となる。

【 0 1 6 7 】また、記録すべきマーク長がおなじで、前回の記録マーク長が同じならば、直前の無記録部分の長さが小さいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、今回のマーク始端の伸びは大きくなる。従って、 $d 5 (N , 2 , M) > d 5 (N , 3 , M) > \dots > d 5 (N , 8 , M)$ (N , M は 2 から 8 の整数) となる。

【 0 1 6 8 】また、前回の記録マーク長がおなじで、直前の無記録部分の長さが同じならば、今回の記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場合には、短いマークほど始端の伸びが大きい。従って $d 5 (N , M , 2) > d 5 (N , M , 3) > \dots > d 5 (N , M , 8)$ 、 (N , M は 2 から 8 の整数) となる。

【 0 1 6 9 】その結果、前回の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、前回の記録マーク長さによる差異と直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク 1 0 0 1 、 1 0 0 2 の始端部分は、正しい位置に形成される。

【 0 1 7 0 】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【 0 1 7 1 】図 9 は、本発明の実施例 5 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【 0 1 7 2 】図 9 において 9 0 1 はクロック発生回路、9 0 2 はチャネルクロック信号、9 0 3 は記録信号発生回路、9 0 4 は記録信号発生回路 9 0 3 から出力される記録信号、9 0 5 は H レベル期間長測定回路 1 、9 0 6 はその測定結果出力、9 0 7 は L レベル期間長測定回路、9 0 8 はその測定結果出力、9 0 9 は H レベル期間長測定回路 2 、9 1 0 は H レベル期間長測定回路 2 を通過後の記録信号、9 1 1 は H レベル期間長測定回路 2 の測定結果出力、9 1 2 は遅延回路、9 1 3 はメモリ、9 1 4 はメモリ出力、9 1 5 は可変遅延器、9 1 6 はその

出力、9 1 7 はアンド回路、9 1 8 はその出力、9 1 9 はレーザ駆動回路、9 2 0 は光駆動波形である。

【 0 1 7 3 】上記構成の動作について、図 1 0 のタイミングチャートを参照して説明する。

【 0 1 7 4 】クロック発生回路 9 0 1 は、周期が検出窓幅 $T w$ のチャネルクロック 9 0 2 を出力する。d u t y は可変である。

【 0 1 7 5 】クロック発生回路 9 0 1 からチャネルクロック信号 9 0 2 の立ち上がりで同期して、記録信号発生回路 9 0 3 から出力された記録信号 9 0 4 は、H レベル期間長測定回路 1 (9 0 5) と、L レベル期間長測定回路 9 0 7 と、H レベル期間長測定回路 2 (9 0 9) に入力する。

【 0 1 7 6 】H レベル期間長測定回路 1 (9 0 5) は、記録信号 9 0 4 の H レベル期間長を測定し、結果 9 0 6 を次の H レベルの立ち上がりで出力する。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 $T 1 0 0 1$ の長さは 3 であり、次の H レベル期間 $T 1 0 0 3$ の立ち上がりで 3 が出力され、H レベル期間 $T 1 0 0 3$ の長さは 5 であり、次の H レベル期間 $T 1 0 0 5$ の立ち上がりで 5 が出力される。

【 0 1 7 7 】L レベル期間長測定回路 9 0 7 は記録信号 9 0 4 の L レベル期間長を測定し、結果 9 0 8 を当該 L レベルの次にくる H レベルの立ち上がりで出力する。すなわち、L レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、L レベル期間 $T 1 0 0 2$ の長さは 2 であり、次の H レベル期間 $T 1 0 0 3$ の立ち上がりで 2 が出力され、L レベル期間 $T 1 0 0 4$ の長さは 6 であり、次の H レベル期間 $T 1 0 0 5$ の立ち上がりで 6 が出力される。

【 0 1 7 8 】H レベル期間長測定回路 2 (9 0 9) は、記録信号 9 0 4 の H レベル期間長を測定し、結果 9 1 1 を当該 H レベルの立ち上がりで出力する。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 $T 1 0 0 3$ の長さは 5 であり、当該 H レベル期間 $T 1 0 0 3$ の立ち上がりで 5 が出力され、H レベル期間 $T 1 0 0 5$ の長さは 8 であり、当該 H レベル期間 $T 1 0 0 5$ の立ち上がりで 8 が出力される。

【 0 1 7 9 】そして測定結果 9 0 6 、 9 0 8 、 9 1 1 が遅延回路 9 1 2 に入力される。

【 0 1 8 0 】遅延回路 9 1 2 内で、測定結果 9 0 6 、 9 0 8 、 9 1 1 はメモリ 9 1 3 に入力され、メモリ 9 1 3 からメモリ出力 9 1 4 が出力される。ここでメモリ 9 1 3 には表 5 のように、前回の記録マークのあるべき長さ (測定結果 9 0 6 に対応) と、今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さ (測定結果 9 0 8 に対応) と今回の記録マークのあるべき長さ (測定結果 9 1 1 に対応) の組み合わせに対応して値が格納されており、対

応した格納値が出力される。

【0181】可変遅延器915はメモリ出力914に従って、記録信号910を遅延して信号916を出力する。

【0182】記録信号910と信号916はAND回路917に入力し、信号918として出力する。

【0183】この出力信号918は、レーザ駆動回路919に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形920となり、記録マーク1001、1002が形成される。

【0184】このように、実施例5においては、記録マーク1001あるいは1002を形成するに際して、前回の記録マークのあるべき長さ（ $\times Tw$ ）と今回の記録マークの直前にあるべき無記録部分の長さと今回の記録マークの記録すべき長さの組み合わせに応じて、光源の記録パワーでの駆動開始時刻を遅らせる。その結果、前回の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、前回のマーク長による差異と今回の記録マークの直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の

熱履歴の差異も補正できるので、記録マーク1001、1002の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0185】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0186】（実施例6）図12の光駆動波形1127は、本発明の実施例6における光駆動波形である。

【0187】光駆動波形1127は、先頭パルスとマルチパルスからなる。さらに、光駆動波形1127は、記録信号1110に対して、駆動開始時刻が遅延している。

【0188】その遅延量は、（1、7）変調を例にとれば、表6に示すように、前回の記録マークのあるべき長さと、今回のマークの直前の無記録部分のあるべき長さと、今回の記録マークのあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0189】

【表6】

前回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻 遅延量	メモリ1113の 格納値
2	2	2	d6 (2, 2, 2)	d6 (2, 2, 2)
2	2	3	d6 (2, 2, 3)	d6 (2, 2, 3)
2	2	4	d6 (2, 2, 4)	d6 (2, 2, 4)
2	2	5	d6 (2, 2, 5)	d6 (2, 2, 5)
2	2	6	d6 (2, 2, 6)	d6 (2, 2, 6)
2	2	7	d6 (2, 2, 7)	d6 (2, 2, 7)
2	2	8	d6 (2, 2, 8)	d6 (2, 2, 8)
2	3	2	d6 (2, 3, 2)	d6 (2, 3, 2)
2	3	3	d6 (2, 3, 3)	d6 (2, 3, 3)
.
.
.
N	M	L	d6 (N, M, L)	d6 (N, M, L)
.
.
8	8	4	d6 (8, 8, 4)	d6 (8, 8, 4)
8	8	5	d6 (8, 8, 5)	d6 (8, 8, 5)
8	8	6	d6 (8, 8, 6)	d6 (8, 8, 6)
8	8	7	d6 (8, 8, 7)	d6 (8, 8, 7)
8	8	8	d6 (8, 8, 8)	d6 (8, 8, 8)

(N, M, Lは2から8の整数)

【0190】たとえば、マーク1201のあるべき長さは $T1203 = 5Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直前の無記録期間は $T1202 = 2Tw$ であり、前回の記録マークは $T1201 = 3Tw$ であるので、光駆動波形はd6 (3, 2, 5)だけ遅延し、マーク1202のあるべき長さは $T1205 = 8Tw$ であり直前の無記録期間は $T1204 = 6Tw$ であり、前回の記録マークは $T1203 = 5Tw$ であるので、光駆動波形はd6 (5, 6, 8)だけ遅延する。

【0191】記録すべきマーク長がおなじで、直前の無記録部分の長さがおなじならば、前回の記録マークが大きいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、始端の伸びが大きくなる。従って、 $d6 (8, N, M) > d6 (7, N,$

$M) > \dots > d6 (2, N, M)$ (N, M は2から8の整数)となる傾向がある。

【0192】また、記録すべきマーク長がおなじで、前回の記録マーク長が同じならば、直前の無記録部分の長さが小さいほど、前回の記録パワーによる熱影響が大きく、マーク始端部分が昇温しやすいので、今回のマーク始端の伸びは大きくなる。従って、 $d6 (N, 2, M) > d6 (N, 3, M) > \dots > d6 (N, 8, M)$

(N, M は2から8の整数)となる傾向がある。

【0193】また、前回の記録マーク長がおなじで、直前の無記録部分の長さが同じならば、今回の記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすいので、昇温後急冷して非晶質マークを形成する相変化媒体を用いた場合には、短いマークほど始端の

伸びが大きい。従って $d6(N, M, 2) > d6(N, M, 3) > \dots > d6(N, M, 8)$ となる傾向がある。

【0194】その結果、前回の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、前回の記録マーク長さによる差異と直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク1001、1002の始端部分は、正しい位置に形成される。

【0195】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0196】図11は、本発明の実施例6の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0197】図11において1101はクロック発生回路、1102はチャンネルクロック信号、1103は記録信号発生回路、1104は記録信号発生回路1103から出力される記録信号、1105はHレベル期間長測定回路1、1106はその測定結果出力、1107はLレベル期間長測定回路、1108はその測定結果出力、1109はHレベル期間長測定回路2、1110はHレベル期間長測定回路2を通過後の記録信号、1111はHレベル期間長測定回路2の測定結果出力、1112は遅延回路、1113はメモリ、1114はメモリ出力、1115は可変遅延器、1116はパルス分割回路、1117は先頭パルス信号、1118は後半パルス信号、1119はマルチパルス生成回路であり、反転回路1120とAND回路1121から構成される。

【0198】1122はマルチパルス、1123は可変遅延器出力、1124はOR回路、1125はその出力、1126はレーザ駆動回路、1127は光駆動波形である。

【0199】上記構成の動作について、図12のタイミングチャートを参照して説明する。

【0200】クロック発生回路1101は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック1102を出力する。dutyは可変である。

【0201】クロック発生回路1101からのチャンネルクロック信号1102の立ち上がりで同期して、記録信号発生回路1103から出力された記録信号1104は、Hレベル期間長測定回路1(1105)と、Lレベル期間長測定回路1107と、Hレベル期間長測定回路2(1109)に入力する。

【0202】Hレベル期間長測定回路1(1105)は、記録信号1104のHレベル期間長を測定し、結果1106を次のHレベルの立ち上がりで出力する。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数で

あらわすことにすれば、Hレベル期間T1201の長さは3であり、次のHレベル期間T1203の立ち上がりで3が出力され、Hレベル期間T1203の長さは5であり、次のHレベル期間T1205の立ち上がりで5が出力される。

【0203】Lレベル期間長測定回路1107は記録信号1104のLレベル期間長を測定し、結果1108を当該Lレベルの次にくるHレベルの立ち上がりで出力する。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T1202の長さは2であり、次のHレベル期間T1203の立ち上がりで2が出力され、Lレベル期間T1204の長さは6であり、次のHレベル期間T1205の立ち上がりで6が出力される。

【0204】Hレベル期間長測定回路2(1109)は、記録信号1104のHレベル期間長を測定し、結果1111を当該Hレベルの立ち上がりで同期して出力する。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T1203の長さは5であり、当該Hレベル期間T1203の立ち上がりで5が出力され、Hレベル期間T1205の長さは8であり、当該Hレベル期間T1205の立ち上がりで8が出力される。

【0205】そして測定結果1106、1108、1111が遅延回路1112に入力される。

【0206】遅延回路1112内で、測定結果1106、1108、1111はメモリ1113に入力され、メモリ1113からメモリ出力1114が出力される。ここでメモリ1113には表6のように、前回の記録マークのあるべき長さ(測定結果1106に対応)と、今回の記録マークの直前の無記録部分のあるべき長さ(測定結果1108に対応)と今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果1111に対応)の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0207】一方、記録信号1110は、パルス分割回路1116で先頭パルス1117と後半パルス1118に分割される。

【0208】先頭パルスは記録信号1110の立ち上がりで立ち上がり、Tw後に立ち下がる信号であり、後半パルスは記録信号1110の立ち上がりからTw後に立ち上がり、記録信号1110の立ち下がり立ち下がる信号である。

【0209】後半パルス1118は、マルチパルス生成回路1119に入力し、マルチパルス1122が出力される。

【0210】先頭パルス1117は、可変遅延器1115でメモリ出力1114に従って、遅延され信号1123となる。

【0211】マルチパルス1122と信号1123はOR回路1124に入力し、信号1125として出力す

る。

【0212】この出力信号1125は、レーザ駆動回路1126に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形1127となり、記録マーク1201、1202が形成される。

【0213】このように、実施例6においては、記録マーク1201あるいは1202を形成するに際して、光源をパルス状に発光し、前回の記録マークのあるべき長さとは今回の記録マークの直前にあるべき無記録部分の長短と今回の記録マークの記録すべき長さの組み合わせに
10 応じて、先頭パルスの駆動開始時刻を遅らせる。その結果、前回の記録マークを形成した記録パワーが今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響の、前回のマーク長による差異と今回の記録マークの直前の無記録部分の長短による差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク始端部分の熱履歴の差異も補正できるので、記録マーク1201、1202の始端部分は、正しい位置に形成される。また、パルス状に駆動することで媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0214】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0215】（実施例7）図14の光駆動波形1318は、本発明の実施例7における光駆動波形である。

【0216】光駆動波形1318は、記録信号1306を固定量Kだけ遅延した、基準信号1314に対して、駆動終了時刻が早くなっている。

【0217】その変更量は、(1、7)変調を例にとれば、表7に示すように、記録すべき記録マークの長さとは対応して決められる。
30

【0218】

【表7】

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T_w$)	駆動終了時刻 遅延量	メモリ1309 格納値
2	-d7(2)	K-d7(2)
3	-d7(3)	K-d7(3)
4	-d7(4)	K-d7(4)
5	-d7(5)	K-d7(5)
6	-d7(6)	K-d7(6)
7	-d7(7)	K-d7(7)
8	-d7(8)	K-d7(8)

遅延量の-（マイナス）符号は、早く終了することを意味する。

【0219】たとえば、記録マーク1401の記録すべき長さは $T1401 = 2T_w$ (T_w は検出窓幅)であるので、d7(2)だけはやく終了し、記録マーク1402の記録すべき長さは $T1402 = 8T_w$ であるので、d7(8)だけ早く終了する。

【0220】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終
50

端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $d7(8) > d7(7) > \dots > d7(2)$ となる傾向がある。

【0221】その結果、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正でき、記録マーク1401、1402の終端部分は、正しい位置に形成される。

【0222】なお、ここでは光駆動波形1318は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0223】図13は、本発明の実施例7の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0224】図13において1301はクロック発生回路、1302はクロック信号、1303は記録信号発生回路、1304は記録信号発生回路1303から出力される記録信号、1305はHレベル期間長測定回路、1306はHレベル期間長測定回路1305を通過後の記録信号、1307はHレベル期間測定結果出力、1308は遅延回路、1309はメモリ、1310はメモリ出力、1311は可変遅延器、1312は可変遅延器出力、1313は固定遅延器、1314はその出力、1315はアンド回路、1316はその出力、1317はレーザ駆動回路、1318は光駆動波形である。
20

【0225】上記構成の動作について、図14のタイミングチャートを参照して説明する。

【0226】クロック発生回路1301は、周期が検出窓幅 T_w のチャネルクロック1302を出力する。dutyは可変である。

【0227】クロック発生回路1301からのチャネルクロック信号1302の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路1303から出力された記録信号1304は、Hレベル期間長測定回路1305に入力される。Hレベル期間長測定回路1305は記録信号1304のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号1306と、測定結果1307を出力する。測定結果1307は、記録信号1306の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間 $T1401$ の長さは2であり、測定結果1307は当該Hレベル期間 $T1401$ の立ち上がりで2となり、Hレベル期間 $T1402$ の長さは8であり、測定結果1307は当該Hレベル期間 $T1402$ の立ち上がりで8となる。
40

【0228】そして、測定結果1307は、遅延回路1308に入力する。

【0229】遅延回路1308内で、測定結果1307はメモリ1309に入力され、メモリ1309からメモリ出力1310が出力される。ここでメモリ1309には、表7のように、今回の記録マークのあるべき長さ

(測定結果 1 3 0 7 に対応) に対応して値が格納されており、測定結果 1 3 0 7 に対応した格納値が出力される。

【0 2 3 0】可変遅延器 1 3 1 1 はメモリ出力 1 3 1 0 に従って、記録信号 1 3 0 6 を遅延して信号 1 3 1 2 を出力する。

【0 2 3 1】一方、記録信号 1 3 0 6 は、遅延量 K の固定遅延器 1 3 1 3 を通って、K だけ遅延した出力 1 3 1 4 になる。

【0 2 3 2】出力 1 3 1 2 と出力 1 3 1 4 は AND 回路 1 3 1 5 に入力し、信号 1 3 1 6 として出力する。

【0 2 3 3】この出力信号 1 3 1 6 は、レーザ駆動回路 1 3 1 7 に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形 1 3 1 8 となり、記録マーク 1 4 0 1、1 4 0 2 が形成される。

【0 2 3 4】このように、実施例 7 においては、記録マーク 1 4 0 1 あるいは 1 4 0 2 を形成するに際して、記録マークの記録すべき長さに応じて、光源の記録パワーでの駆動を早く終了するので、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正することができ、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0 2 3 5】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 2 3 6】(実施例 8) 図 1 6 の光駆動波形 1 5 3 8 は、本発明の実施例 8 における光駆動波形である。

【0 2 3 7】光駆動波形 1 5 3 8 は、複数のパルスから構成されている。さらに、光駆動波形 1 5 3 8 は、記録信号 1 5 0 6 を固定量 K だけ遅延した信号 1 6 0 0 を基準とすると、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0 2 3 8】その変更量は、(1、7) 変調を例にとれば、表 8 に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0 2 3 9】

【表 8】

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T_w$)	駆動終了時刻 遅延量	メモリ 1 5 2 7 格納値
2	-d 8 (2)	K-d 8 (2)
3	-d 8 (3)	K-d 8 (3)
4	-d 8 (4)	K-d 8 (4)
5	-d 8 (5)	K-d 8 (5)
6	-d 8 (6)	K-d 8 (6)
7	-d 8 (7)	K-d 8 (7)
8	-d 8 (8)	K-d 8 (8)

遅延量の - (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0 2 4 0】たとえば、記録マーク 1 6 0 1 の記録すべき長さは $T 1 6 0 1 = 2 T_w$ (T_w は検出窓幅) である

ので、d 8 (2) だけはやく終了し、記録マーク 1 6 0 2 の記録すべき長さは $T 1 6 0 2 = 8 T_w$ であるので、d 8 (8) だけ早く終了する。

【0 2 4 1】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $d 8 (8) > d 8 (7) > \dots > d 8 (2)$ となる傾向がある。

【0 2 4 2】その結果、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正でき、記録マーク 1 6 0 1、1 6 0 2 の終端部分は、正しい位置に形成される。

【0 2 4 3】なお、ここでは光駆動波形 1 5 3 8 は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 2 4 4】図 1 5 は、本発明の実施例 8 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0 2 4 5】図 1 5 において 1 5 0 1 はクロック発生回路、1 5 0 2 はクロック信号、1 5 0 3 は記録信号発生回路、1 5 0 4 は記録信号発生回路 1 5 0 3 から出力される記録信号、1 5 0 5 は H レベル期間長測定回路、1 5 0 6 は H レベル期間長測定回路 1 5 0 5 を通過後の記録信号、1 5 0 7 は H レベル期間測定結果出力、1 5 0 8 はパルス分割回路、1 5 0 9 は先頭パルス、1 5 1 0 は中間パルス、1 5 1 1 はラストパルス、1 5 1 2 は固定遅延器、1 5 1 3 はその出力、1 5 1 4 はマルチパルス生成回路、1 5 1 5 は反転回路、1 5 1 6 は AND 回路、1 5 1 7 は中間マルチパルス、1 5 1 8 は固定遅延器、1 5 1 9 はその出力、1 5 2 0 はマルチパルス生成回路、1 5 2 1 は反転回路、1 5 2 2 は AND 回路、1 5 2 3 はラストマルチ回路、1 5 2 4 はセクタ、1 5 2 5 はその出力、1 5 2 6 は遅延回路、1 5 2 7 はメモリ、1 5 2 8 はメモリ出力、1 5 2 9 は可変遅延器、1 5 3 0 はその出力、1 5 3 1 は OR 回路、1 5 3 2 はその出力、1 5 3 3 は AND 回路、1 5 3 4 はその出力、1 5 3 5 はセクタ、1 5 3 6 はその出力、1 5 3 7 はレーザ駆動回路、1 5 3 8 は光駆動波形、1 5 3 9 はゲート発生回路、1 5 4 0 はその出力、1 5 4 1 はスイッチ、1 5 4 2 はセレクト信号である。ここで、セクタ 1 5 2 4、1 5 3 5 は、セレクト信号 1 5 4 2 が L レベルのときは X 入力を選択して出力し、H レベルのときは Y 入力を選択して出力する。

【0 2 4 6】はじめに、スイッチ 1 5 4 1 が OFF、すなわち、セレクト信号 1 5 4 2 が L レベルのときの動作について、図 1 6 のタイミングチャートを参照して説明する。

【0 2 4 7】クロック発生回路 1 5 0 1 は、周期が検出窓幅 T_w のチャネルクロック 1 5 0 2 を出力する。du ty は可変である。

【0 2 4 8】クロック発生回路 1 5 0 1 からのチャネル

クロック信号 1 5 0 2 の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路 1 5 0 3 から出力された記録信号 1 5 0 4 は、H レベル期間長測定回路 1 5 0 5 に入力される。H レベル期間長測定回路 1 5 0 5 は記録信号 1 5 0 4 の H レベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号 1 5 0 6 と、測定結果 1 5 0 7 を出力する。測定結果 1 5 0 7 は、記録信号 1 5 0 6 の測定した H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 T 1 6 0 1 の長さは 2 であり、測定結果 1 5 0 7 は当該 H レベル期間 T 1 6 0 1 の立ち上がりで 2 となり、H レベル期間 T 1 6 0 2 の長さは 8 であり、測定結果 1 5 0 7 は当該 H レベル期間 T 1 6 0 2 の立ち上がりで 8 となる。

【0 2 4 9】そして、測定結果 1 5 0 7 は、遅延回路 1 5 2 6 に入力する。遅延回路 1 5 2 6 内で、測定結果 1 5 0 7 はメモリ 1 5 2 7 に入力され、メモリ 1 5 2 7 からメモリ出力 1 5 2 8 が出力される。ここでメモリ 1 5 2 7 には、表 8 のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 1 5 0 7 に対応）に対応して値が格納されており、測定結果 1 5 0 7 に対応した格納値が出力される。

【0 2 5 0】一方、記録信号 1 5 0 6 は、パルス分割回路 1 5 0 8 で、先頭パルス 1 5 0 9 と中間パルス 1 5 1 0 とラストパルス 1 5 1 1 に分割される。本例では、先頭パルス 1 5 0 9 は記録信号 1 5 0 6 の立ち上がりで立ち上がり、T_w後に立ち下がる信号であり、中間パルス 1 5 1 0 は記録信号 1 5 0 6 の立ち上がりから T_w後に立ち上がり記録信号 1 5 0 6 の立ち下がる T_w前に立ち下がる信号であり、ラストパルス 1 5 1 1 は記録信号 1 5 0 6 の立ち下がる T_w前に立ち上がり、記録信号 1 5 0 6 の立ち下がり立ち下がる信号である。記録信号 1 5 0 6 の H レベル期間が 2 T_wのときは中間パルスは発生しない。

【0 2 5 1】先頭パルス 1 5 0 9 は、遅延量 K の固定遅延器 1 5 1 2 で遅延され、信号 1 5 1 3 となる。

【0 2 5 2】中間パルス 1 5 1 0 は、マルチパルス生成回路 1 5 1 4 に入力し、中間マルチパルス 1 5 1 7 となり、遅延量 K の固定遅延器 1 5 1 8 で遅延され、信号 1 5 1 9 となる。

【0 2 5 3】ラストパルス 1 5 1 1 は、マルチパルス生成回路 1 5 2 0 でラストマルチパルス 1 5 2 3 となり、セクタ 1 5 2 4 で選択され、信号 1 5 2 5 となり、可変遅延器 1 5 2 9 で、メモリ出力 1 5 2 8 にしたがって遅延され、信号 1 5 3 0 となる。

【0 2 5 4】信号 1 5 1 9 と信号 1 5 1 3 と信号 1 5 3

0 の OR 回路 1 5 3 1 による出力 1 5 3 2 がセクタ 1 5 3 5 で選択され、レーザ駆動回路 1 5 3 7 に入力し、光源が駆動され、光駆動波形 1 5 3 8 となり、記録マーク 1 6 0 1、1 6 0 2 が形成される。

【0 2 5 5】つぎに、スイッチ 1 5 4 1 が ON のときを、図 1 7 を用いて説明する。

【0 2 5 6】ゲート発生回路 1 5 3 9 は、測定結果 1 5 0 7 が 2 のときのみ H レベルを出力する。よって、セレクト信号 1 5 4 2 が、測定結果 1 5 0 7 が 2 のときに、H レベルになり、セクタ 1 5 2 4、1 5 3 5 が Y 入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス 1 5 1 1 が可変遅延器 1 5 2 9 に入力し、遅延され、信号 1 5 3 0 となり、さらに、信号 1 5 1 3 と信号 1 5 3 0 の AND 回路 1 5 3 3 による出力 1 5 3 4 が、レーザ駆動回路 1 5 3 7 に導かれる。したがって、記録すべきマークが 2 T_wのときに、T_w以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0 2 5 7】測定結果 1 5 0 7 が 2 以外のときは、スイッチ 1 5 4 1 が OFF のときと同じである。

【0 2 5 8】このように、実施例 8 においては、記録マーク 1 6 0 1 あるいは 1 6 0 2 を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、記録マークの記録すべき長さに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了するので、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正することができ、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0 2 5 9】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0 2 6 0】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 2 6 1】（実施例 9）図 1 9 の光駆動波形 1 8 2 0 は、本発明の実施例 9 における光駆動波形である。

【0 2 6 2】光駆動波形 1 8 2 0 は、記録信号 1 8 0 6 を固定量 K だけ遅延した、基準となる信号 1 8 1 6 に対して、駆動終了時刻が早くなっている。

【0 2 6 3】その変更量は、（1、7）変調を例にとれば、表 9 に示すように、記録すべき記録マークの長さとして直後にあるべき無記録部分の長さの組み合わせに対応して決められる。

【0 2 6 4】

【表 9】

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻 の遅延量	メモリ 1811 の格納値
2	2	-d9 (2, 2)	K-d9 (2, 2)
2	3	-d9 (2, 3)	K-d9 (2, 3)
2	4	-d9 (2, 4)	K-d9 (2, 4)
2	5	-d9 (2, 5)	K-d9 (2, 5)
2	6	-d9 (2, 6)	K-d9 (2, 6)
2	7	-d9 (2, 7)	K-d9 (2, 7)
2	8	-d9 (2, 8)	K-d9 (2, 8)
3	2	-d9 (3, 2)	K-d9 (3, 2)
3	3	-d9 (3, 3)	K-d9 (3, 3)
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	-d9 (N, M)	K-d9 (N, M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	-d9 (8, 6)	K-d9 (8, 6)
8	7	-d9 (8, 7)	K-d9 (8, 7)
8	8	-d9 (8, 8)	K-d9 (8, 8)

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0265】たとえば、記録マーク1901の記録すべき長さは $T1901 = 5Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直後の無記録部分の長さは $T1902 = 6Tw$ であるので、光駆動波形1820はd9 (5, 6) だけはやく終了し、記録マーク1902の記録すべき長さは $T1903 = 8Tw$ であり、直後の無記録部分の長さは $T1904 = 2Tw$ であるので、d9 (8, 2) だけ早く終了する。

【0266】直後の無記録部分の長さがおなじならば、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $d9(8, N) > d9(7, N) > \dots > d9(2, N)$ となる傾向がある。

【0267】また、記録マーク長がおなじならば、直後の無記録部分の長さが小さいほど、マーク終端部分の温度が下がりにくく、終端ののびがおおきくなる。したがって、 $d9(N, 2) > d9(N, 3) > \dots > d9(N, 8)$ となる傾向がある。

【0268】その結果、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異および直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異が補正でき、記録マーク1901、1902の終端部分は、正しい位置に形成される。

【0269】なお、ここでは光駆動波形1820は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0270】図18は、本発明の実施例9の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0271】図18において1801はクロック発生回路、1802はクロック信号、1803は記録信号発生回路、1804は記録信号発生回路1803から出力さ

れる記録信号、1805はHレベル期間長測定回路、1806はHレベル期間長測定回路1805を通過後の記録信号、1807はHレベル期間測定結果出力、1808はLレベル期間長測定回路、1809はその測定結果出力、1810は遅延回路、1811はメモリ、1812はメモリ出力、1813は可変遅延器、1814は可変遅延器出力、1815は固定遅延器、1816はその出力、1817はアンド回路、1818はその出力、1819はレーザ駆動回路、1820は光駆動波形である。

【0272】上記構成の動作について、図19のタイミングチャートを参照して説明する。

【0273】クロック発生回路1801は、周期が検出窓幅 Tw のチャネルクロック1802を出力する。du tyは可変である。

【0274】クロック発生回路1801からのチャネルクロック信号1802の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路1803から出力された記録信号1804は、Hレベル期間長測定回路1805に入力される。Hレベル期間長測定回路1805は記録信号1804のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号1806と、測定結果1807を出力する。測定結果1807は、記録信号1806の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間 $T1901$ の長さは5であり、測定結果1807は当該Hレベル期間 $T1901$ の立ち上がりで5となり、Hレベル期間 $T1903$ の長さは8であり、測定結果1807は当該Hレベル期間 $T1903$ の立ち上がりで8となる。

【0275】また、記録信号1804は、Lレベル期間長測定回路1808に入力される。Lレベル期間長測定回路1808は記録信号1804のLレベル期間の長さ

を測定し、測定結果 1809 を出力する。測定結果 1809 は、測定した L レベルの一つ前の H レベルの立ち上がりで同期して出力される。すなわち、L レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、L レベル期間 T 1902 の長さは 6 であり、測定結果 1809 は一つ前の H レベル期間 T 1901 の立ち上がりで 6 となり、L レベル期間 T 1904 の長さは 8 であり、測定結果 1809 は一つ前の H レベル期間 T 1903 の立ち上がりで 8 となる。

【0276】そして、測定結果 1807、1809 は、10 遅延回路 1810 に入力する。

【0277】遅延回路 1810 内で、測定結果 1807、1809 はメモリ 1811 に入力され、メモリ 1811 からメモリ出力 1812 が出力される。ここでメモリ 1811 には、表 9 のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 1807 に対応）と直後の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 1809 に対応）の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0278】可変遅延器 1813 はメモリ出力 1812 20 に従って、記録信号 1806 を遅延して信号 1814 を出力する。

【0279】一方、記録信号 1806 は、遅延量 K の固定遅延器 1815 を通って、K だけ遅延した信号 1816 になる。

【0280】信号 1814 と信号 1816 は AND 回路 1817 に入力し、信号 1818 として出力する。

【0281】この出力信号 1818 は、レーザ駆動回路 1819 に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形 1

820 となり、記録マーク 1901、1902 が形成される。

【0282】このように、実施例 9 においては、記録マーク 1901、1902 を形成するに際して、記録マークの記録すべき長さ（直後の無記録部分のあるべき長さ）の組み合わせに応じて、光源の記録パワーでの駆動を早く終了するので、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正することができ、かつ、直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異を補正できるので、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0283】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0284】（実施例 10）図 21 の光駆動波形 2038 は、本発明の実施例 10 における光駆動波形である。

【0285】光駆動波形 2038 は、複数のパルスから構成されている。さらに、光駆動波形 2038 は、記録信号 2006 を固定量 K だけ遅延した信号 2100 を基準とすると、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0286】その変更量は、（1、7）変調を例にとれば、表 10 に示すように、記録すべき記録マークの長さと、直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0287】

【表 10】

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻 の遅延量	メモリ 2027 の格納値
2	2	-d10 (2, 2)	K-d10 (2, 2)
2	3	-d10 (2, 3)	K-d10 (2, 3)
2	4	-d10 (2, 4)	K-d10 (2, 4)
2	5	-d10 (2, 5)	K-d10 (2, 5)
2	6	-d10 (2, 6)	K-d10 (2, 6)
2	7	-d10 (2, 7)	K-d10 (2, 7)
2	8	-d10 (2, 8)	K-d10 (2, 8)
3	2	-d10 (3, 2)	K-d10 (3, 2)
3	3	-d10 (3, 3)	K-d10 (3, 3)
.	.	.	.
N	M	-d10 (N, M)	K-d10 (N, M)
.	.	.	.
8	6	-d10 (8, 6)	K-d10 (8, 6)
8	7	-d10 (8, 7)	K-d10 (8, 7)
8	8	-d10 (8, 8)	K-d10 (8, 8)

遅延量の -（マイナス）符号は、早く終了することを意味する。

【0288】たとえば、記録マーク 2101 の記録すべき長さは $T2101 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅) であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T2102 = 4Tw$ であるので、d10 (2, 4) だけはやく終了し、

記録マーク 2102 の記録すべき長さは $T2103 = 8Tw$ であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T2104 = 3Tw$ であるので、d10 (8, 3) だけ早く終了する。

【0289】直後の無記録部分のあるべき長さがおなじなら、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $d10(8, N) > d10(7, N) > \dots > d10(2, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0290】また、記録すべきマーク長がおなじなら、直後の無記録部分のあるべき長さが短いほど、マーク終端部分での温度が下がりにくく、終端の伸びが大きい。したがって、 $d10(N, 2) > d10(N, 3) > \dots > d10(N, 8)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0291】その結果、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正でき、かつ、直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異も補正でき、記録マーク2101、2102の終端部分は、正しい位置に形成される。

【0292】なお、ここでは光駆動波形2038は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0293】図20は、本発明の実施例10の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0294】図20において2001はクロック発生回路、2002はクロック信号、2003は記録信号発生回路、2004は記録信号発生回路2003から出力される記録信号、2005はHレベル期間長測定回路、2006はHレベル期間長測定回路2005を通過後の記録信号、2007はHレベル期間測定結果出力、2008はパルス分割回路、2009は先頭パルス、2010は中間パルス、2011はラストパルス、2012は固定遅延器、2013はその出力、2014はマルチパルス生成回路、2015は反転回路、2016はAND回路、2017は中間マルチパルス、2018は固定遅延器、2019はその出力、2020はマルチパルス生成回路、2021は反転回路、2022はAND回路、2023はラストマルチ回路、2024はセクタ、2025はその出力、2026は遅延回路、2027はメモリ、2028はメモリ出力、2029は可変遅延器、2030はその出力、2031はOR回路、2032はその出力、2033はAND回路、2034はその出力、2035はセクタ、2036はその出力、2037はレーザ駆動回路、2038は光駆動波形、2039はゲート発生回路、2040はその出力、2041はスイッチ、2042はセレクト信号である。ここで、セクタ2024、2035は、セレクト信号2042がLレベルのときはX入力を選択して出力し、HレベルのときはY入力を選択して出力する。2043はLレベル期間長測定回路、2044はその測定結果出力である。

【0295】はじめに、スイッチ2041がOFF、すなわち、セレクト信号2042がLレベルのときの動作について、図21のタイミングチャートを参照して説明する。

【0296】クロック発生回路2001は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック2002を出力する。dutyは可変である。

【0297】クロック発生回路2001からのチャンネルクロック信号2002の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路2003から出力された記録信号2004は、Hレベル期間長測定回路2005とLレベル期間長測定回路2043に入力される。

【0298】Hレベル期間長測定回路2005は記録信号2004のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号2006と、測定結果2007を出力する。測定結果2007は、記録信号2006の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T2101の長さは2であり、測定結果2007は当該Hレベル期間T2101の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T2103の長さは8であり、測定結果2007は当該Hレベル期間T2103の立ち上がりで8となる。

【0299】Lレベル期間長測定回路2043は記録信号2004のLレベル期間の長さを測定し、測定結果2044を出力する。測定結果2044は、記録信号2006の測定したLレベルの直前のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T2102の長さは4であり、測定結果2044は直前Hレベル期間T2101の立ち上がりで4となり、Lレベル期間T2104の長さは3であり、測定結果2044は直前Hレベル期間T2103の立ち上がりで3となる。

【0300】そして、測定結果2007、2044は、遅延回路2026に入力する。遅延回路2026内で、測定結果2007、2044はメモリ2027に入力され、メモリ2027からメモリ出力2028が出力される。ここでメモリ2027には、表10のように、今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果2007に対応)と直後の無記録部分のあるべき長さ(測定結果2044に対応)の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0301】一方、記録信号2006は、パルス分割回路2008で、先頭パルス2009と中間パルス2010とラストパルス2011に分割される。本例では、先頭パルス2009は記録信号2006の立ち上がりで立ち上がり、Tw後に立ち下がる信号であり、中間パルス2010は記録信号2006の立ち上がりからTw後に立ち上がり記録信号2006の立ち下がりのTw前に立

ち下がる信号であり、ラストパルス 2011 は記録信号 2006 の立ち下がり Tw 前に立ち上がり、記録信号 2006 の立ち下がり で立ち下がる信号である。記録信号 2006 の H レベル期間が 2 Tw のときは中間パルスは発生しない。

【0302】先頭パルス 2009 は、遅延量 K の固定遅延器 2012 で遅延され、信号 2013 となる。

【0303】中間パルス 2010 は、マルチパルス生成回路 2014 に入力し、中間マルチパルス 2017 となり、遅延量 K の固定遅延器 2018 で遅延され、信号 2019 となる。

【0304】ラストパルス 2011 は、マルチパルス生成回路 2020 でラストマルチパルス 2023 となり、セクタ 2024 で選択され、信号 2025 となり、可変遅延器 2029 で、メモリ出力 2028 にしたがって遅延され、信号 2030 となる。

【0305】信号 2019 と信号 2013 と信号 2030 の OR 回路 2031 による出力 2032 がセクタ 2035 で選択され、レーザ駆動回路 2037 に入力し、光源が駆動され、光駆動波形 2038 となり、記録マーク 2101、2102 が形成される。

【0306】つぎに、スイッチ 2041 が ON のときを、図 22 を用いて説明する。

【0307】ゲート発生回路 2039 は、測定結果 2007 が 2 のときのみ H レベルを出力する。よって、セレクト信号 2042 が、測定結果 2007 が 2 のときに、H レベルになり、セクタ 2024、2035 が Y 入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス 2011 が可変遅延器 2029 に入力し、遅延され、信号 2030 となり、さらに、信号 2013 と信号 2030 の AND 回路 2033 による出力 2034 が、レーザ駆動回路 2037 に導かれる。したがって、記録すべきマークが 2 Tw のときに、Tw 以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0308】測定結果 2007 が 2 以外のときは、スイッチ 2041 が OFF のときと同じである。

【0309】このように、実施例 10 においては、記録マーク 2101 あるいは 2102 を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、記録マークの記録すべき長さ、直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了するので、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正することができ、かつ、直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異も補正できるので、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができ、また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0310】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0311】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0312】(実施例 11) 図 24 の光駆動波形 2321 は、本発明の実施例 11 における光駆動波形である。光駆動波形 2321 は、記録信号 2306 を固定量 K だけ遅延した、基準となる信号 2400 に対して、記録パワーでの駆動開始時刻が遅延し、かつ、駆動終了時刻が早くなっている。

【0313】駆動開始時刻の遅延量および駆動終了時刻の変更量(どれだけはやく終了するか)は、(1、7) 変調を例にとれば、表 11 に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0314】

【表 11】

今回の記録マークのあるべき長さ (× Tw)	駆動開始時刻の遅延量	駆動終了時刻の遅延量	第 1 メモリ 2309 の格納値	第 2 メモリ 2314 の格納値
2	B11 (2)	-E11 (2)	K+B11 (2)	K-E11 (2)
3	B11 (3)	-E11 (3)	K+B11 (3)	K-E11 (3)
4	B11 (4)	-E11 (4)	K+B11 (4)	K-E11 (4)
5	B11 (5)	-E11 (5)	K+B11 (5)	K-E11 (5)
6	B11 (6)	-E11 (6)	K+B11 (6)	K-E11 (6)
7	B11 (7)	-E11 (7)	K+B11 (7)	K-E11 (7)
8	B11 (8)	-E11 (8)	K+B11 (8)	K-E11 (8)

遅延量の - (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0315】たとえば、記録マーク 2401 の記録すべき長さは $T2401 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅) であるので、光駆動波形 2321 の記録パワーの駆動開始時刻は B11 (2) だけ遅延し、終了時刻は E11 (2) だけはやく終了する。記録マーク 2402 の記録すべき長

さは $T2402 = 8Tw$ であるので、光駆動波形 2321 の記録パワーの駆動開始時刻は B11 (8) だけ遅延し、終了時刻は E11 (8) だけはやく終了する。

【0316】記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での昇温後の急冷条件が得やすいので、相変化媒

体を用いた場合にはマーク始端の伸びが大きくなる。したがって、 $B11(2) > B11(3) > \dots > B11(8)$ となる傾向がある。

【0317】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E11(8) > E11(7) > \dots > E11(2)$ となる傾向がある。

【0318】その結果、記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異および記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正でき、記録マーク2401、2402の始端、終端部分は、正しい位置に形成される。

【0319】なお、ここでは光駆動波形2321は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0320】図23は、本発明の実施例11の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0321】図23において2301はクロック発生回路、2302はクロック信号、2303は記録信号発生回路、2304は記録信号発生回路2303から出力される記録信号、2305はHレベル期間長測定回路、2306はHレベル期間長測定回路2305を通過後の記録信号、2307はHレベル期間測定結果出力、2308は第1遅延回路、2309は第1メモリ、2310は第1メモリ出力、2311は第1可変遅延器、2312はその出力、2313は第2遅延回路、2314は第2メモリ、2315は第2メモリ出力、2316は第2可変遅延器、2317はその出力、2318はAND回路、2319はその出力、2320はレーザ駆動回路、2321は光駆動波形である。

【0322】上記構成の動作について、図24のタイミングチャートを参照して説明する。

【0323】クロック発生回路2301は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック2302を出力する。dutyは可変である。

【0324】クロック発生回路2301からのチャンネルクロック信号2302の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路2303から出力された記録信号2304は、Hレベル期間長測定回路2305に入力される。Hレベル期間長測定回路2305は記録信号2304のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号2306と、測定結果2307を出力する。測定結果2307は、記録信号2306の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T2401の長さは2であり、測定結果2307は当該Hレベル期間T2401の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T2402の長さは8であり、測定

結果2307は当該Hレベル期間T2402の立ち上がりで8となる。

【0325】そして、測定結果2307は、第1遅延回路2308と第2遅延回路2313に入力する。

【0326】第1遅延回路2308内で、測定結果2307は第1メモリ2309に入力され、第1メモリ2309から第1メモリ出力2310が出力される。ここでメモリ2309には、表11のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果2307に対応）に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第1可変遅延器2311は第1メモリ出力2310に従って、記録信号2306を遅延して信号2312を出力する。

【0327】また、第2遅延回路2313内で、測定結果2307は第2メモリ2314に入力され、第2メモリ2314から第2メモリ出力2315が出力される。ここで第2メモリ2314には、表11のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果2307に対応）に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第2可変遅延器2316は第2メモリ出力2315に従って、記録信号2306を遅延して信号2317を出力する。

【0328】信号2312と信号2317はAND回路2318に入力し、信号2319として出力する。

【0329】この出力信号2319は、レーザ駆動回路2320に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形2321となり、記録マーク2401、2402が形成される。

【0330】このように、実施例11においては、記録マーク2401、2402を形成するに際して、記録マークの記録すべき長さに応じて、記録パワーでの駆動開始時刻を遅延して、記録マークの長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正し、かつ、記録パワーでの駆動終了時刻を早く終了して、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正するので、記録マークの始端、終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0331】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0332】（実施例12）図26の光駆動波形2541は、本発明の実施例12における光駆動波形である。

【0333】光駆動波形2541は、複数のパルスから構成されている。さらに、光駆動波形2541は、記録信号2506を固定量Kだけ遅延した信号2600を基準とすると、最初のパルスの駆動開始時刻が遅延しており、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0334】その遅延量は、(1、7)変調を例にとれば、表12に示すように、記録すべき記録マークの長さ

に対応して決められる。

【表 1 2】

【0 3 3 5】

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	駆動終了時刻の 遅延量	第 1 メモリ 2 5 1 3 の格納値	第 2 メモリ 2 5 1 8 の格納値
2	B 1 2 (2)	E 1 2 (2)	K + B 1 2 (2)	K - E 1 2 (2)
3	B 1 2 (3)	- E 1 2 (3)	K + B 1 2 (3)	K - E 1 2 (3)
4	B 1 2 (4)	- E 1 2 (4)	K + B 1 2 (4)	K - E 1 2 (4)
5	B 1 2 (5)	- E 1 2 (5)	K + B 1 2 (5)	K - E 1 2 (5)
6	B 1 2 (6)	- E 1 2 (6)	K + B 1 2 (6)	K - E 1 2 (6)
7	B 1 2 (7)	- E 1 2 (7)	K + B 1 2 (7)	K - E 1 2 (7)
8	B 1 2 (8)	- E 1 2 (8)	K + B 1 2 (8)	K - E 1 2 (8)

遅延量の - (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0 3 3 6】たとえば、記録マーク 2 6 0 1 の記録すべき長さは $T 2 6 0 1 = 2 Tw$ (Tw は検出窓幅) であるので、記録開始時刻は B 1 2 (2) だけ遅延し、終了時刻は E 1 2 (2) だけはやく終了する。記録マーク 2 6 0 2 の記録すべき長さは $T 2 6 0 2 = 8 Tw$ であるので、記録開始時刻は B 1 2 (8) だけ遅延し、終了時刻は E 1 2 (8) だけはやく終了する。

【0 3 3 7】記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすく、昇温後急冷することでマークを形成する相変化媒体の場合には、マーク始端の伸びが大きい。したがって、 $B 1 2 (2) > B 1 2 (3) > \dots > B 1 2 (8)$ となる傾向がある。

【0 3 3 8】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E 1 2 (8) > E 1 2 (7) > \dots > E 1 2 (2)$ となる傾向がある。

【0 3 3 9】その結果、記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異も補正できるので、記録マーク 2 6 0 1、2 6 0 2 の始端部分、終端部分は、正しい位置に形成される。

【0 3 4 0】なお、ここでは光駆動波形 2 5 4 1 は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 3 4 1】図 2 5 は、本発明の実施例 1 2 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0 3 4 2】図 2 5 において 2 5 0 1 はクロック発生回路、2 5 0 2 はクロック信号、2 5 0 3 は記録信号発生回路、2 5 0 4 は記録信号発生回路 2 5 0 3 から出力される記録信号、2 5 0 5 は H レベル期間長測定回路、2 5 0 6 は H レベル期間長測定回路 2 5 0 5 を通過後の記録信号、2 5 0 7 は H レベル期間測定結果出力、2 5 0 8 はパルス分割回路、2 5 0 9 は先頭パルス、2 5 1 0 は中間パルス、2 5 1 1 はラストパルス、2 5 1 2 は第 1 遅延回路、2 5 1 3 は第 1 メモリ、2 5 1 4 は第 1 メ

モリ出力、2 5 1 5 は第 1 可変遅延器、2 5 1 6 はその出力、2 5 1 7 は第 2 遅延回路、2 5 1 8 は第 2 メモリ、2 5 1 9 は第 2 メモリ出力、2 5 2 0 は第 2 可変遅延器、2 5 2 1 はその出力、2 5 2 2 はマルチパルス生成回路、2 5 2 3 は反転回路、2 5 2 4 は AND 回路、2 5 2 5 は中間マルチパルス、2 5 2 6 は固定遅延器、2 5 2 7 はその出力、2 5 2 8 はマルチパルス生成回路、2 5 2 9 は反転回路、2 5 3 0 は AND 回路、2 5 3 1 はラストマルチパルス、2 5 3 2 はセクタ、2 5 3 3 はその出力、2 5 3 4 は OR 回路、2 5 3 5 はその出力、2 5 3 6 は AND 回路、2 5 3 7 はその出力、2 5 3 8 はセクタ、2 5 3 9 はその出力、2 5 4 0 はレーザ駆動回路、2 5 4 1 は光駆動波形、2 5 4 2 はゲート発生回路、2 5 4 3 はその出力、2 5 4 4 はスイッチ、2 5 4 5 はセレクト信号である。ここで、セクタ 2 5 3 2、2 5 3 8 は、セレクト信号 2 5 4 5 が L レベルのときは X 入力を選択して出力し、H レベルのときは Y 入力を選択して出力する。

【0 3 4 3】はじめに、スイッチ 2 5 4 4 が OFF、すなわち、セレクト信号 2 5 4 5 が L レベルのときの動作について、図 2 6 のタイミングチャートを参照して説明する。

【0 3 4 4】クロック発生回路 2 5 0 1 は、周期が検出窓幅 Tw のチャネルクロック 2 5 0 2 を出力する。duty は可変である。

【0 3 4 5】クロック発生回路 2 5 0 1 からのチャネルクロック信号 2 5 0 2 の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路 2 5 0 3 から出力された記録信号 2 5 0 4 は、H レベル期間長測定回路 2 5 0 5 に入力される。

【0 3 4 6】H レベル期間長測定回路 2 5 0 5 は記録信号 2 5 0 4 の H レベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号 2 5 0 6 と、測定結果 2 5 0 7 を出力する。測定結果 2 5 0 7 は、記録信号 2 5 0 6 の測定した H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 $T 2 6 0 1$ の長さは 2 であり、測定結果 2 5 0 7 は当該 H レベル期間 $T 2 6 0 1$ の

立ち上がりで2となり、Hレベル期間T 2 6 0 2の長さは8であり、測定結果2 5 0 7は当該Hレベル期間T 2 6 0 2の立ち上がりで8となる。

【0 3 4 7】そして、測定結果2 5 0 7は、第1遅延回路2 5 1 2、第2遅延回路2 5 1 7に入力する。

【0 3 4 8】第1遅延回路2 5 1 2内で、測定結果2 5 0 7は第1メモリ2 5 1 3に入力され、第1メモリ2 5 1 3から第1メモリ出力2 5 1 4が出力される。ここで第1メモリ2 5 1 3には、表1 2のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果2 5 0 7に対応）に

対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0 3 4 9】第2遅延回路2 5 1 7内で、測定結果2 5 0 7は第2メモリ2 5 1 8に入力され、第2メモリ2 5 1 8から第2メモリ出力2 5 1 9が出力される。ここで第2メモリ2 5 1 8には、表1 2のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果2 5 0 7に対応）に

対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0 3 5 0】一方、記録信号2 5 0 6は、パルス分割回路2 5 0 8で、先頭パルス2 5 0 9と中間パルス2 5 1 0とラストパルス2 5 1 1に分割される。本例では、先頭パルス2 5 0 9は記録信号2 5 0 6の立ち上がりで立ち上がり、Tw後に立ち下がる信号であり、中間パルス2 5 1 0は記録信号2 5 0 6の立ち上がりからTw後に立ち上がり記録信号2 5 0 6の立ち下がるのTw前に立ち下がる信号であり、ラストパルス2 5 1 1は記録信号2 5 0 6の立ち下がるのTw前に立ち上がり、記録信号2 5 0 6の立ち下がり

で立ち下がる信号である。記録信号2 5 0 6のHレベル期間が2 Twのときは中間パルスは発生しない。

【0 3 5 1】先頭パルス2 5 0 9は、第1可変遅延器2 5 1 5で第1メモリ出力2 5 1 4だけ遅延され、信号2 5 1 6となる。

【0 3 5 2】中間パルス2 5 1 0は、マルチパルス生成回路2 5 2 2に入力し、中間マルチパルス2 5 2 5となり、遅延量Kの固定遅延器2 5 2 6で遅延され、信号2 5 2 7となる。

【0 3 5 3】ラストパルス2 5 1 1は、マルチパルス生成回路2 5 2 8でラストマルチパルス2 5 3 1となり、セクタ2 5 3 2で選択され、信号2 5 3 3となり、第2可変遅延器2 5 2 0で、第2メモリ出力2 5 1 9にしたがって遅延され、信号2 5 2 1となる。

【0 3 5 4】信号2 5 1 6と信号2 5 2 7と信号2 5 2 1のOR回路2 5 3 4による出力2 5 3 5がセクタ2 5 3 8で選択され、レーザ駆動回路2 5 4 0に入力し、光源が駆動され、光駆動波形2 5 4 1となり、記録マ

ク2 6 0 1、2 6 0 2が形成される。

【0 3 5 5】つぎに、スイッチ2 5 4 4がONのときを、図2 7を用いて説明する。

【0 3 5 6】ゲート発生回路2 5 4 2は、測定結果2 5 0 7が2のときのみHレベルを出力する。よって、セレクト信号2 5 4 5が、測定結果2 5 0 7が2のときに、Hレベルになり、セクタ2 5 3 2、2 5 3 8がY入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス2 5 1 1が第2可変遅延器2 5 2 0に入力し、遅延され、信号2 5 2 1となり、さらに、信号2 5 2 1と信号2 5 1 6のAND回路2 5 3 6による出力2 5 3 7が、レーザ駆動回路2 5 4 0に導かれる。したがって、記録すべきマークが2 Twのときに、Tw以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0 3 5 7】測定結果2 5 0 7が2以外のときは、スイッチ2 5 4 4がOFFのときと同じである。

【0 3 5 8】このように、実施例1 2においては、記録マーク2 6 0 1あるいは2 6 0 2を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、記録マークの記録すべき長さに応じて、最初のパルスの駆動開始時刻を遅延して記録マーク長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、マーク終端を正しい位置に形成でき、かつ、記録マークの記録すべき長さに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了して記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正するので、記録マークの終端部分も正しい位置に形成することができる。また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0 3 5 9】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0 3 6 0】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 3 6 1】（実施例1 3）図2 9の光駆動波形2 8 2 1は、本発明の実施例1 3における光駆動波形である。光駆動波形2 8 2 1は、記録信号2 8 0 6を固定量Kだけ遅延した、基準となる信号2 9 0 0に対して、記録パワーでの駆動開始時刻が遅延し、かつ、駆動終了時刻が早くなっている。

【0 3 6 2】駆動開始時刻の遅延量は、（1、7）変調を例にとれば、表1 3（a）に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0 3 6 3】

【表1 3】

57

58

(a)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	第1メモリ2809 の格納値
2	B13 (2)	K+B13 (2)
3	B13 (3)	K+B13 (3)
4	B13 (4)	K+B13 (4)
5	B13 (5)	K+B13 (5)
6	B13 (6)	K+B13 (6)
7	B13 (7)	K+B13 (7)
8	B13 (8)	K+B13 (8)

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻の 遅延量	第2メモリ2814の 格納値
2	2	-E13 (2, 2)	K-E13 (2, 2)
2	3	-E13 (2, 3)	K-E13 (2, 3)
2	4	-E13 (2, 4)	K-E13 (2, 4)
2	5	-E13 (2, 5)	K-E13 (2, 5)
2	6	-E13 (2, 6)	K-E13 (2, 6)
2	7	-E13 (2, 7)	K-E13 (2, 7)
2	8	-E13 (2, 8)	K-E13 (2, 8)
3	2	-E13 (3, 2)	K-E13 (3, 2)
3	3	-E13 (3, 3)	K-E13 (3, 3)
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	-E13 (N, M)	K-E13 (N, M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	-E13 (8, 6)	K-E13 (8, 6)
8	7	-E13 (8, 7)	K-E13 (8, 7)
8	8	-E13 (8, 8)	K-E13 (8, 8)

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0364】たとえば、記録マーク2901の記録すべき長さは $T2901 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、光駆動波形2821の記録パワーの駆動開始時刻はB13 (2) だけ遅延し、記録マーク2902の記録すべき長さは $T2903 = 8Tw$ であるので、光駆動波形2821の記録パワーの駆動開始時刻はB13 (8) だけ遅延する。

【0365】駆動終了時刻の遅延量は、(1, 7) 変調を例にとれば、表13 (b) に示すように、記録すべき記録マークの長さとの組み合わせに対応して決められる。

【0366】たとえば、記録マーク2901の記録すべき長さは $T2901 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T2902 = 4Tw$ であるので、光駆動波形2821の記録パワーの駆動終了時刻はE13 (2, 4) だけ早く終了し、記録マーク2902の記録すべき長さは $T2903 = 8Tw$ であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T2904 = 3Tw$ であるので、光駆動波形2821の記録パワーの駆動終了時刻はE13 (8, 3) だけ早く終了する。

【0367】記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での昇温後の急冷条件が得やすいので、相変化媒

体を用いた場合にはマーク始端の伸びが大きくなる。したがって、 $B13 (2) > B13 (3) > \dots > B13 (8)$ となる傾向がある。

【0368】直後の無記録部分の長さがおなじならば、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E13 (8, N) > E13 (7, N) > \dots > E13 (2, N)$ となる傾向がある。(Nは2から8の整数)

記録すべきマーク長がおなじならば、直後の無記録部分の長さが短いほど、マーク終端部分の温度が下がりにくく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E13 (N, 2) > E13 (N, 3) > \dots > E13 (N, 8)$ となる傾向がある。(Nは2から8の整数)

その結果、記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異が補正でき、マーク始端部分は正しい位置に形成される。また、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正でき、直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分での熱履歴の差異が補正できるので、マーク終端部分は、正しい位置に形成される。

【0369】なお、ここでは光駆動波形2821は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワー

と再生パワーの間、または、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0370】図 28 は、本発明の実施例 13 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0371】図 28 において 2801 はクロック発生回路、2802 はクロック信号、2803 は記録信号発生回路、2804 は記録信号発生回路 2803 から出力される記録信号、2805 は H レベル期間長測定回路、2806 は H レベル期間長測定回路 2805 を通過後の記録信号、2807 は H レベル期間測定結果出力、2808 は第 1 遅延回路、2809 は第 1 メモリ、2810 は第 1 メモリ出力、2811 は第 1 可変遅延器、2812 はその出力、2813 は第 2 遅延回路、2814 は第 2 メモリ、2815 は第 2 メモリ出力、2816 は第 2 可変遅延器、2817 はその出力、2818 は AND 回路、2819 はその出力、2820 はレーザ駆動回路、2821 は光駆動波形、2822 は L レベル期間長測定回路、2823 はその測定結果出力である。

【0372】上記構成の動作について、図 29 のタイミングチャートを参照して説明する。

【0373】クロック発生回路 2801 は、周期が検出窓幅 T_w のチャネルクロック 2802 を出力する。duty は可変である。

【0374】クロック発生回路 2801 からのチャネルクロック信号 2802 の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路 2803 から出力された記録信号 2804 は、H レベル期間長測定回路 2805 と L レベル期間長測定回路 2822 に入力される。

【0375】H レベル期間長測定回路 2805 は記録信号 2804 の H レベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号 2806 と、測定結果 2807 を出力する。測定結果 2807 は、記録信号 2806 の測定した H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、H レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 T_{2901} の長さは 2 であり、測定結果 2807 は当該 H レベル期間 T_{2901} の立ち上がりで 2 となり、H レベル期間 T_{2903} の長さは 8 であり、測定結果 2807 は当該 H レベル期間 T_{2903} の立ち上がりで 8 となる。

【0376】そして、測定結果 2807 は、第 1 遅延回路 2808 と第 2 遅延回路 2813 に入力する。

【0377】L レベル期間長測定回路 2822 は記録信号 2804 の L レベル期間の長さを測定し、測定結果 2823 を出力する。測定結果 2823 は、記録信号 2806 の測定した L レベルの直前の H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、L レベル期間の長さをチャネルクロックの個数であらわすことにすれば、L レベル期間 T_{2902} の長さは 4 であり、測定結果 2823 は当該 L レベル期間の直前の H レベル期間 T_{290

1 の立ち上がりで 4 となり、L レベル期間 T_{2904} の長さは 3 であり、測定結果 2823 は、直前 H レベル期間 T_{2903} の立ち上がりで 3 となる。

【0378】そして、測定結果 2823 は、第 2 遅延回路 2813 に入力する。

【0379】第 1 遅延回路 2808 内で、測定結果 2807 は第 1 メモリ 2809 に入力され、第 1 メモリ 2809 から第 1 メモリ出力 2810 が出力される。ここでメモリ 2809 には、表 13 (a) のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 2807 に対応）に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第 1 可変遅延器 2811 は第 1 メモリ出力 2810 に従って、記録信号 2806 を遅延して信号 2812 を出力する。

【0380】また、第 2 遅延回路 2813 内で、測定結果 2807、2823 は第 2 メモリ 2814 に入力され、第 2 メモリ 2814 から第 2 メモリ出力 2815 が出力される。ここで第 2 メモリ 2814 には、表 13

(b) のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 2807 に対応）と直後の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 2823 に対応）との組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第 2 可変遅延器 2816 は第 2 メモリ出力 2815 に従って、記録信号 2806 を遅延して信号 2817 を出力する。

【0381】信号 2812 と信号 2817 は AND 回路 2818 に入力し、信号 2819 として出力する。

【0382】この出力信号 2819 は、レーザ駆動回路 2820 に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形 2821 となり、記録マーク 2901、2902 が形成される。

【0383】このように、実施例 13 においては、記録マーク 2901、2902 を形成するに際して、記録マークの記録すべき長さに応じて、記録パワーでの駆動開始時刻を遅延して、記録マークの長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、記録マークの始端を正しい位置に形成できる。かつ、記録マークの記録すべき長さとは直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに応じて、記録パワーでの駆動終了時刻を早く終了して、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正し、直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異を補正するので、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0384】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0385】（実施例 14）図 31 の光駆動波形 3041 は、本発明の実施例 14 における光駆動波形である。

【0386】光駆動波形 3041 は、複数のパルスから

構成されている。さらに、光駆動波形 3 0 4 1 は、記録信号 3 0 0 6 を固定量 K だけ遅延した信号 3 1 0 0 を基準とすると、最初のパルスの駆動開始時刻が遅延しており、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0 3 8 7】最初のパルスの駆動開始遅延量は、(1、

(a)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T w$)	駆動開始時刻の 遅延量	第 1 メモリ 3 0 1 3 の格納値
2	B 1 4 (2)	K + B 1 4 (2)
3	B 1 4 (3)	K + B 1 4 (3)
4	B 1 4 (4)	K + B 1 4 (4)
5	B 1 4 (5)	K + B 1 4 (5)
6	B 1 4 (6)	K + B 1 4 (6)
7	B 1 4 (7)	K + B 1 4 (7)
8	B 1 4 (8)	K + B 1 4 (8)

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times T w$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times T w$)	駆動終了時刻の 遅延量	第 2 メモリ 3 0 1 8 の 格納値
2	2	- E 1 4 (2 , 2)	K - E 1 4 (2 , 2)
2	3	- E 1 4 (2 , 3)	K - E 1 4 (2 , 3)
2	4	- E 1 4 (2 , 4)	K - E 1 4 (2 , 4)
2	5	- E 1 4 (2 , 5)	K - E 1 4 (2 , 5)
2	6	- E 1 4 (2 , 6)	K - E 1 4 (2 , 6)
2	7	- E 1 4 (2 , 7)	K - E 1 4 (2 , 7)
2	8	- E 1 4 (2 , 8)	K - E 1 4 (2 , 8)
3	2	- E 1 4 (3 , 2)	K - E 1 4 (3 , 2)
3	3	- E 1 4 (3 , 3)	K - E 1 4 (3 , 3)
.	.	.	.
N	M	- E 1 4 (N , M)	K - E 1 4 (N , M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	- E 1 4 (8 , 6)	K - E 1 4 (8 , 6)
8	7	- E 1 4 (8 , 7)	K - E 1 4 (8 , 7)
8	8	- E 1 4 (8 , 8)	K - E 1 4 (8 , 8)

遅延量の - (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0 3 8 9】たとえば、記録マーク 3 1 0 1 の記録すべき長さは $T 3 1 0 1 = 2 T w$ ($T w$ は検出窓幅) であるので、記録開始時刻は B 1 4 (2) だけ遅延し、記録マーク 3 1 0 2 の記録すべき長さは $T 3 1 0 3 = 8 T w$ であるので、記録開始時刻は B 1 4 (8) だけ遅延する。

【0 3 9 0】最後のパルスの駆動終了遅延量は、(1、7) 変調を例にとれば、表 1 4 (b) に示すように、記録すべき記録マークの長さ

40

と直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。
【0 3 9 1】たとえば、記録マーク 3 1 0 1 の記録すべき長さは $T 3 1 0 1 = 2 T w$ ($T w$ は検出窓幅) であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T 3 1 0 2 = 4 T w$ であるので、終了時刻は E 1 4 (2 , 4) だけ早くなり、記録マーク 3 1 0 2 の記録すべき長さは $T 3 1 0 3 = 8 T w$ であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T 3 1 0 4 = 3 T w$ であるので、終了時刻は E 1 4

(8 , 3) だけ早くる。

7) 変調を例にとれば、表 1 4 (a) に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0 3 8 8】

【表 1 4】

【0 3 9 2】記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすく、昇温後急冷することでマークを形成する相変化媒体の場合には、マーク始端の伸びが大きい。したがって、 $B 1 4 (2) > B 1 4 (3) > \dots > B 1 4 (8)$ となる傾向がある。

【0 3 9 3】直後の無記録部分の長さがおなじならば、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E 1 4 (8 , N) > E 1 4 (7 , N) > \dots > E 1 4 (2 , N)$ (N は 2 から 8 の整数) となる傾向がある。

【0 3 9 4】記録すべきマーク長がおなじならば、直後の無記録部分の長さが短いほど、マーク終端部分での温度がさがりにくく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E 1 4 (N , 2) > E 1 4 (N , 3) > \dots > E 1 4 (N , 8)$ (N は 2 から 8 の整数) となる傾向がある。

50

【0 3 9 5】その結果、記録マーク長によるマーク始端

部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異も補正でき、かつ直後の無記録部分の長短によるマーク終端部分での熱履歴も補正できるので、記録マーク3101、3102の始端部分、終端部分は、正しい位置に形成される。

【0396】なお、ここでは光駆動波形3041は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0397】図30は、本発明の実施例14の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0398】図30において3001はクロック発生回路、3002はクロック信号、3003は記録信号発生回路、3004は記録信号発生回路3003から出力される記録信号、3005はHレベル期間長測定回路、3006はHレベル期間長測定回路3005を通過後の記録信号、3007はHレベル期間測定結果出力、3008はパルス分割回路、3009は先頭パルス、3010は中間パルス、3011はラストパルス、3012は第1遅延回路、3013は第1メモリ、3014は第1メモリ出力、3015は第1可変遅延器、3016はその出力、3017は第2遅延回路、3018は第2メモリ、3019は第2メモリ出力、3020は第2可変遅延器、3021はその出力、3022はマルチパルス生成回路、3023は反転回路、3024はAND回路、3025は中間マルチパルス、3026は固定遅延器、3027はその出力、3028はマルチパルス生成回路、3029は反転回路、3030はAND回路、3031はラストマルチパルス、3032はセクタ、3033はその出力、3034はOR回路、3035はその出力、3036はAND回路、3037はその出力、3038はセクタ、3039はその出力、3040はレーザ駆動回路、3041は光駆動波形、3042はゲート発生回路、3043はその出力、3044はスイッチ、3045はセレクト信号である。ここで、セクタ3032、3038は、セレクト信号3045がLレベルのときはX入力を選択して出力し、HレベルのときはY入力を選択して出力する。さらに、3046はLレベル期間長検出回路、3047はその測定結果出力である。

【0399】はじめに、スイッチ3044がOFF、すなわち、セレクト信号3045がLレベルのときの動作について、図31のタイミングチャートを参照して説明する。

【0400】クロック発生回路3001は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック3002を出力する。dutyは可変である。

【0401】クロック発生回路3001からのチャンネルクロック信号3002の立ち上がりに同期して、記録信

号発生回路3003から出力された記録信号3004は、Hレベル期間長測定回路3005とLレベル期間長測定回路3046に入力される。

【0402】Hレベル期間長測定回路3005は記録信号3004のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号3006と、測定結果3007を出力する。測定結果3007は、記録信号3006の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T3101の長さは2であり、測定結果3007は当該Hレベル期間T3101の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T3103の長さは8であり、測定結果3007は当該Hレベル期間T3103の立ち上がりで8となる。

【0403】そして、測定結果3007は、第1遅延回路3012、第2遅延回路3017に入力する。

【0404】Lレベル期間長測定回路3046は記録信号3004のLレベル期間の長さを測定し、測定結果3047を出力する。測定結果3047は、記録信号3006の測定したLレベルの直前のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T3102の長さは4であり、測定結果3047は当該Lレベルの直前Hレベル期間T3101の立ち上がりで4となり、Lレベル期間T3104の長さは3であり、測定結果3047は直前のHレベル期間T3103の立ち上がりで3となる。

【0405】そして、測定結果3047は、第2遅延回路3017に入力する。

【0406】第1遅延回路3012内で、測定結果3007は第1メモリ3013に入力され、第1メモリ3013から第1メモリ出力3014が出力される。ここで第1メモリ3013には、表14(a)のように、今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果3007に対応)に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0407】第2遅延回路3017内で、測定結果3007、3047は第2メモリ3018に入力され、第2メモリ3018から第2メモリ出力3019が出力される。ここで第2メモリ3018には、表14(b)のように、今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果3007に対応)と直後の無記録部分のあるべき長さ(測定結果3047に対応)の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0408】一方、記録信号3006は、パルス分割回路3008で、先頭パルス3009と中間パルス3010とラストパルス3011に分割される。本例では、先頭パルス3009は記録信号3006の立ち上がりで立ち上がり、Tw後に立ち下がる信号であり、中間パルス3010は記録信号3006の立ち上がりからTw後に

立ち上がり記録信号 3 0 0 6 の立ち下りの T_w 前に立ち下がる信号であり、ラストパルス 3 0 1 1 は記録信号 3 0 0 6 の立ち下りの T_w 前に立ち上がり、記録信号 3 0 0 6 の立ち下りで立ち下がる信号である。記録信号 3 0 0 6 の H レベル期間が $2 T_w$ のときは中間パルスは発生しない。

【0 4 0 9】先頭パルス 3 0 0 9 は、第 1 可変遅延器 3 0 1 5 で第 1 メモリ出力 3 0 1 4 だけ遅延され、信号 3 0 1 6 となる。

【0 4 1 0】中間パルス 3 0 1 0 は、マルチパルス生成回路 3 0 2 2 に入力し、中間マルチパルス 3 0 2 5 となり、遅延量 K の固定遅延器 3 0 2 6 で遅延され、信号 3 0 2 7 となる。

【0 4 1 1】ラストパルス 3 0 1 1 は、マルチパルス生成回路 3 0 2 8 でラストマルチパルス 3 0 3 1 となり、セクタ 3 0 3 2 で選択され、信号 3 0 3 3 となり、第 2 可変遅延器 3 0 2 0 で、第 2 メモリ出力 3 0 1 9 にしたがって遅延され、信号 3 0 2 1 となる。

【0 4 1 2】信号 3 0 1 6 と信号 3 0 2 7 と信号 3 0 2 1 の OR 回路 3 0 3 4 による出力 3 0 3 5 がセクタ 3 0 3 8 で選択され、レーザ駆動回路 3 0 4 0 に入力し、光源が駆動され、光駆動波形 3 0 4 1 となり、記録マーク 3 1 0 1、3 1 0 2 が形成される。

【0 4 1 3】つぎに、スイッチ 3 0 4 4 が ON のときを、図 3 2 を用いて説明する。

【0 4 1 4】ゲート発生回路 3 0 4 2 は、測定結果 3 0 0 7 が 2 のときのみ H レベルを出力する。よって、セレクト信号 3 0 4 5 が、測定結果 3 0 0 7 が 2 のときに、H レベルになり、セクタ 3 0 3 2、3 0 3 8 が Y 入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス 3 0 1 1 が第 2 可変遅延器 3 0 2 0 に入力し、遅延され、信号 3 0 2 1 となり、さらに、信号 3 0 2 1 と信号 3 0 1 6 の AND 回路 3 0 3 6 による出力 3 0 3 7 が、レーザ駆動回路 3 0 4 0 に導かれる。したがって、記録すべきマークが $2 T_w$ のときに、 T_w 以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0 4 1 5】測定結果 3 0 0 7 が 2 以外のときは、スイッチ 3 0 4 4 が OFF のときと同じである。

【0 4 1 6】このように、実施例 1 4 においては、記録マーク 3 1 0 1 あるいは 3 1 0 2 を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、記録マークの記録すべき長さに応じて、最初のパルスの駆動開始時刻を遅延して記録マーク長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、マーク終端を正しい位置に形成でき、かつ、記録マークの記録すべき長さと直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了して、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異と直後の無記録部分の長さによるマーク終端部分の熱履歴の差異を補正するので、記録マークの終端部分も正しい位置に形成することができる。また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0 4 1 7】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0 4 1 8】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 4 1 9】（実施例 1 5）図 3 4 の光駆動波形 3 3 2 1 は、本発明の実施例 1 5 における光駆動波形である。光駆動波形 3 3 2 1 は、記録信号 3 3 0 6 を固定量 K だけ遅延した、基準となる信号 3 4 0 0 に対して、記録パワーでの駆動開始時刻が遅延し、かつ、駆動終了時刻が早くなっている。

【0 4 2 0】駆動開始時刻の遅延量は、(1, 7) 変調を例にとれば、表 1 5 (a) に示すように、記録すべき記録マークの長さと直前の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0 4 2 1】

【表 1 5】

67

(a)

直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	第1メモリ3309の 格納値
2	2	B15 (2, 2)	K + B15 (2, 2)
2	3	B15 (2, 3)	K + B15 (2, 3)
2	4	B15 (2, 4)	K + B15 (2, 4)
2	5	B15 (2, 5)	K + B15 (2, 5)
2	6	B15 (2, 6)	K + B15 (2, 6)
2	7	B15 (2, 7)	K + B15 (2, 7)
2	8	B15 (2, 8)	K + B15 (2, 8)
3	2	B15 (3, 2)	K + B15 (3, 2)
3	3	B15 (3, 3)	K + B15 (3, 3)
.	.	.	.
N	M	B15 (N, M)	K + B15 (N, M)
.	.	.	.
8	6	B15 (8, 6)	K + B15 (8, 6)
8	7	B15 (8, 7)	K + B15 (8, 7)
8	8	B15 (8, 8)	K + B15 (8, 8)

68

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻の 遅延量	第2メモリ3314 の格納値
2	-E15 (2)	K - E15 (2)
3	-E15 (3)	K - E15 (3)
4	-E15 (4)	K - E15 (4)
5	-E15 (5)	K - E15 (5)
6	-E15 (6)	K - E15 (6)
7	-E15 (7)	K - E15 (7)
8	-E15 (8)	K - E15 (8)

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0422】たとえば、記録マーク3401の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3401 = 3Tw$ であり、記録すべき長さは $T3402 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、光駆動波形3321の記録パワーの駆動開始時刻はB15 (3, 2)だけ遅延し、記録マーク3402の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3403 = 4Tw$ であり、記録すべき長さは $T3404 = 8Tw$ であるので、光駆動波形3321の記録パワーの駆動開始時刻はB15 (4, 8)だけ遅延する。

【0423】駆動終了時刻の遅延量は、(1, 7)変調を例にとれば、表15 (b)に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0424】たとえば、記録マーク3401の記録すべき長さは $T3402 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、光駆動波形3321の記録パワーの駆動終了時刻はE15 (2)だけ早く終了し、記録マーク3402の記録すべき長さは $T3404 = 8Tw$ であるので、光駆動波形3321の記録パワーの駆動終了時刻はE15 (8)だけ早く終了する。

【0425】記録すべきマーク長がおなじならば、直前の無記録部分のあるべき長さが短いほど、前回の記録パワーの今回のマーク始端部分に及ぼす熱影響が大きく、

マーク始端の伸びが大きくなる。したがって、 $B15 (2, N) > B15 (3, N) > \dots > B15 (8, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0426】直前の無記録部分のあるべき長さがおなじならば、記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での昇温後の急冷条件が得やすいので、相変化媒体を用いた場合にはマーク始端の伸びが大きくなる。したがって、 $B15 (N, 2) > B15 (N, 3) > \dots > B15 (N, 8)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0427】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E15 (8) > E15 (7) > \dots > E15 (2)$ となる傾向がある。

【0428】その結果、直前の無記録部分の長短によるマーク始端部分での前回の記録パワーの熱影響の差異と記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異が補正でき、マーク始端部分は正しい位置に形成される。また、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異が補正できるので、マーク終端部分は、正しい位置に形成される。

【0429】なお、ここでは光駆動波形3321は記録

パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0430】図33は、本発明の実施例15の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0431】図33において3301はクロック発生回路、3302はクロック信号、3303は記録信号発生回路、3304は記録信号発生回路3303から出力される記録信号、3305はHレベル期間長測定回路、3306はHレベル期間長測定回路3305を通過後の記録信号、3307はHレベル期間測定結果出力、3308は第1遅延回路、3309は第1メモリ、3310は第1メモリ出力、3311は第1可変遅延器、3312はその出力、3313は第2遅延回路、3314は第2メモリ、3315は第2メモリ出力、3316は第2可変遅延器、3317はその出力、3318はAND回路、3319はその出力、3320はレーザ駆動回路、3321は光駆動波形、3322はLレベル期間長測定回路、3323はその測定結果出力である。

【0432】上記構成の動作について、図34のタイミングチャートを参照して説明する。

【0433】クロック発生回路3301は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック3302を出力する。dutyは可変である。

【0434】クロック発生回路3301からのチャンネルクロック信号3302の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路3303から出力された記録信号3304は、Hレベル期間長測定回路3305とLレベル期間長測定回路3322に入力される。

【0435】Hレベル期間長測定回路3305は記録信号3304のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号3306と、測定結果3307を出力する。測定結果3307は、記録信号3306の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T3402の長さは2であり、測定結果3307は当該Hレベル期間T3402の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T3404の長さは8であり、測定結果3307は当該Hレベル期間T3404の立ち上がりで8となる。

【0436】そして、測定結果3307は、第1遅延回路3308と第2遅延回路3313に入力する。

【0437】Lレベル期間長測定回路3322は記録信号3304のLレベル期間の長さを測定し、測定結果3323を出力する。測定結果3323は、記録信号3306の測定したLレベルの直後のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T3401の長さは3であり、測定結果33

23は当該Lレベル期間の直後のHレベル期間T3402の立ち上がりで3となり、Lレベル期間T3403の長さは4であり、測定結果3323は、直後Hレベル期間T3404の立ち上がりで4となる。

【0438】そして、測定結果3323は、第1遅延回路3308に入力する。

【0439】第1遅延回路3308内で、測定結果3307、3323は第1メモリ3309に入力され、第1メモリ3309から第1メモリ出力3310が出力される。ここでメモリ3309には、表15(a)のように、直前の無記録部分のあるべき長さ(測定結果3323に対応)と今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果3307に対応)の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第1可変遅延器3311は第1メモリ出力3310に従って、記録信号3306を遅延して信号3312を出力する。

【0440】また、第2遅延回路3313内で、測定結果3307は第2メモリ3314に入力され、第2メモリ3314から第2メモリ出力3315が出力される。ここで第2メモリ3314には、表15(b)のように、今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果3307に対応)に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第2可変遅延器3316は第2メモリ出力3315に従って、記録信号3306を遅延して信号3317を出力する。

【0441】信号3312と信号3317はAND回路3318に入力し、信号3319として出力する。

【0442】この出力信号3319は、レーザ駆動回路3320に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形3321となり、記録マーク3401、3402が形成される。

【0443】このように、実施例15においては、記録マーク3401、3402を形成するに際して、直前の無記録部分のあるべき長さ(測定結果3323)と今回の記録マークの記録すべき長さの組み合わせに応じて、記録パワーでの駆動開始時刻を遅延して、直前の無記録部分の長さによるマーク始端部分での熱影響の差異と今回の記録マークの長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、記録マークの始端を正しい位置に形成できる。かつ、記録マークの記録すべき長さに応じて、記録パワーでの駆動終了時刻を早く終了して、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正するので、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0444】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0445】(実施例16)図36の光駆動波形3541は、本発明の実施例16における光駆動波形である。

【0446】光駆動波形3541は、複数のパルスから

構成されている。さらに、光駆動波形 3541 は、記録信号 3506 を固定量 K だけ遅延した信号 3600 を基準とすると、最初のパルスの駆動開始時刻が遅延しており、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0447】最初のパルスの駆動開始遅延量は、(1、

(a)

直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	第1メモリ3518の 格納値
2	2	$B16(2, 2)$	$K+B16(2, 2)$
2	3	$B16(2, 3)$	$K+B16(2, 3)$
2	4	$B16(2, 4)$	$K+B16(2, 4)$
2	5	$B16(2, 5)$	$K+B16(2, 5)$
2	6	$B16(2, 6)$	$K+B16(2, 6)$
2	7	$B16(2, 7)$	$K+B16(2, 7)$
2	8	$B16(2, 8)$	$K+B16(2, 8)$
3	2	$B16(3, 2)$	$K+B16(3, 2)$
3	3	$B16(3, 3)$	$K+B16(3, 3)$
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	$B16(N, M)$	$K+B16(N, M)$
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	$B16(8, 6)$	$K+B16(8, 6)$
8	7	$B16(8, 7)$	$K+B16(8, 7)$
8	8	$B16(8, 8)$	$K+B16(8, 8)$

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻の 遅延量	第2メモリ3518 の格納値
2	$-E16(2)$	$K-E16(2)$
3	$-E16(3)$	$K-E16(3)$
4	$-E16(4)$	$K-E16(4)$
5	$-E16(5)$	$K-E16(5)$
6	$-E16(6)$	$K-E16(6)$
7	$-E16(7)$	$K-E16(7)$
8	$-E16(8)$	$K-E16(8)$

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0449】たとえば、記録マーク 3601 の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3601 = 2Tw$ であり、記録すべき長さは $T3602 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅) であるので、記録開始時刻は $B16(2, 2)$ だけ遅延し、記録マーク 3602 の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3603 = 4Tw$ であり、記録すべき長さは $T3604 = 8Tw$ であるので、記録開始時刻は $B16(4, 8)$ だけ遅延する。

【0450】最後のパルスの駆動終了遅延量は、(1、7) 変調を例にとれば、表 16 (b) に示すように、記録すべき記録マークの長さに対応して決められる。

【0451】たとえば、記録マーク 3601 の記録すべき長さは $T3602 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅) であるので、終了時刻は $E16(2)$ だけ早くなり、記録マーク 3602 の記録すべき長さは $T3604 = 8Tw$ であるので、終了時刻は $E16(8)$ だけ早くなる。

【0452】記録すべきマーク長がおなじならば、直前

7) 変調を例にとれば、表 16 (a) に示すように、直前の無記録部分のあるべき長さと記録すべき記録マークの長さの組み合わせに対応して決められる。

【0448】

【表 16】

の無記録部分の長さが短いほど、前回の記録パワーが今回の記録マークの始端部分に及ぼす熱影響が大きく、マーク始端の伸びは大きくなる。したがって、 $B16(2, N) > B16(3, N) > \dots > B16(8, N)$ (N は 2 から 8 の整数) となる傾向がある。

【0453】直前の無記録部分の長さがおなじならば、記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすく、昇温後急冷することでマークを形成する相変化媒体の場合には、マーク始端の伸びが大きい。したがって、 $B16(N, 2) > B16(N, 3) > \dots > B16(N, 8)$ となる傾向がある。

【0454】記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E16(8) > E16(7) > \dots > E16(2)$ (N は 2 から 8 の整数) となる傾向がある。

【0455】その結果、直前の無記録部分の長短による

マーク始端部分の熱影響の差異と記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異も補正できるので、記録マーク 3 6 0 1、3 6 0 2 の始端部分、終端部分は、正しい位置に形成される。

【0 4 5 6】なお、ここでは光駆動波形 3 5 4 1 は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと 0 との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 4 5 7】図 3 5 は、本発明の実施例 1 6 の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0 4 5 8】図 3 5 において 3 5 0 1 はクロック発生回路、3 5 0 2 はクロック信号、3 5 0 3 は記録信号発生回路、3 5 0 4 は記録信号発生回路 3 5 0 3 から出力される記録信号、3 5 0 5 は H レベル期間長測定回路、3 5 0 6 は H レベル期間長測定回路 3 5 0 5 を通過後の記録信号、3 5 0 7 は H レベル期間測定結果出力、3 5 0 8 はパルス分割回路、3 5 0 9 は先頭パルス、3 5 1 0 は中間パルス、3 5 1 1 はラストパルス、3 5 1 2 は第 1 遅延回路、3 5 1 3 は第 1 メモリ、3 5 1 4 は第 1 メモリ出力、3 5 1 5 は第 1 可変遅延器、3 5 1 6 はその出力、3 5 1 7 は第 2 遅延回路、3 5 1 8 は第 2 メモリ、3 5 1 9 は第 2 メモリ出力、3 5 2 0 は第 2 可変遅延器、3 5 2 1 はその出力、3 5 2 2 はマルチパルス生成回路、3 5 2 3 は反転回路、3 5 2 4 は AND 回路、3 5 2 5 は中間マルチパルス、3 5 2 6 は固定遅延器、3 5 2 7 はその出力、3 5 2 8 はマルチパルス生成回路、3 5 2 9 は反転回路、3 5 3 0 は AND 回路、3 5 3 1 はラストマルチパルス、3 5 3 2 はセクタ、3 5 3 3 はその出力、3 5 3 4 は OR 回路、3 5 3 5 はその出力、3 5 3 6 は AND 回路、3 5 3 7 はその出力、3 5 3 8 はセクタ、3 5 3 9 はその出力、3 5 4 0 はレーザ駆動回路、3 5 4 1 は光駆動波形、3 5 4 2 はゲート発生回路、3 5 4 3 はその出力、3 5 4 4 はスイッチ、3 5 4 5 はセレクト信号である。ここで、セレクト 3 5 3 2、3 5 3 8 は、セレクト信号 3 5 4 5 が L レベルのときは X 入力を選択して出力し、H レベルのときは Y 入力を選択して出力する。さらに、3 5 4 6 は L レベル期間長検出回路、3 5 4 7 はその測定結果出力である。

【0 4 5 9】はじめに、スイッチ 3 5 4 4 が OFF、すなわち、セレクト信号 3 5 4 5 が L レベルのときの動作について、図 3 6 のタイミングチャートを参照して説明する。

【0 4 6 0】クロック発生回路 3 5 0 1 は、周期が検出窓幅 Tw のチャンネルクロック 3 5 0 2 を出力する。duty は可変である。

【0 4 6 1】クロック発生回路 3 5 0 1 からのチャンネルクロック信号 3 5 0 2 の立ち上がりに同期して、記録信

号発生回路 3 5 0 3 から出力された記録信号 3 5 0 4 は、H レベル期間長測定回路 3 5 0 5 と L レベル期間長測定回路 3 5 4 6 に入力される。

【0 4 6 2】H レベル期間長測定回路 3 5 0 5 は記録信号 3 5 0 4 の H レベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号 3 5 0 6 と、測定結果 3 5 0 7 を出力する。測定結果 3 5 0 7 は、記録信号 3 5 0 6 の測定した H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、H レベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、H レベル期間 T 3 6 0 2 の長さは 2 であり、測定結果 3 5 0 7 は当該 H レベル期間 T 3 6 0 2 の立ち上がりで 2 となり、H レベル期間 T 3 6 0 4 の長さは 8 であり、測定結果 3 5 0 7 は当該 H レベル期間 T 3 6 0 4 の立ち上がりで 8 となる。

【0 4 6 3】そして、測定結果 3 5 0 7 は、第 1 遅延回路 3 5 1 2、第 2 遅延回路 3 5 1 7 に入力する。

【0 4 6 4】L レベル期間長測定回路 3 5 4 6 は記録信号 3 5 0 4 の L レベル期間の長さを測定し、測定結果 3 5 4 7 を出力する。測定結果 3 5 4 7 は、記録信号 3 5 0 6 の測定した L レベルの直後の H レベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、L レベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、L レベル期間 T 3 6 0 1 の長さは 2 であり、測定結果 3 5 4 7 は当該 L レベルの直後 H レベル期間 T 3 6 0 2 の立ち上がりで 2 となり、L レベル期間 T 3 6 0 3 の長さは 4 であり、測定結果 3 5 4 7 は直後の H レベル期間 T 3 6 0 4 の立ち上がりで 4 となる。

【0 4 6 5】そして、測定結果 3 5 4 7 は、第 1 遅延回路 3 5 1 2 に入力する。

【0 4 6 6】第 1 遅延回路 3 5 1 2 内で、測定結果 3 5 0 7、3 5 4 7 は第 1 メモリ 3 5 1 3 に入力され、第 1 メモリ 3 5 1 3 から第 1 メモリ出力 3 5 1 4 が出力される。ここで第 1 メモリ 3 5 1 3 には、表 1 6 (a) のように、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 5 4 7 に対応）と今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 3 5 0 7 に対応）との組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0 4 6 7】第 2 遅延回路 3 5 1 7 内で、測定結果 3 5 0 7 は第 2 メモリ 3 5 1 8 に入力され、第 2 メモリ 3 5 1 8 から第 2 メモリ出力 3 5 1 9 が出力される。ここで第 2 メモリ 3 5 1 8 には、表 1 6 (b) のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 3 0 0 7 に対応）に対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0 4 6 8】一方、記録信号 3 5 0 6 は、パルス分割回路 3 5 0 8 で、先頭パルス 3 5 0 9 と中間パルス 3 5 1 0 とラストパルス 3 5 1 1 に分割される。本例では、先頭パルス 3 5 0 9 は記録信号 3 5 0 6 の立ち上がりで立ち上がり、Tw 後に立ち下がる信号であり、中間パルス 3 5 1 0 は記録信号 3 5 0 6 の立ち上がりから Tw 後に

立ち上がり記録信号 3 5 0 6 の立ち下りの Tw 前に立ち下がる信号であり、ラストパルス 3 5 1 1 は記録信号 3 5 0 6 の立ち下りの Tw 前に立ち上がり、記録信号 3 5 0 6 の立ち下りで立ち下がる信号である。記録信号 3 5 0 6 の H レベル期間が 2 Tw のときは中間パルスは発生しない。

【0 4 6 9】先頭パルス 3 5 0 9 は、第 1 可変遅延器 3 5 1 5 で第 1 メモリ出力 3 5 1 4 だけ遅延され、信号 3 5 1 6 となる。

【0 4 7 0】中間パルス 3 5 1 0 は、マルチパルス生成回路 3 5 2 2 に入力し、中間マルチパルス 3 5 2 5 となり、遅延量 K の固定遅延器 3 5 2 6 で遅延され、信号 3 5 2 7 となる。

【0 4 7 1】ラストパルス 3 5 1 1 は、マルチパルス生成回路 3 5 2 8 でラストマルチパルス 3 5 3 1 となり、セクタ 3 5 3 2 で選択され、信号 3 5 3 3 となり、第 2 可変遅延器 3 5 2 0 で、第 2 メモリ出力 3 5 1 9 にしたがって遅延され、信号 3 5 2 1 となる。

【0 4 7 2】信号 3 5 1 6 と信号 3 5 2 7 と信号 3 5 2 1 の OR 回路 3 5 3 4 による出力 3 5 3 5 がセクタ 3 5 3 8 で選択され、レーザ駆動回路 3 5 4 0 に入力し、光源が駆動され、光駆動波形 3 5 4 1 となり、記録マーク 3 6 0 1、3 6 0 2 が形成される。

【0 4 7 3】つぎに、スイッチ 3 5 4 4 が ON のときを、図 3 7 を用いて説明する。

【0 4 7 4】ゲート発生回路 3 5 4 2 は、測定結果 3 5 0 7 が 2 のときのみ H レベルを出力する。よって、セレクト信号 3 5 4 5 が、測定結果 3 5 0 7 が 2 のときに、H レベルになり、セクタ 3 5 3 2、3 5 3 8 が Y 入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス 3 5 1 1 が第 2 可変遅延器 3 5 2 0 に入力し、遅延され、信号 3 5 2 1 となり、さらに、信号 3 5 2 1 と信号 3 5 1 6 の AND 回路 3 5 3 6 による出力 3 5 3 7 が、レーザ駆動回路 3 5 4 0 に導かれる。したがって、記録すべきマークが 2 Tw のときに、Tw 以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0 4 7 5】測定結果 3 5 0 7 が 2 以外のときは、スイッチ 3 5 4 4 が OFF のときと同じである。

【0 4 7 6】このように、実施例 1 6 においては、記録マーク 3 6 0 1 あるいは 3 6 0 2 を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、直前の無記録部分のあるべき長さで記録マークの記録すべき長さの組み合わせに応じて、最初のパルスの駆動開始時刻を遅延して、直前の無記録部分の長さによる前回の記録パワーの熱影響の差異と記録マーク長さによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、マーク終端を正しい位置に形成でき、かつ、記録マークの記録すべき長さに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了して、記録マークの長さによるマーク終端部分の熱蓄積の差異を補正するので、記録マークの終端部分も正しい位置に形成することができる。また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0 4 7 7】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0 4 7 8】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 4 7 9】（実施例 1 7）図 3 9 の光駆動波形 3 8 2 1 は、本発明の実施例 1 7 における光駆動波形である。光駆動波形 3 8 2 1 は、記録信号 3 8 0 6 を固定量 K だけ遅延した、基準となる信号 3 9 0 0 に対して、記録パワーでの駆動開始時刻が遅延し、かつ、駆動終了時刻が早くなっている。

【0 4 8 0】駆動開始時刻の遅延量は、(1、7) 変調を例にとれば、表 1 7 (a) に示すように、記録すべき記録マークの長さと直前の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0 4 8 1】

【表 1 7】

77

78

(a)

直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	第1メモリ3809の 格納値
2	2	B17 (2, 2)	K+B17 (2, 2)
2	3	B17 (2, 3)	K+B17 (2, 3)
2	4	B17 (2, 4)	K+B17 (2, 4)
2	5	B17 (2, 5)	K+B17 (2, 5)
2	6	B17 (2, 6)	K+B17 (2, 6)
2	7	B17 (2, 7)	K+B17 (2, 7)
2	8	B17 (2, 8)	K+B17 (2, 8)
3	2	B17 (3, 2)	K+B17 (3, 2)
3	3	B17 (3, 3)	K+B17 (3, 3)
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	B17 (N, M)	K+B17 (N, M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	B17 (8, 6)	K+B17 (8, 6)
8	7	B17 (8, 7)	K+B17 (8, 7)
8	8	B17 (8, 8)	K+B17 (8, 8)

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻の 遅延量	第2メモリ3814の 格納値
2	2	-E17 (2, 2)	K-E17 (2, 2)
2	3	-E17 (2, 3)	K-E17 (2, 3)
2	4	-E17 (2, 4)	K-E17 (2, 4)
2	5	-E17 (2, 5)	K-E17 (2, 5)
2	6	-E17 (2, 6)	K-E17 (2, 6)
2	7	-E17 (2, 7)	K-E17 (2, 7)
2	8	-E17 (2, 8)	K-E17 (2, 8)
3	2	-E17 (3, 2)	K-E17 (3, 2)
3	3	-E17 (3, 3)	K-E17 (3, 3)
.	.	.	.
.	.	.	.
N	M	-E17 (N, M)	K-E17 (N, M)
.	.	.	.
.	.	.	.
8	6	-E17 (8, 6)	K-E17 (8, 6)
8	7	-E17 (8, 7)	K-E17 (8, 7)
8	8	-E17 (8, 8)	K-E17 (8, 8)

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0482】たとえば、記録マーク3901の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3901 = 2Tw$ であり、記録すべき長さは $T3902 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、光駆動波形3821の記録パワーの駆動開始時刻はB17 (2, 2)だけ遅延し、記録マーク3902の直前の無記録部分のあるべき長さは $T3903 = 4Tw$ であり、記録すべき長さは $T3904 = 8Tw$ であるので、光駆動波形3821の記録パワーの駆動開始時刻はB17 (4, 8)だけ遅延する。

【0483】駆動終了時刻の遅延量は、(1, 7)変調を例にとれば、表17 (b)に示すように、記録すべき記録マークの長さとの直後の無記録部分のあるべき長さの組み合わせに対応して決められる。

【0484】たとえば、記録マーク3901の記録すべき長さは $T3902 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T3903 = 4$

Tw であるので、光駆動波形3821の記録パワーの駆動終了時刻はE17 (2, 4)だけ早く終了し、記録マーク3902の記録すべき長さは $T3904 = 8Tw$ であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T3905 = 3Tw$ であるので、光駆動波形3821の記録パワーの駆動終了時刻はE17 (8, 3)だけ早く終了する。

【0485】記録すべきマーク長がおなじならば、直前の無記録部分のあるべき長さが短いほど、前回の記録パワーの今回のマーク始端部分に及ぼす熱影響が大きく、マーク始端の伸びが大きくなる。したがって、 $B17 (2, N) > B17 (3, N) > \dots > B17 (8, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0486】直前の無記録部分のあるべき長さがおなじならば、記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での昇温後の急冷条件が得やすいので、相変化媒体を用いた場合にはマーク始端の伸びが大きくなる。したが

って、 $B17(N, 2) > B17(N, 3) > \dots > B17(N, 8)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0487】直後の無記録部分のあるべき長さがおなじならば、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E17(8, N) > E17(7, N) > \dots > E17(2, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0488】記録すべきマーク長がおなじならば、直後の無記録部分のあるべき長さが短いほど、マーク終端部分の温度が下がりにくく、終端ののびが大きい。したがって、 $E17(N, 2) > E17(N, 3) > \dots > E17(N, 8)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0489】その結果、直前の無記録部分の長短によるマーク始端部分での前回の記録パワーの熱影響の差異と、記録マーク長によるマーク始端部分での熱履歴の差異が補正でき、マーク始端部分は正しい位置に形成される。また、記録マーク長によるマーク終端部分の熱蓄積の差異と直後の無記録部分の長短によるマーク終端部分での熱履歴の差異が補正できるので、マーク終端部分は、正しい位置に形成される。

【0490】なお、ここでは光駆動波形3821は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0491】図38は、本発明の実施例17の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0492】図38において3801はクロック発生回路、3802はクロック信号、3803は記録信号発生回路、3804は記録信号発生回路3803から出力される記録信号、3805はHレベル期間長測定回路、3806はHレベル期間長測定回路3805を通過後の記録信号、3807はHレベル期間測定結果出力、3808は第1遅延回路、3809は第1メモリ、3810は第1メモリ出力、3811は第1可変遅延器、3812はその出力、3813は第2遅延回路、3814は第2メモリ、3815は第2メモリ出力、3816は第2可変遅延器、3817はその出力、3818はAND回路、3819はその出力、3820はレーザ駆動回路、3821は光駆動波形、3822はLレベル期間長測定回路1、3823はその測定結果出力、3824はLレベル期間長測定回路2、3825はその測定結果出力である。

【0493】上記構成の動作について、図39のタイミングチャートを参照して説明する。

【0494】クロック発生回路3801は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック3802を出力する。du

tyは可変である。

【0495】クロック発生回路3801からのチャンネルクロック信号3802の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路3803から出力された記録信号3804は、Hレベル期間長測定回路3805とLレベル期間長測定回路1(3822)とLレベル期間長測定回路2(3824)に入力される。

【0496】Lレベル期間長測定回路1(3822)は記録信号3804のLレベル期間の長さを測定し、測定結果3823を出力する。測定結果3823は、記録信号3806の測定したLレベルの直後のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T3901の長さは2であり、測定結果3823は当該Lレベル期間の直後のHレベル期間T3902の立ち上がりで2となり、Lレベル期間T3903の長さは4であり、測定結果3823は、直後Hレベル期間T3904の立ち上がりで4となる。

【0497】そして、測定結果3823は、第1遅延回路3808に入力する。

【0498】Hレベル期間長測定回路3805は記録信号3804のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号3806と、測定結果3807を出力する。測定結果3807は、記録信号3806の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T3902の長さは2であり、測定結果3807は当該Hレベル期間T3902の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T3904の長さは8であり、測定結果3807は当該Hレベル期間T3904の立ち上がりで8となる。

【0499】そして、測定結果3807は、第1遅延回路3808と第2遅延回路3813に入力する。

【0500】Lレベル期間長測定回路2(3824)は記録信号3804のLレベル期間の長さを測定し、測定結果3825を出力する。測定結果3825は、記録信号3806の測定したLレベルの直前のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T3903の長さは4であり、測定結果3825は当該Lレベル期間の直前のHレベル期間T3902の立ち上がりで4となり、Lレベル期間T3905の長さは3であり、測定結果3825は、直後Hレベル期間T3904の立ち上がりで3となる。

【0501】そして、測定結果3825は、第2遅延回路3813に入力する。

【0502】第1遅延回路3808内で、測定結果3807、3823は第1メモリ3809に入力され、第1メモリ3809から第1メモリ出力3810が出力される。ここで第1メモリ3809には、表17(a)のよ

うに、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 8 2 3 に対応）と今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 3 8 0 7 に対応）の組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第 1 可変遅延器 3 8 1 1 は第 1 メモリ出力 3 8 1 0 に従って、記録信号 3 8 0 6 を遅延して信号 3 8 1 2 を出力する。

【0 5 0 3】また、第 2 遅延回路 3 8 1 3 内で、測定結果 3 8 0 7、3 8 2 5 は第 2 メモリ 3 8 1 4 に入力され、第 2 メモリ 3 8 1 4 から第 2 メモリ出力 3 8 1 5 が出力される。ここで第 2 メモリ 3 8 1 4 には、表 1 7

(b) のように、今回の記録マークのあるべき長さ（測定結果 3 8 0 7 に対応）と直後の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 8 2 5 に対応）との組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。第 2 可変遅延器 3 8 1 6 は第 2 メモリ出力 3 8 1 5 に従って、記録信号 3 8 0 6 を遅延して信号 3 8 1 7 を出力する。

【0 5 0 4】信号 3 8 1 2 と信号 3 8 1 7 は AND 回路 3 8 1 8 に入力し、信号 3 8 1 9 として出力する。

【0 5 0 5】この出力信号 3 8 1 9 は、レーザ駆動回路 3 8 2 0 に入力されて、光源が駆動され、光駆動波形 3 8 2 1 となり、記録マーク 3 9 0 1、3 9 0 2 が形成される。

【0 5 0 6】このように、実施例 1 7 においては、記録マーク 3 9 0 1、3 9 0 2 を形成するに際して、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 8 2 3 に対応）と今回の記録マークの記録すべき長さ（測定結果 3 8 0 7 に対応）の組み合わせに応じて、記録パワーでの駆動開始時刻を遅延して、直前の無記録部分の長さの違いによ

るマーク始端部分での熱影響の差異と今回の記録マークの長さの違いによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、記録マークの始端を正しい位置に形成できる。かつ、記録マークの記録すべき長さ（測定結果 3 8 0 7 に対応）と直後の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 8 2 5 に対応）の組み合わせに応じて、記録パワーでの駆動終了時刻を早く終了して、記録マークの長さの違いによるマーク終端部分の熱蓄積の差異と、直後の無記録部分の長さの違いによるマーク終端部分での熱履歴の差異とを補正するので、記録マークの終端部分を正しい位置に形成することができる。

【0 5 0 7】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと 0 との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0 5 0 8】（実施例 1 8）図 4 1 の光駆動波形 4 0 4 1 は、本発明の実施例 1 8 における光駆動波形である。

【0 5 0 9】光駆動波形 4 0 4 1 は、複数のパルスから構成されている。さらに、光駆動波形 4 0 4 1 は、記録信号 4 0 0 6 を固定量 K だけ遅延した信号 4 1 0 0 を基準とすると、最初のパルスの駆動開始時刻が遅延しており、最後のパルスの駆動終了時刻が早くなっている。

【0 5 1 0】最初のパルスの駆動開始遅延量は、（1、7）変調を例にとれば、表 1 8（a）に示すように、直前の無記録部分のあるべき長さ（測定結果 3 8 2 3 に対応）と記録すべき記録マークの長さ（測定結果 3 8 0 7 に対応）の組み合わせに対応して決められる。

【0 5 1 1】

【表 1 8】

(a)

直前の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動開始時刻の 遅延量	第1メモリ4013の 格納値
2	2	B18 (2, 2)	K+B18 (2, 2)
2	3	B18 (2, 3)	K+B18 (2, 3)
2	4	B18 (2, 4)	K+B18 (2, 4)
2	5	B18 (2, 5)	K+B18 (2, 5)
2	6	B18 (2, 6)	K+B18 (2, 6)
2	7	B18 (2, 7)	K+B18 (2, 7)
2	8	B18 (2, 8)	K+B18 (2, 8)
3	2	B18 (3, 2)	K+B18 (3, 2)
3	3	B18 (3, 3)	K+B18 (3, 3)
.	.	.	.
N	M	B18 (N, M)	K+B18 (N, M)
.	.	.	.
8	6	B18 (8, 6)	K+B18 (8, 6)
8	7	B18 (8, 7)	K+B18 (8, 7)
8	8	B18 (8, 8)	K+B18 (8, 8)

(b)

今回の記録マーク のあるべき長さ ($\times Tw$)	直後の無記録部分 のあるべき長さ ($\times Tw$)	駆動終了時刻の 遅延量	第2メモリ4018の 格納値
2	2	-E18 (2, 2)	K-E18 (2, 2)
2	3	-E18 (2, 3)	K-E18 (2, 3)
2	4	-E18 (2, 4)	K-E18 (2, 4)
2	5	-E18 (2, 5)	K-E18 (2, 5)
2	6	-E18 (2, 6)	K-E18 (2, 6)
2	7	-E18 (2, 7)	K-E18 (2, 7)
2	8	-E18 (2, 8)	K-E18 (2, 8)
3	2	-E18 (3, 2)	K-E18 (3, 2)
3	3	-E18 (3, 3)	K-E18 (3, 3)
.	.	.	.
N	M	-E18 (N, M)	K-E18 (N, M)
.	.	.	.
8	6	-E18 (8, 6)	K-E18 (8, 6)
8	7	-E18 (8, 7)	K-E18 (8, 7)
8	8	-E18 (8, 8)	K-E18 (8, 8)

遅延量の- (マイナス) 符号は、早く終了することを意味する。

【0512】たとえば、記録マーク4101の直前の無記録部分のあるべき長さは $T4101 = 2Tw$ であり、記録すべき長さは $T4102 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であるので、記録開始時刻はB18 (2, 2)だけ遅延し、記録マーク4102の直前の無記録部分のあるべき長さは $T4103 = 4Tw$ であり、記録すべき長さは $T4104 = 8Tw$ であるので、記録開始時刻はB18 (4, 8)だけ遅延する。

【0513】最後のパルスの駆動終了遅延量は、(1, 7)変調を例にとれば、表18 (b)に示すように、記録すべき記録マークの長さとは直後の無記録部分のあるべき長さに対応して決められる。

【0514】たとえば、記録マーク4101の記録すべき長さは $T4102 = 2Tw$ (Tw は検出窓幅)であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T4103 = 4Tw$ であるので、終了時刻はE18 (2, 4)だけ早く

なり、記録マーク4102の記録すべき長さは $T4104 = 8Tw$ であり、直後の無記録部分のあるべき長さは $T4105 = 3Tw$ であるので、終了時刻はE18 (8, 3)だけ早くなる。

【0515】記録すべきマーク長がおなじならば、直前の無記録部分の長さが短いほど、前回の記録パワーが今回の記録マークの始端部分に及ぼす熱影響が大きく、マーク始端の伸びは大きくなる。したがって、 $B18 (2, N) > B18 (3, N) > \dots > B18 (8, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0516】直前の無記録部分の長さがおなじならば、記録すべきマーク長が短いほど、マーク始端部分での急冷条件が得られやすく、昇温後急冷することでマークを形成する相変化媒体の場合には、マーク始端の伸びが大きい。したがって、 $B18 (N, 2) > B18 (N, 3) > \dots > B18 (N, 8)$ となる傾向がある。

40

50

【0517】直後の無記録部分の長さがおなじなら、記録すべきマーク長が長いほど、マーク終端部分での熱蓄積の影響が大きく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E18(8, N) > E18(7, N) > \dots > E18(2, N)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0518】記録すべきマーク長がおなじならば、直後の無記録部分の長さが短いほど、マーク終端部分の温度が下がりにくく、終端の伸びが大きい。したがって、 $E18(N, 2) > E18(N, 3) > \dots > E18(N, 8)$ (N は2から8の整数)となる傾向がある。

【0519】その結果、直前の無記録部分の長さの違いによるマーク始端部分の熱影響の差異と記録マーク長の違いによるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マーク長の違いによるマーク終端部分での熱履歴の差異も補正できるので、記録マーク4101、4102の始端部分、終端部分は、正しい位置に形成される。

【0520】なお、ここでは光駆動波形4041は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、または、記録パワーと0との間など、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0521】図40は、本発明の実施例18の光駆動波形がえられる光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【0522】図40において4001はクロック発生回路、4002はクロック信号、4003は記録信号発生回路、4004は記録信号発生回路4003から出力される記録信号、4005はHレベル期間長測定回路、4006はHレベル期間長測定回路4005を通過後の記録信号、4007はHレベル期間測定結果出力、4008はパルス分割回路、4009は先頭パルス、4010は中間パルス、4011はラストパルス、4012は第1遅延回路、4013は第1メモリ、4014は第1メモリ出力、4015は第1可変遅延器、4016はその出力、4017は第2遅延回路、4018は第2メモリ、4019は第2メモリ出力、4020は第2可変遅延器、4021はその出力、4022はマルチパルス生成回路、4023は反転回路、4024はAND回路、4025は中間マルチパルス、4026は固定遅延器、4027はその出力、4028はマルチパルス生成回路、4029は反転回路、4030はAND回路、4031はラストマルチパルス、4032はセクタ、4033はその出力、4034はOR回路、4035はその出力、4036はAND回路、4037はその出力、4038はセクタ、4039はその出力、4040はレーザ駆動回路、4041は光駆動波形、4042はゲート発生回路、4043はその出力、4044はスイッチ、4045はセレクト信号である。ここで、セクタ4032、4038は、セレクト信号4045がLレベ

ルのときはX入力を選択して出力し、HレベルのときはY入力を選択して出力する。さらに、4046はLレベル期間長測定回路1、4047はその測定結果出力、4048はLレベル期間長測定回路2、4049はその測定結果出力である。

【0523】はじめに、スイッチ4044がOFF、すなわち、セレクト信号4045がLレベルのときの動作について、図41のタイミングチャートを参照して説明する。

【0524】クロック発生回路4001は、周期が検出窓幅Twのチャンネルクロック4002を出力する。du tyは可変である。

【0525】クロック発生回路4001からのチャンネルクロック信号4002の立ち上がりに同期して、記録信号発生回路4003から出力された記録信号4004は、Hレベル期間長測定回路4005とLレベル期間長測定回路1(4046)とLレベル期間長測定回路2(4048)に入力される。

【0526】Lレベル期間長測定回路1(4046)は記録信号4004のLレベル期間の長さを測定し、測定結果4047を出力する。測定結果4047は、記録信号4006の測定したLレベルの直後のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Lレベル期間T4101の長さは2であり、測定結果3407は当該Lレベルの直後のHレベル期間T4102の立ち上がりで2となり、Lレベル期間T4103の長さは4であり、測定結果4047は直後のHレベル期間T4104の立ち上がりで4となる。

【0527】そして、測定結果4047は、第1遅延回路4012に入力する。

【0528】Hレベル期間長測定回路4005は記録信号4004のHレベル期間の長さを測定し、あらためて記録信号4006と、測定結果4007を出力する。測定結果4007は、記録信号4006の測定したHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Hレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれば、Hレベル期間T4102の長さは2であり、測定結果4007は当該Hレベル期間T4102の立ち上がりで2となり、Hレベル期間T4104の長さは8であり、測定結果4007は当該Hレベル期間T4104の立ち上がりで8となる。

【0529】そして、測定結果4007は、第1遅延回路4012、第2遅延回路4017に入力する。

【0530】Lレベル期間長測定回路2(4048)は記録信号4004のLレベル期間の長さを測定し、測定結果4049を出力する。測定結果4049は、記録信号4006の測定したLレベルの直前のHレベルの立ち上がりに同期して出力される。すなわち、Lレベル期間の長さをチャンネルクロックの個数であらわすことにすれ

ば、Lレベル期間T4103の長さは4であり、測定結果4049は当該Lレベルの直前のHレベル期間T4102の立ち上がりで4となり、Lレベル期間T4105の長さは3であり、測定結果4049は直前のHレベル期間T4104の立ち上がりで3となる。

【0531】そして、測定結果4049は、第2遅延回路4017に入力する。

【0532】第1遅延回路4012内で、測定結果4007、4047は第1メモリ4013に入力され、第1メモリ4013から第1メモリ出力4014が出力される。ここで第1メモリ4013には、表18(a)のように、直前の無記録部分のあるべき長さ(測定結果4047に対応)と今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果4007に対応)との組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0533】第2遅延回路4017内で、測定結果4007、4049は第2メモリ4018に入力され、第2メモリ4018から第2メモリ出力4019が出力される。ここで第2メモリ4018には、表18(b)のように、今回の記録マークのあるべき長さ(測定結果4007に対応)と直後の無記録部分のあるべき長さ(測定結果4049に対応)との組み合わせに対応して値が格納されており、対応した格納値が出力される。

【0534】一方、記録信号4006は、パルス分割回路4008で、先頭パルス4009と中間パルス4010とラストパルス4011に分割される。本例では、先頭パルス4009は記録信号4006の立ち上がりで立ち上がり、Tw後に立ち下がる信号であり、中間パルス4010は記録信号4006の立ち上がりからTw後に立ち上がり記録信号4006の立ち下がるTw前に立ち下がる信号であり、ラストパルス4011は記録信号4006の立ち下がるTw前に立ち上がり、記録信号4006の立ち下がりで立ち下がる信号である。記録信号4006のHレベル期間が2Twのときは中間パルスは発生しない。

【0535】先頭パルス4009は、第1可変遅延器4015で第1メモリ出力4014だけ遅延され、信号4016となる。

【0536】中間パルス4010は、マルチパルス生成回路4022に入力し、中間マルチパルス4025となり、遅延量Kの固定遅延器4026で遅延され、信号4027となる。

【0537】ラストパルス4011は、マルチパルス生成回路4028でラストマルチパルス4031となり、セクタ4032で選択され、信号4033となり、第2可変遅延器4020で、第2メモリ出力4019にしたがって遅延され、信号4021となる。

【0538】信号4016と信号4027と信号4021のOR回路4034による出力4035がセクタ4038で選択され、レーザ駆動回路4040に入力し、

光源が駆動され、光駆動波形4041となり、記録マーク4101、4102が形成される。

【0539】つぎに、スイッチ4044がONのときを、図42を用いて説明する。

【0540】ゲート発生回路4042は、測定結果4007が2のときのみHレベルを出力する。よって、セレクト信号4045が、測定結果4007が2のときに、Hレベルになり、セクタ4032、4038がY入力を選択して出力する。そのため、ラストパルス4011が第2可変遅延器4020に入力し、遅延され、信号4021となり、さらに、信号4021と信号4016のAND回路4036による出力4037が、レーザ駆動回路4040に導かれる。したがって、記録すべきマークが2Twのときに、Tw以下のパルス幅が作成でき、より小さいマークまで対応できる。

【0541】測定結果4007が2以外のときは、スイッチ4044がOFFのときと同じである。

【0542】このように、実施例18においては、記録マーク4101あるいは4102を形成するに際して、複数のパルスで駆動し、直前の無記録部分のあるべき長さ(測定結果4007)と記録マークの記録すべき長さ(測定結果4047)の組み合わせに応じて、最初のパルスの駆動開始時刻を遅延して、直前の無記録部分の長さの違いによる前回の記録パワーの熱影響の差異と記録マークの長さの違いによるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正するので、マーク始端を正しい位置に形成でき、かつ、記録マークの記録すべき長さに応じて、最後のパルスの駆動を早く終了して、記録マークの長さの違いによるマーク終端部分の熱蓄積の差異と直後の無記録部分の長さの違いによるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正するので、記録マークの終端部分も正しい位置に形成することができる。また、複数のパルス状に駆動することにより、媒体に与える熱負荷を軽減でき、繰り返し記録による劣化を軽減する効果もある。

【0543】また、パルス分割回路による、先頭パルス、中間パルス、ラストパルスの分割方法を変えることにより、各種パルスパターンに対応できる。

【0544】なお、ここでは光駆動波形は記録パワーと消去パワーの間で駆動しているが、記録パワーと再生パワーの間、記録パワーと0との間等、記録媒体にあわせて駆動すればよい。

【0545】(実施例19) 図43は本発明の第19の実施例における光学情報の記録方法の記録波形を示すものである。(43a)は最大反転間隔(以降Tmaxと表す)の変調データであり、(43b)は変調データ(43a)に相当する記録マークを形成するための記録波形であり、(43c)は形成される記録マークである。

【0546】(43d)は最小反転間隔(以降Tminと表す)の変調データであり、(43e)は変調データ(43d)に相当する記録マークを形成するための記録

波形であり、(43f)は形成される記録マークである。

【0547】記録波形(43b)は、第1番目のパルスとそれに続く $(T_{\max} - T_{\min}) / T_w$ 個(T_w は検出窓幅。以降 T_w で表す)の後続パルスから構成されており、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と前記第1番目のパルスの立ち上がり(E2)との間隔は x ($0 < x$)であり、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と前記第1番目のパルスの立ち下がり(E3)との間隔は $T_{\min} + y$ ($y < 0.5 T_w$)であり、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と第1番目の後続パルスの立ち上がり(E4)との間隔は $T_{\min} + 0.5 T_w - z$ ($0 \leq z < 0.5 T_w$)であり、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と第1番目の後続パルスの立ち下がり(E5)との間隔は $T_{\min} + T_w$ であり、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と第 n 番目の後続パルスの立ち上がり(n は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{\min}) / T_w$)との間隔は $T_{\min} + n T_w - 0.5 T_w - z$ ($0 \leq z < 0.5 T_w$)であり、変調データ(43a)の立ち上がり(E1)と第 n 番目(n は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{\min}) / T_w$)の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{\min} + n T_w$ である。

【0548】従って、第1番目のパルスの立ち下がり(E3)と最初の後続パルスの立ち上がり(E4)との間隔 T_1 は、 $0.5 T_w - z - y$ であり、後続パルス間の間隔 T_2 は、 $0.5 T_w - z$ であるので、 $y \neq 0$ のときに、 $T_1 \neq T_2$ という状態をとらう。

【0549】ここで、 x の設定により、記録マーク(43c)の伸び量 d_1 を補正できるので、 T_{\max} に相当する長さの記録マークが正しく記録できる。

【0550】なお、 x の設定のさいには、 $y = 0$ の状態を設定すればよい。

【0551】記録波形(43e)は、第1番目のパルスのみで構成されており、変調データ(43d)の立ち上がり(E6)と前記第1番目のパルスの立ち上がり(E7)との間隔は最大反転間隔のマークを正しく記録するよう設定した x ($0 < x$)であり、変調データ(43d)の立ち上がり(E6)と前記第1番目のパルスの立ち下がり(E8)との間隔は $T_{\min} + y$ ($y < 0.5 T_w$)である。

【0552】ここで、記録マーク(43f)が T_{\min} に相当する長さになるように y を設定することができる。

【0553】以上のように、記録波形(43b)により形成される記録マークの長さが最大反転間隔 T_{\max} に相当する長さになるように x を設定することができ、記録波形(43e)により形成される記録マークの長さが最小反転間隔 T_{\min} に相当する長さになるように y を設定することができるので、所望のマーク長を得ること

ができる。。

【0554】なお、記録波形(43b)(43e)において、ピークパワーとバイアスパワーとの間でパワー変調しているが、ライトワンス媒体や光磁気媒体に記録する時はピークパワーを記録パワーにし、バイアスパワーを再生パワーに設定すれば良いし、相変化媒体に記録するときはピークパワーを記録パワーにし、バイアスパワーを消去パワーに設定すれば良い。

【0555】(図44)は、第19の実施例における光学情報の記録方法を(1、7)変調に応用したときの記録波形を示したものである。

【0556】ここで、 $T_{\max} = 8 T_w$ 、 $T_{\min} = 2 T_w$ 、 $x = T_w$ 、 $y = 0.25 T_w$ 、 $z = 0$ とした。

【0557】(44a)は最大反転間隔 $8 T_w$ の変調データであり、(44b)は変調データ(44a)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0558】(44c)は $7 T_w$ の変調データであり、(44d)は変調データ(44c)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0559】(44e)は $6 T_w$ の変調データであり、(44f)は変調データ(44e)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0560】(44g)は $5 T_w$ の変調データであり、(44h)は変調データ(44g)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0561】(44i)は $4 T_w$ の変調データであり、(44j)は変調データ(44i)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0562】(44k)は $3 T_w$ の変調データであり、(44l)は変調データ(44k)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0563】(44m)は最小反転間隔 $2 T_w$ の変調データであり、(44n)は変調データ(44m)に相当する記録マークを形成するための記録波形である。

【0564】記録波形(44b)は、第1番目のパルスとそれに続く $(8 T_w - 2 T_w) / T_w = 6$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44a)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = T_w$ であり、変調データ(44a)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{\min} + y = 2.25 T_w$ であり、変調データ(44a)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{\min} + n T_w - 0.5 T_w - z = (1.5 + n) T_w$ であり、変調データ(44a)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{\min} + n T_w = (2 + n) T_w$ である。

【0565】記録波形(44d)は、第1番目のパルスとそれに続く $(7 T_w - 2 T_w) / T_w = 5$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44c)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は

$x = Tw$ であり、変調データ(44c)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y = 2.25Tw$ であり、変調データ(44c)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z = (1.5 + n)Tw$ であり、変調データ(44c)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + nTw = (2 + n)Tw$ である。

【0566】記録波形(44f)は、第1番目のパルスとそれに続く $(6Tw - 2Tw) / Tw = 4$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44e)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = Tw$ であり、変調データ(44e)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y = 2.25Tw$ であり、変調データ(44e)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z = (1.5 + n)Tw$ であり、変調データ(44e)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + nTw = (2 + n)Tw$ である。

【0567】記録波形(44h)は、第1番目のパルスとそれに続く $(5Tw - 2Tw) / Tw = 3$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44g)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = Tw$ であり、変調データ(44g)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y = 2.25Tw$ であり、変調データ(44g)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z = (1.5 + n)Tw$ であり、変調データ(44g)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + nTw = (2 + n)Tw$ である。

【0568】記録波形(44j)は、第1番目のパルスとそれに続く $(4Tw - 2Tw) / Tw = 2$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44i)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = Tw$ であり、変調データ(44i)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y = 2.25Tw$ であり、変調データ(44i)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z = (1.5 + n)Tw$ であり、変調データ(44i)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + nTw = (2 + n)Tw$ である。

【0569】記録波形(44l)は、第1番目のパルスとそれに続く $(3Tw - 2Tw) / Tw = 1$ 個の後続パルスから構成されており、変調データ(44k)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = Tw$ であり、変調データ(44k)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} +$

$+ y = 2.25Tw$ であり、変調データ(44k)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z = (1.5 + n)Tw$ であり、変調データ(44k)の立ち上がりと第 n 番目の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + nTw = (2 + n)Tw$ である。

【0570】記録波形(44n)は、第1番目のパルスのみで構成されており、変調データ(44m)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は $x = Tw$ であり、変調データ(44m)の立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y = 2.25Tw$ である。

【0571】また、以上の記録は計において、第1番目のパルスの立ち下がりと最初の後続パルスの立ち上がりとの間隔は、 $0.25Tw$ であり、後続パルス間の間隔は、 $0.5Tw$ であり、両者は異なる。

【0572】実際に、書換可能な相変化光ディスクに図44の記録方法で記録したときの、変調データ反転間隔にたいする形成された記録マークの長さを測定した結果を、従来方法と比較して、図45に示した。

【0573】用いたディスクの記録膜はGeTeSb系材料で、膜厚は250オングストロームとした。また記録膜の上下にZnS-SiO₂混合層が設けてある。基板はあらかじめトラックの形成してある5インチのポリカーボネイト基板を使用した。このディスクを回転させ、線速度6m/sにおいて、レーザ波長830nm、対物レンズNA0.5のヘッドを用いて、最短マーク長0.8μm(2Tw、Tw=67ns)で記録を行った。記録パワーは15.6mW、消去パワーは8mWである。

【0574】図45において、白丸は従来の記録方法による結果であり、変調データでの反転間隔よりも長い記録マークが形成されてしまう。これに対して、黒丸は本発明の実施例である図44の記録波形を用いた結果であり、変調データでの反転間隔とほぼ等しい長さの記録マークが形成された。即ち所望の長さの記録マークが得られた。

【0575】以上のように本実施例によれば、反転間隔Tに相当する記録マークを形成するための記録波形を、第1番目のパルスとそれに続く $(T - T_{min}) / Tw$ 個(T_{min} は最小反転間隔、Twは検出窓幅)の後続パルスから成る複数のパルス列で構成し、変調データの立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち上がりとの間隔は x ($0 < x$)であり、変調データの立ち上がりと前記第1番目のパルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + y$ (T_{min} は最小反転間隔、 $y < 0.5Tw$ 、Twは検出窓幅)であり、変調データの立ち上がりと第 n 番目(n は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{min}) / Tw$ 、 T_{min} は最小反転間隔、Twは検出窓幅)の後続パルスの立ち上がりとの間隔は $T_{min} + nTw - 0.5Tw - z$

($0 \leq z < 0.5 T_w$ 、 T_{min} は最小反転間隔、 T_w は検出窓幅)であり、変調データの立ち上がりとし第 n 番目(n は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{min}) / T_w$ 、 T_{min} は最小反転間隔、 T_w は検出窓幅)の後続パルスの立ち下がりとの間隔は $T_{min} + n T_w$ (T_{min} は最小反転間隔、 T_w は検出窓幅)であり、最大反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように x を設定し、最小反転間隔のマークが所望の長さに形成されるように y を設定して構成することにより、所望の長さのマークを得ることができる。

【0576】図46は本発明の第19の実施例における記録波形が得られる光学情報の記録装置のブロック図を示すものである。図46において、4600は周期が検出窓幅に等しいクロックを発生するクロック発生器、4601は入力データを変調する変調器、4602は前記変調器4601の出力から最小反転間隔のパルスを入力するパルス発生回路、4603は前記パルス発生回路4602の出力パルスの立ち上がりエッジを遅延させたパルスを入力する第1遅延回路、4604は前記第1遅延回路4603の出力パルスの立ち下がりエッジを遅延させたパルスを入力する第2遅延回路、4605は前記クロックと前記変調器4601の出力と前記パルス発生回路4602の出力を用いて複数パルス列を入力するマルチパルス発生回路、4606は前記第2の遅延回路4604の出力と前記マルチパルス発生回路4605の出力との論理和を入力する論理和回路、4607は前記論理和回路4606の出力を用いて光学ヘッドのレーザを駆動するレーザ駆動回路、4608は光学ヘッド、4609は光ディスクである。

【0577】以上のように構成された光学情報の記録装置について、図47を用いてその動作を説明する。

【0578】クロック発生器4600は、周期が検出窓幅 T_w のクロック(47b)を出力する。 $duty$ は可変である。

【0579】変調器4601は、前記クロック(47b)を入力して、前記クロックに同期した変調データ(47a)を出力する。

【0580】パルス発生回路4602は、前記変調データ(47a)を入力して、前記変調データ(47a)の立ち上がりから最小反転間隔 T_{min} のパルス幅を有するパルス(47c)を出力する。

【0581】第1遅延回路4603は、前記パルス(47c)を入力して、前記パルス(47c)の立ち上がりエッジを x だけ遅延させた第1遅延パルス(47d)を出力する。

【0582】第2遅延回路4604は、前記第1遅延パルス(47d)を入力して、前記第1遅延パルス(47d)の立ち下がりエッジを y だけ遅延させた第2遅延パルス(47e)を出力する。

【0583】マルチパルス発生回路4605は、前記変

調データ(47a)と前記パルス(47c)と前記クロック(47b)とを入力して、前記パルス(47c)の立ち下がりから前記変調データ(47a)の立ち下がりまでの期間で前記クロック(47b)と逆位相の信号を出力するようなマルチパルス(47f)を出力する。

【0584】論理和回路4606は、前記第2遅延パルス(47e)と前記マルチパルス(47f)を入力して、駆動信号(47g)を出力する。

【0585】レーザ駆動回路4608は、前記駆動信号(47g)に従って光学ヘッド8のレーザを光駆動波形(47h)のように駆動し、光ディスク4609に記録マークを形成する。

【0586】光駆動波形(47h)において、ピークパワーとバイアスパワーとの間でパワー変調しているが、ライトワンス媒体や光磁気媒体に記録する時はピークパワーを記録パワーにし、バイアスパワーを再生パワーに設定すれば良いし、相変化媒体に記録するときはピークパワーを記録パワーにし、バイアスパワーを消去パワーに設定すれば良い。

【0587】この構成により、第1遅延パルス(47d)の遅延量 x により最大反転間隔に相当する記録マークの長さを所望値にすることができ、かつ前記第2遅延パルス(47e)の遅延量 y により最小反転間隔に相当する記録マークの長さを所望値にすることができる。

【0588】

【発明の効果】第1発明では、今回の記録マークを形成する際に、この記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、記録マークの長さによる始端部分での熱履歴の差異を補正でき、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【0589】第2発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、今回の記録マークの長さによる始端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0590】第3発明では、今回の記録マークを形成する際に、この記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短

によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【0591】第4発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、この記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0592】第5発明では、今回の記録マークを形成する際に、この記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよびその無記録部分をはさむ状態で位置する一つ前の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。

【0593】第6発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、この記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよびその無記録部分をはさむ状態で位置する一つ前の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークを形成したときの熱が今回の記録マークの始端部分におよぼす影響を補正できるとともに、今回の記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異も補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端部分を形成することが可能になる。さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0594】第7発明では、今回の記録マークを形成する際に、この記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に

今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【0595】第8発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異が補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0596】第9発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異と、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【0597】第10発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異と、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの終端部分を形成することが可能になる。

【0598】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0599】第11発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0600】第12発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、そ

の記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異が補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異が補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0601】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0602】第13発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0603】第14発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、記録マークの長短によるマーク始端部分での熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次の記録マークとの距離によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0604】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0605】第15発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域

のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0606】第16発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0607】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0608】第17発明では、今回の記録マークを形成する際に、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成する場合の光照射の終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次のマークとの間隔によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0609】第18発明では、レーザ等の光源がパルス発光されるので、今回の記録マークを形成する際に、その記録マークの一つ前の記録マークを形成した際の熱影

10

20

30

40

50

響が減少されるとともに、今回の記録マークの直前の無記録部分の領域のあるべき長さおよび今回の記録マークのあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最初のパルスの開始時刻が変更され、かつ、今回の記録マークのあるべき長さおよび今回の記録マークの直後の無記録部分の領域のあるべき長さに応じて、今回の記録マークを形成するためのパルス発光における少なくとも最後のパルスの終了時刻が変更される。その結果、一つ前の記録マークの形成による今回の記録マークの始端部分におよぼす熱影響を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク始端部分の熱履歴の差異を補正でき、かつ、記録マークの長短によるマーク終端部分での熱蓄積の差異を補正でき、かつ、次のマークとの間隔によるマーク終端部分での熱履歴の差異を補正できるので、正しい位置に今回の記録マークの始端および終端部分を形成することが可能になる。

【0610】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【0611】第19発明では、最大反転間隔と最小反転間隔に相当する記録マークの長さを所望値にすることができる。

【0612】さらに、パルス発光により、媒体に与える熱負荷が軽減され、繰り返し記録による劣化が軽減される効果もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図2】図1の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図3】本発明の実施例2に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図4】図3の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図5】本発明の実施例3に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図6】図5の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図7】本発明の実施例4に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図8】図7の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図9】本発明の実施例5に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図10】図9の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図11】本発明の実施例6に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図12】図11の装置の動作説明に供するタイミング

チャートである。

【図13】本発明の実施例7に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図14】図13の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図15】本発明の実施例8に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図16】図15の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図17】図15の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図18】本発明の実施例9に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図19】図18の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図20】本発明の実施例10に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図21】図20の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図22】図20の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図23】本発明の実施例11に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図24】図23の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図25】本発明の実施例12に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図26】図25の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図27】図25の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図28】本発明の実施例13に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図29】図28の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図30】本発明の実施例14に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図31】図30の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図32】図30の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図33】本発明の実施例15に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図34】図33の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図35】本発明の実施例16に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図36】図35の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図37】図35の装置の動作説明に供するタイミング

チャートである。

【図 3 8】本発明の実施例 1 7 に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図 3 9】図 3 8 の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図 4 0】本発明の実施例 1 8 に係る光ディスク装置の記録系のブロック図である。

【図 4 1】図 4 0 の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図 4 2】図 4 0 の装置の動作説明に供するタイミング 10 チャートである。

【図 4 3】本発明の実施例 1 9 における記録波形図である。

【図 4 4】本発明の実施例 1 9 における (1 , 7) 変調での記録波形図である。

【図 4 5】本発明の実施例 1 9 における変調データにたいする記録マークの長さを示した図である。

【図 4 6】本発明の実施例 1 9 に係る光ディスク装置の

ブロック図である。

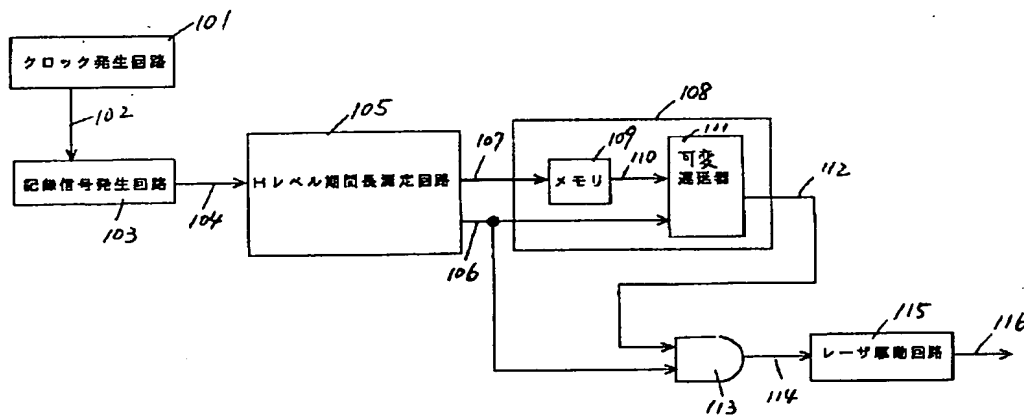
【図 4 7】図 4 6 の装置の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図 4 8】従来の記録方法での記録波形図。

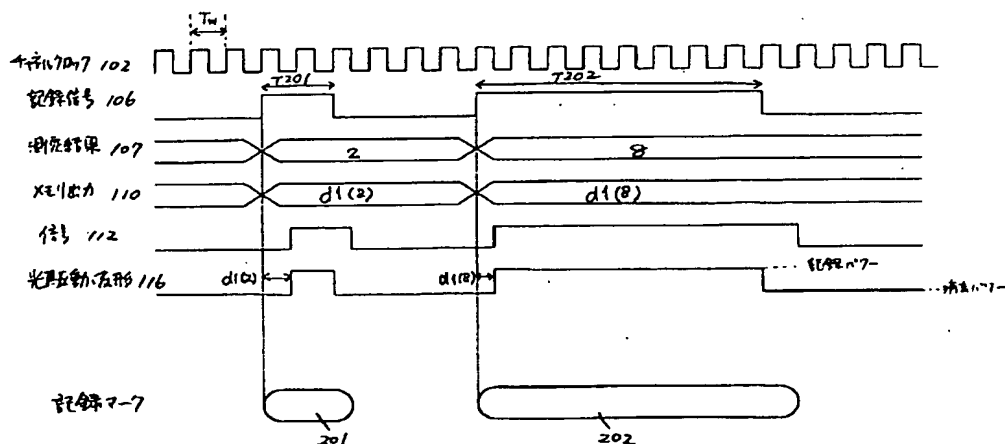
【符号の説明】

- 4 0 0 1 クロック発生回路
- 4 0 0 3 記録信号発生回路
- 4 0 0 5 Hレベル期間長測定回路
- 4 0 0 8 パルス分割回路
- 4 0 1 2 第 1 遅延回路
- 4 0 1 7 第 2 遅延回路
- 4 0 2 2 マルチパルス生成回路
- 4 0 2 8 マルチパルス生成回路
- 4 0 3 4 O R 回路
- 4 0 3 6 A N D 回路
- 4 0 4 0 レーザ駆動回路
- 4 0 4 1 光駆動波形

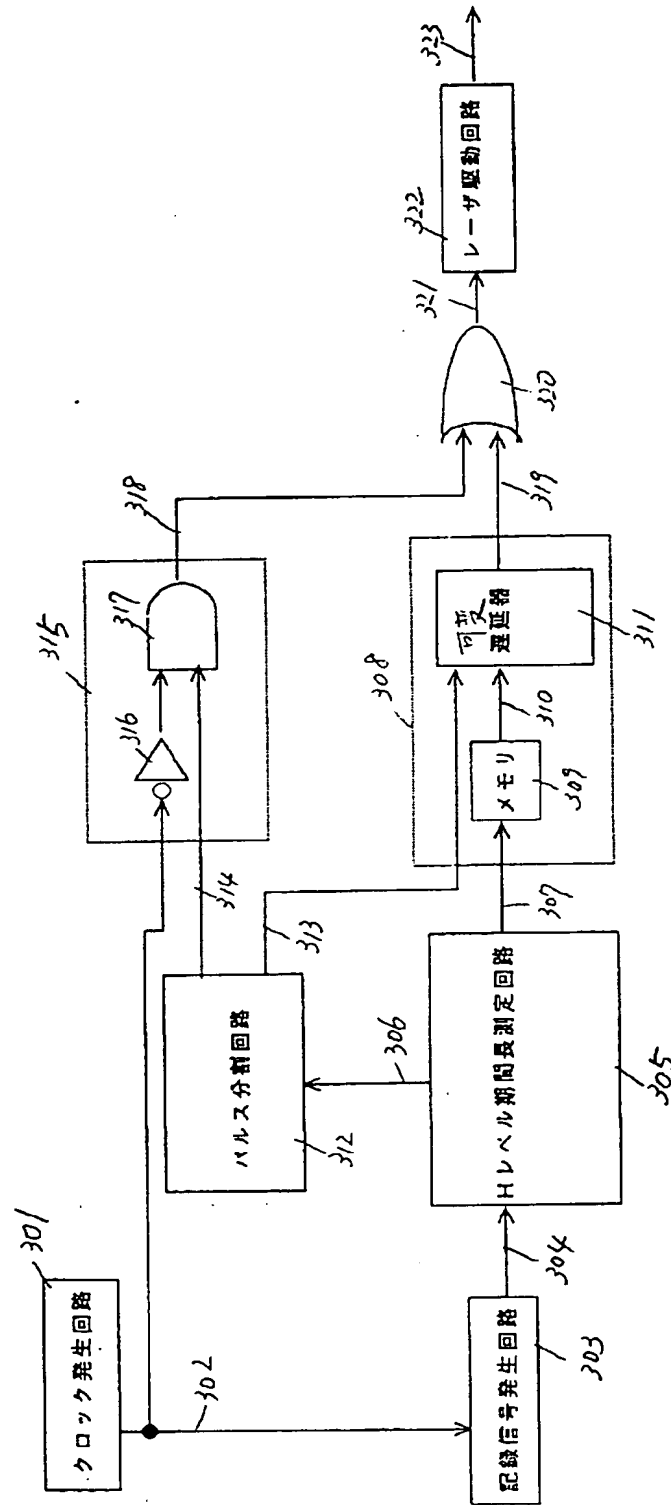
【図 1】



【図 2】



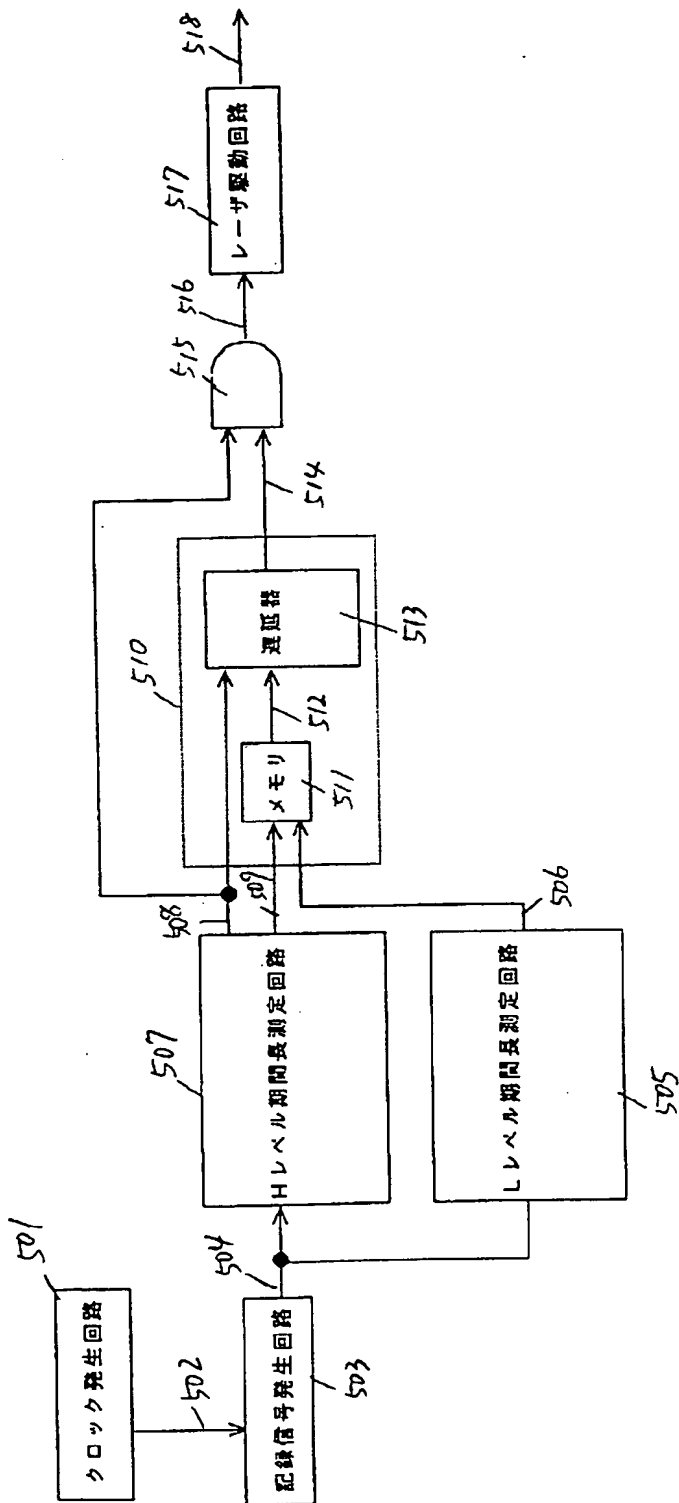
【図 3】



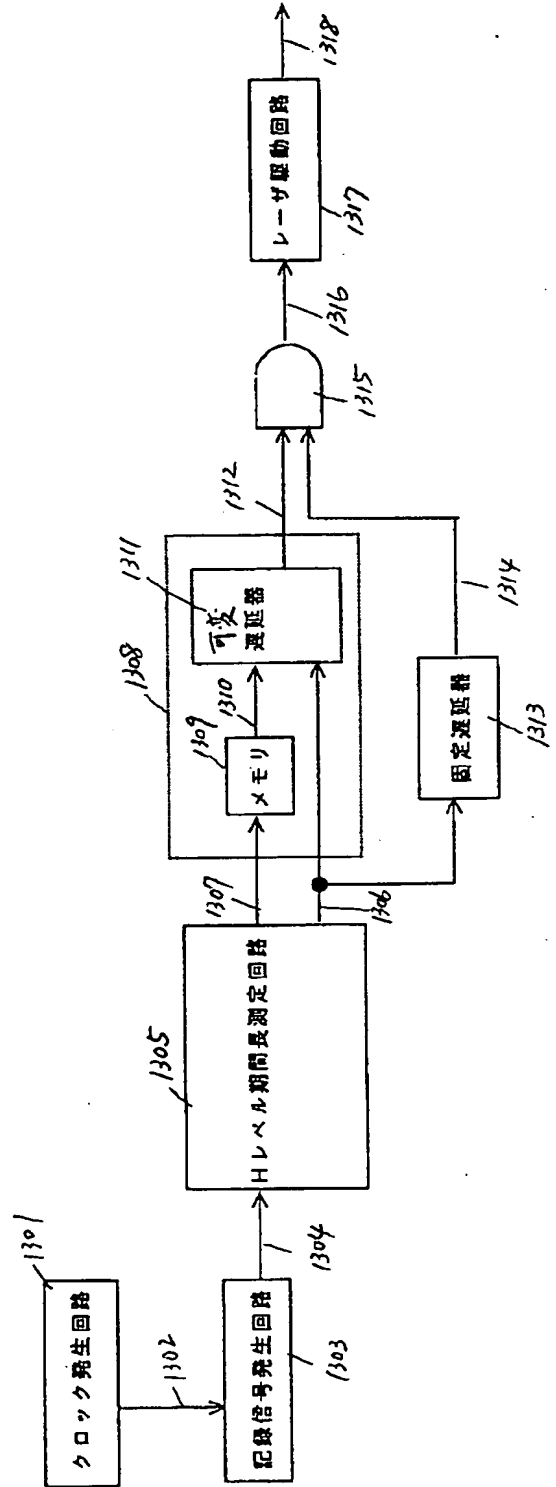
[illegible]

Timing diagram for the 74164 shift register. The diagram shows the relationship between the clock signal (pin 14, 502), the serial input (pin 1, 508), and the parallel data inputs (pins 2, 5, 6, 8, 3, 4, 7, 10). The diagram is divided into four time intervals: T601, T602, T603, and T604. The serial input is high during T601 and T602, and low during T603 and T604. The parallel data inputs are set to specific values during each interval: (2, 5) = 2, 5; (6, 8) = 6, 8; (3, 4) = 3, 4; (7, 10) = 7, 10. The output of the shift register is shown as a series of pulses, with the first pulse occurring at the start of T601 and the last pulse occurring at the end of T604.

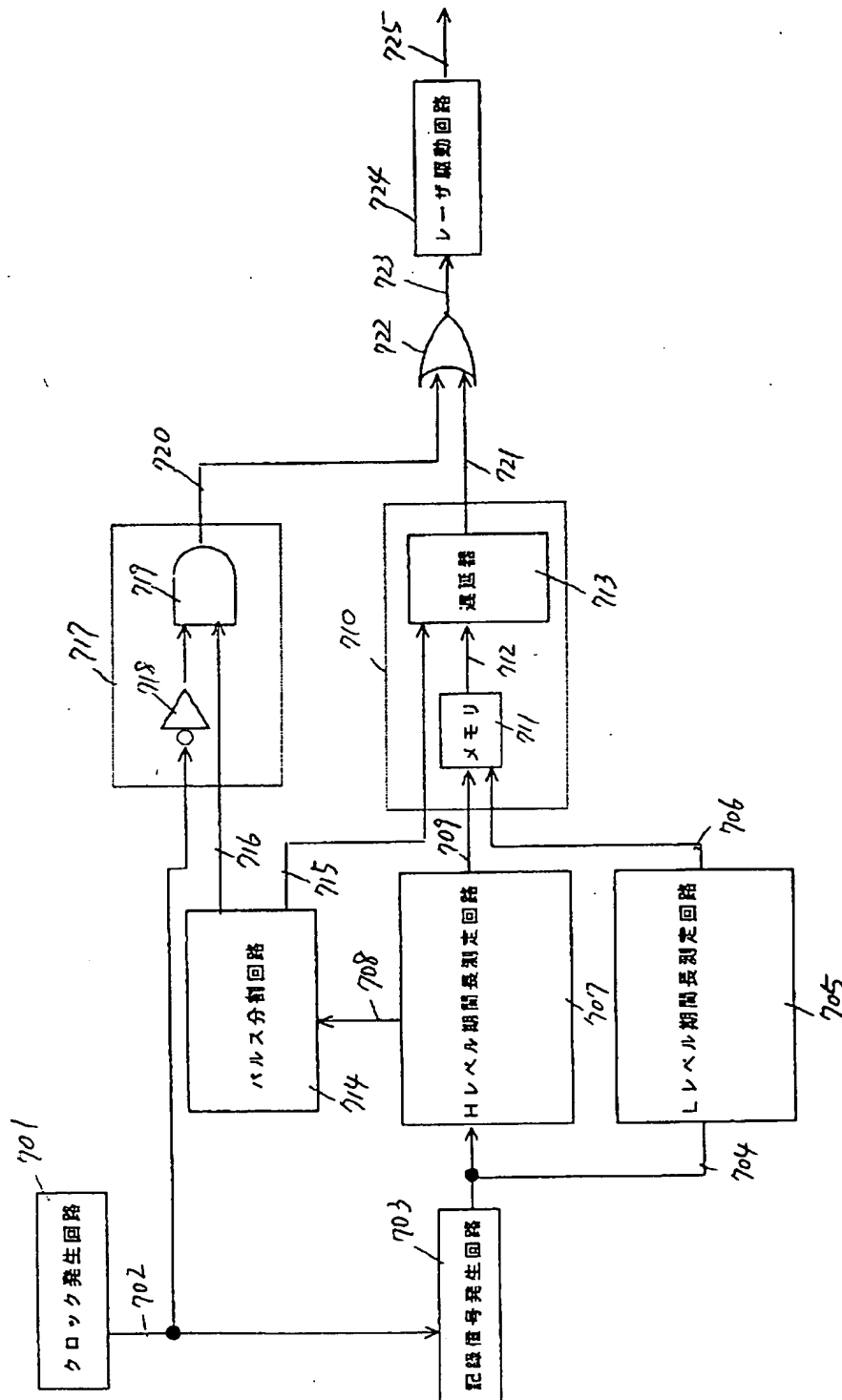
【図 5】



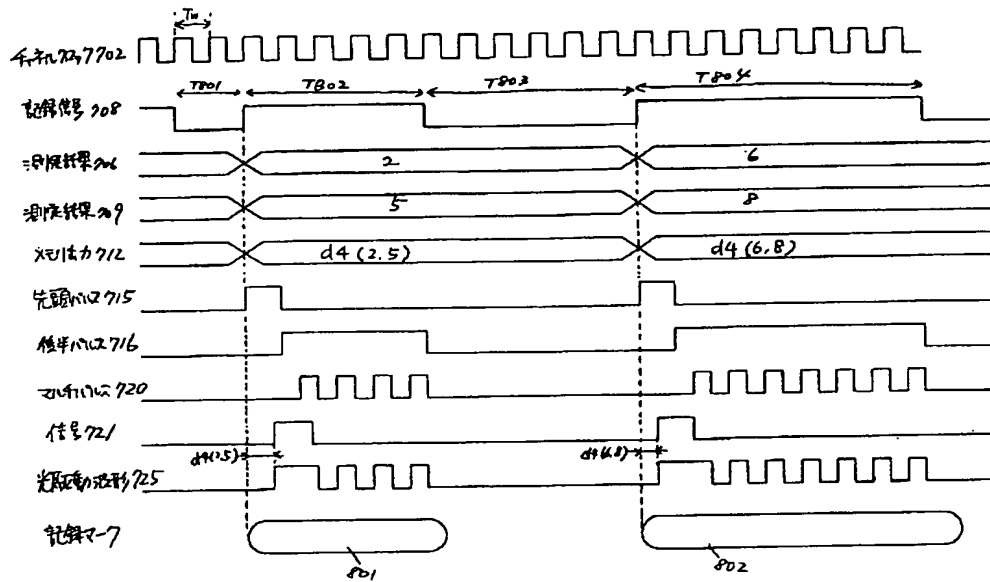
【図 13】



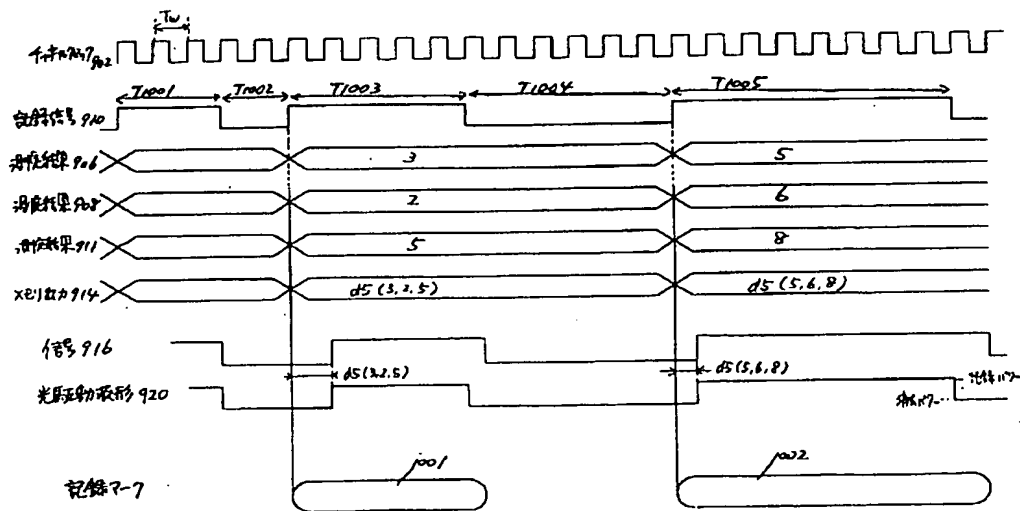
【図 7】



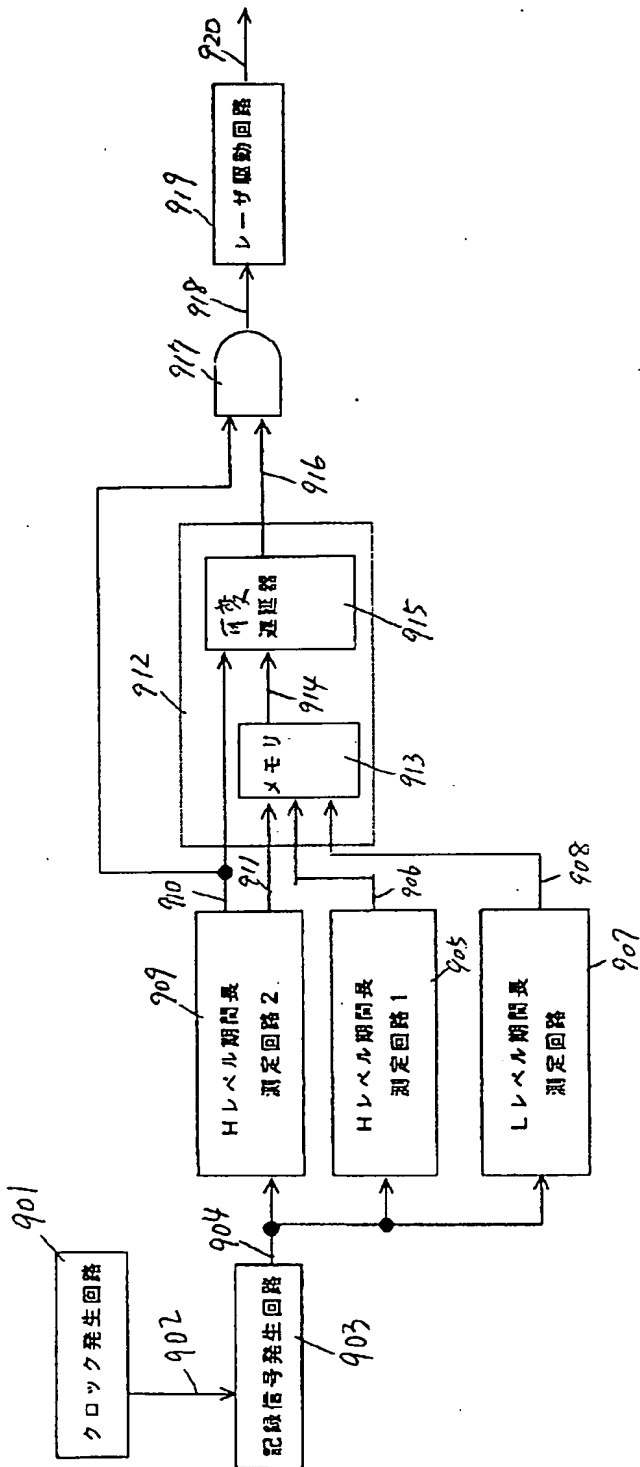
【図 8】



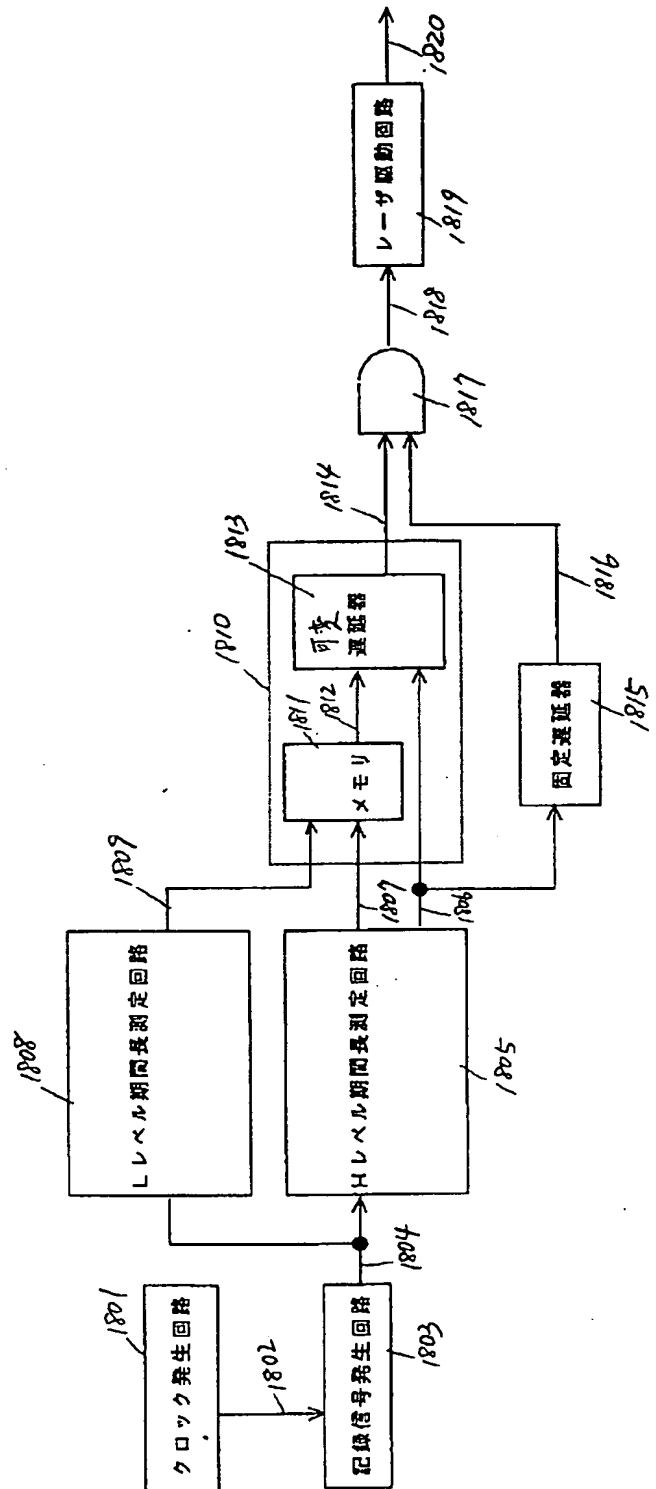
【図 10】



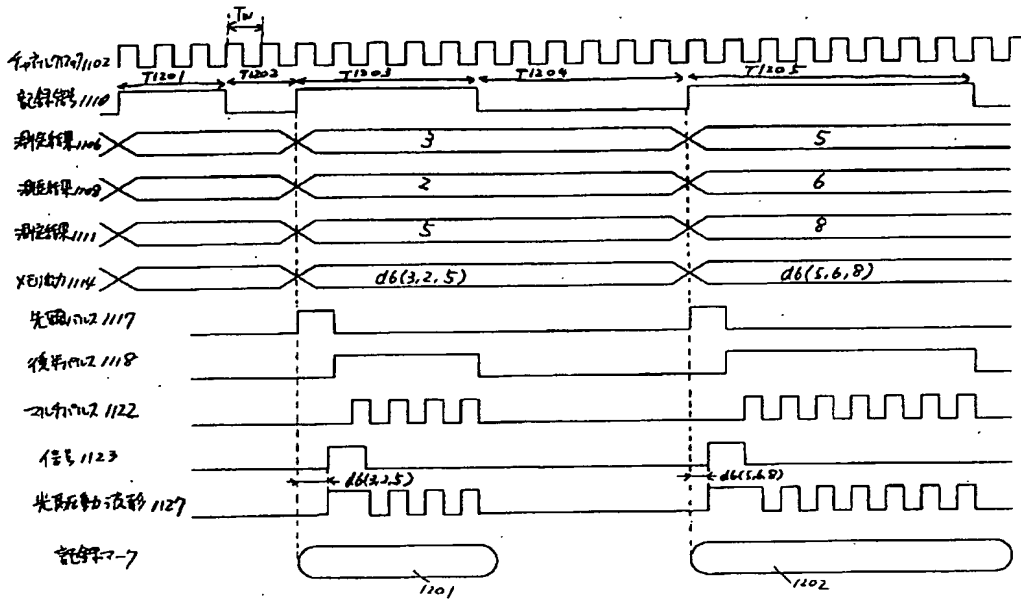
【図 9】



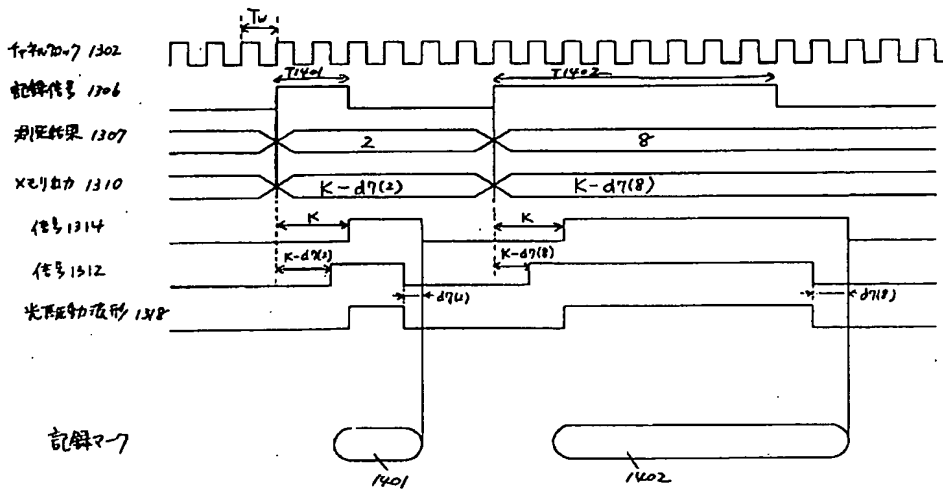
【図 18】



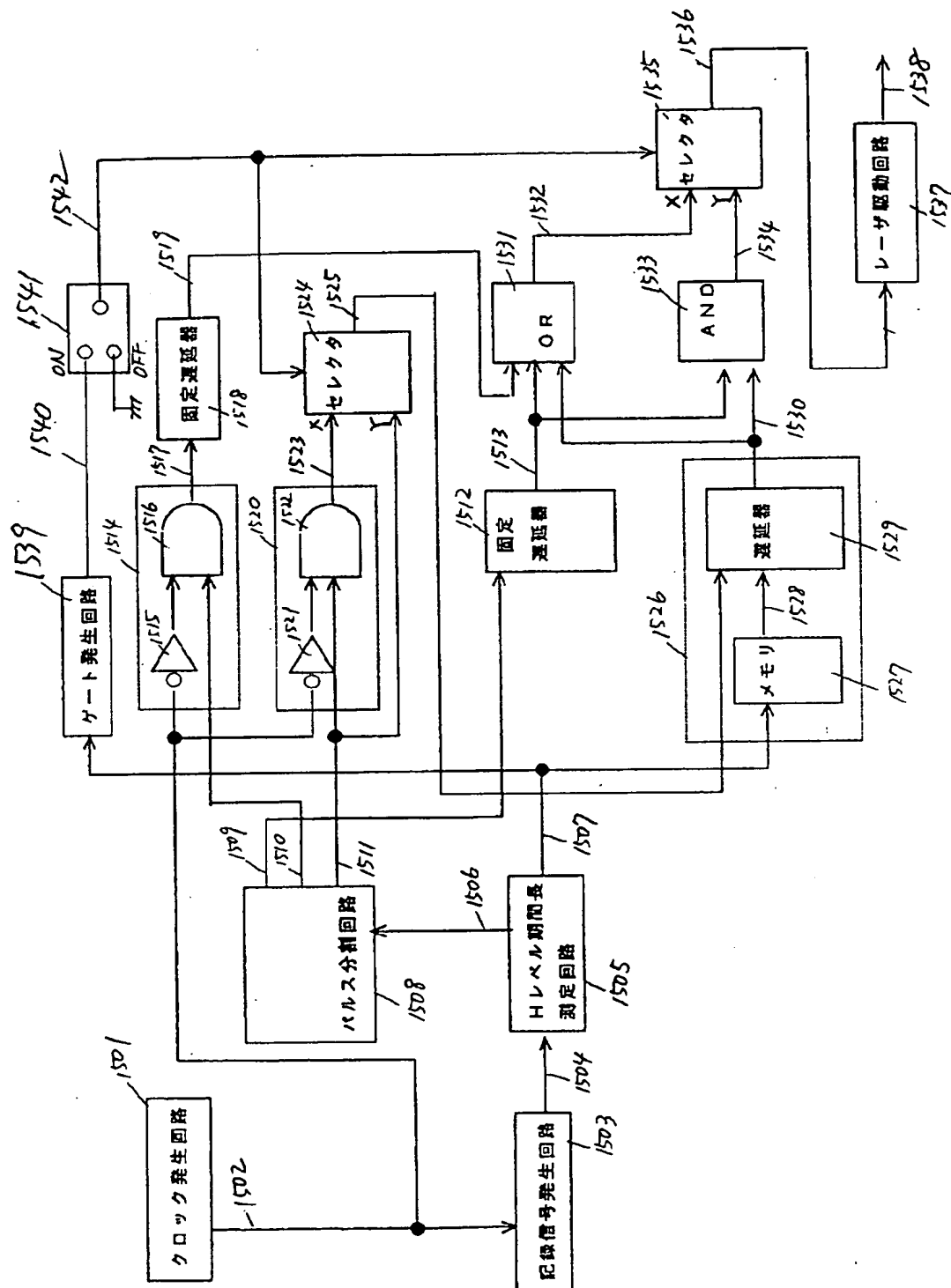
【図 1 2】



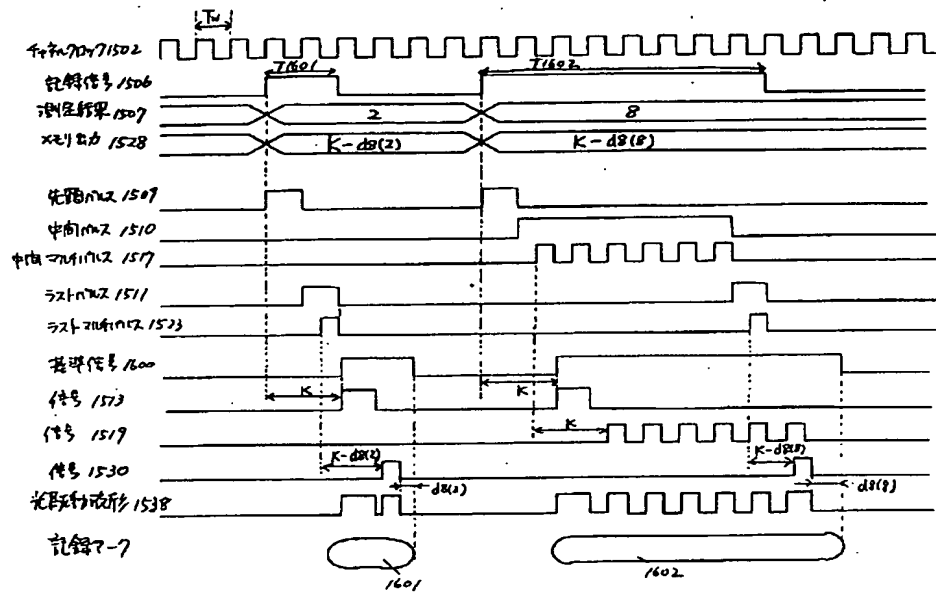
【図 1 4】



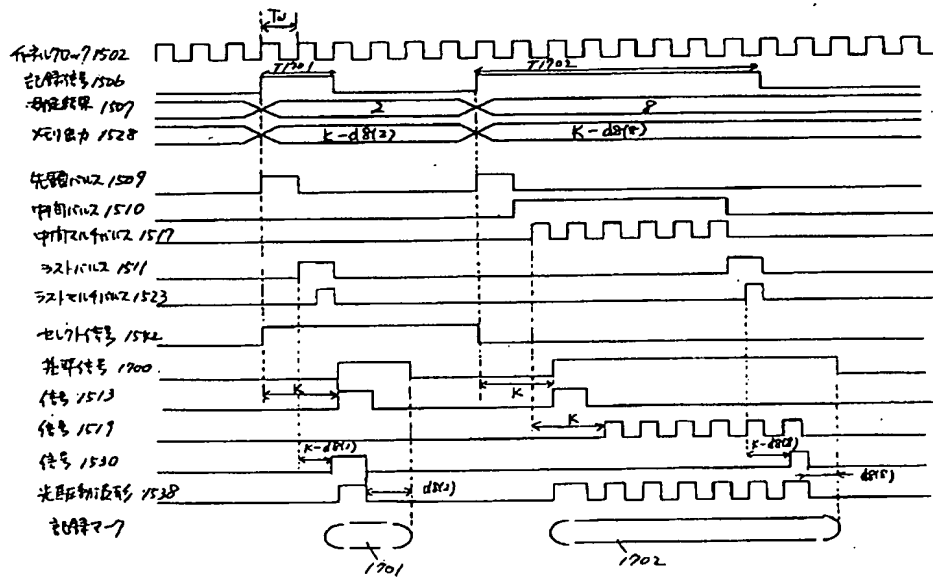
【図 15】



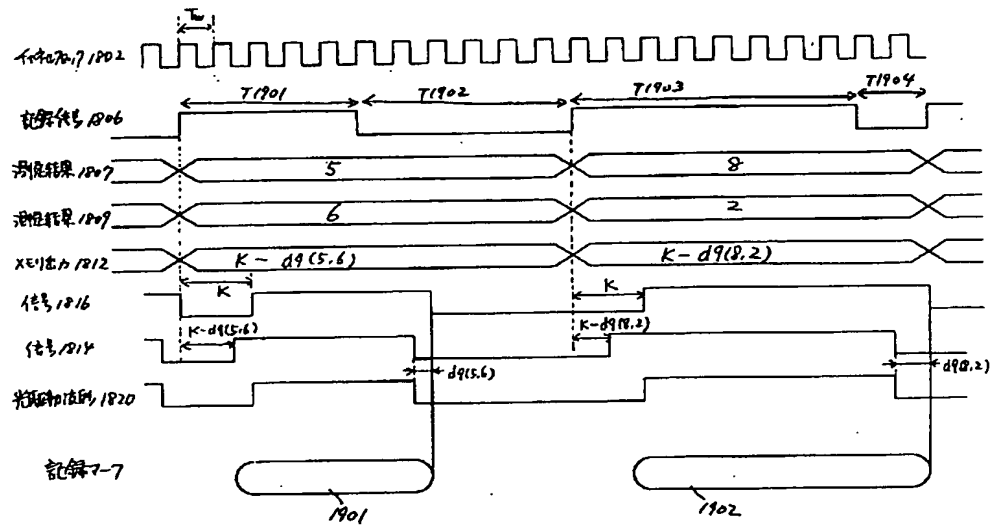
【図 16】



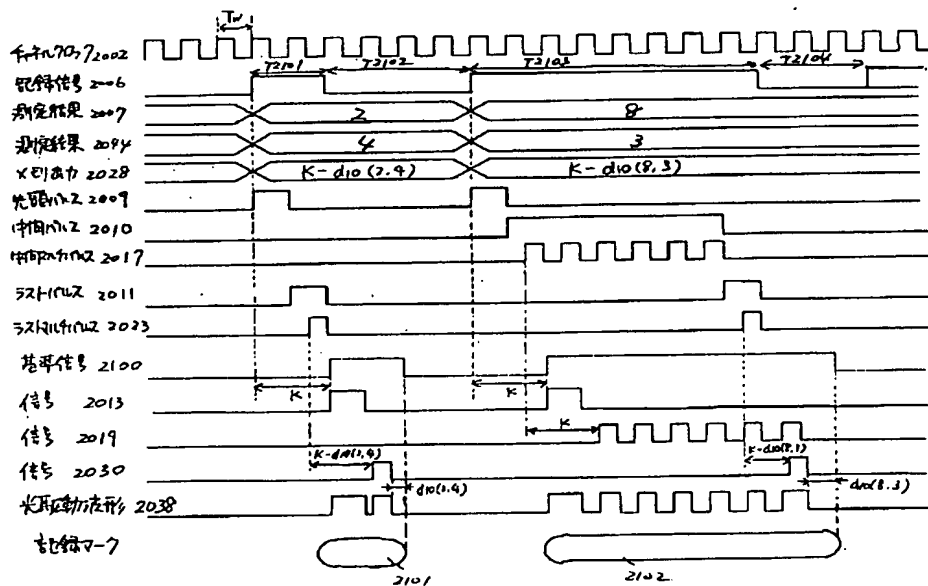
【図 17】



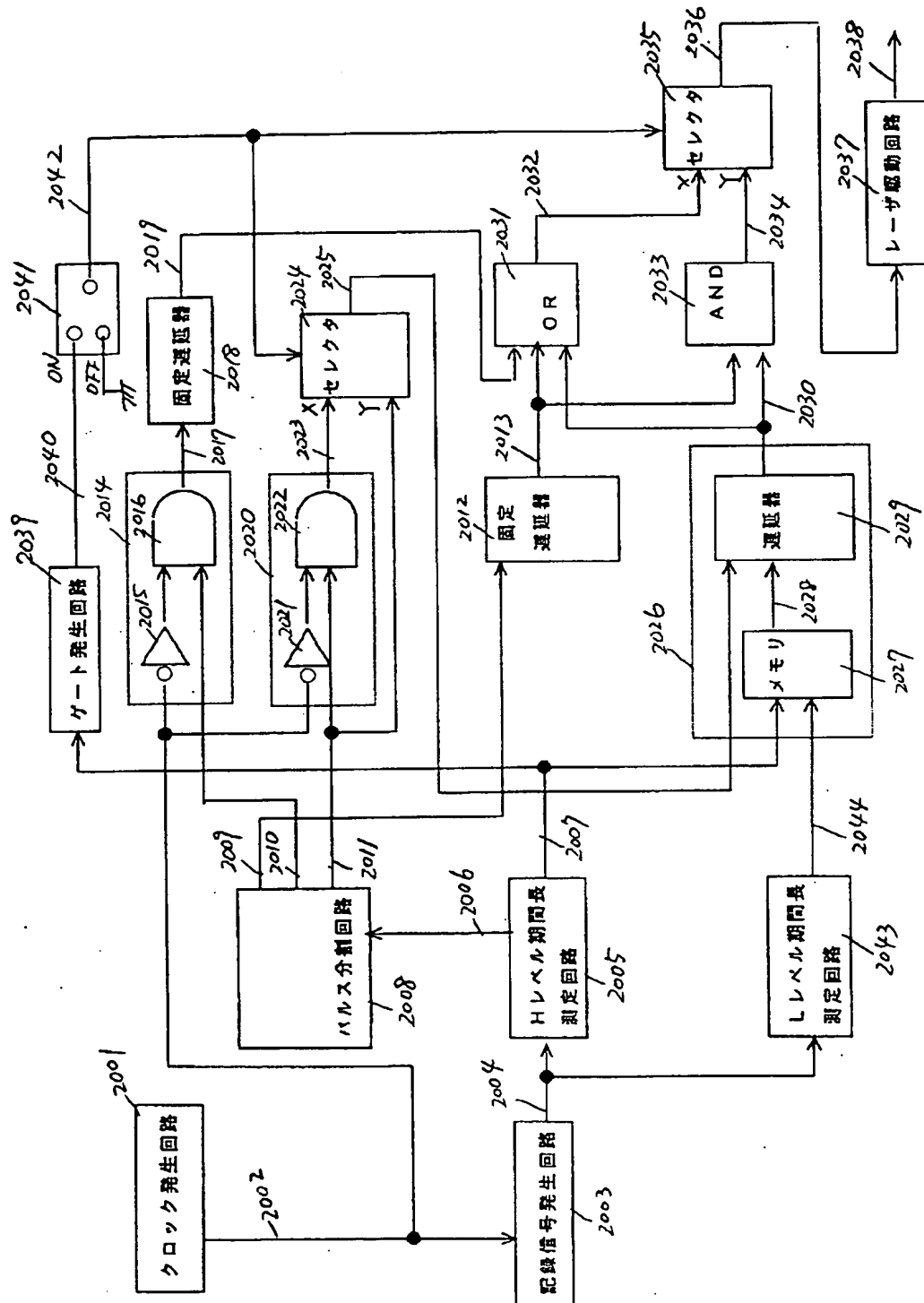
【図 19】



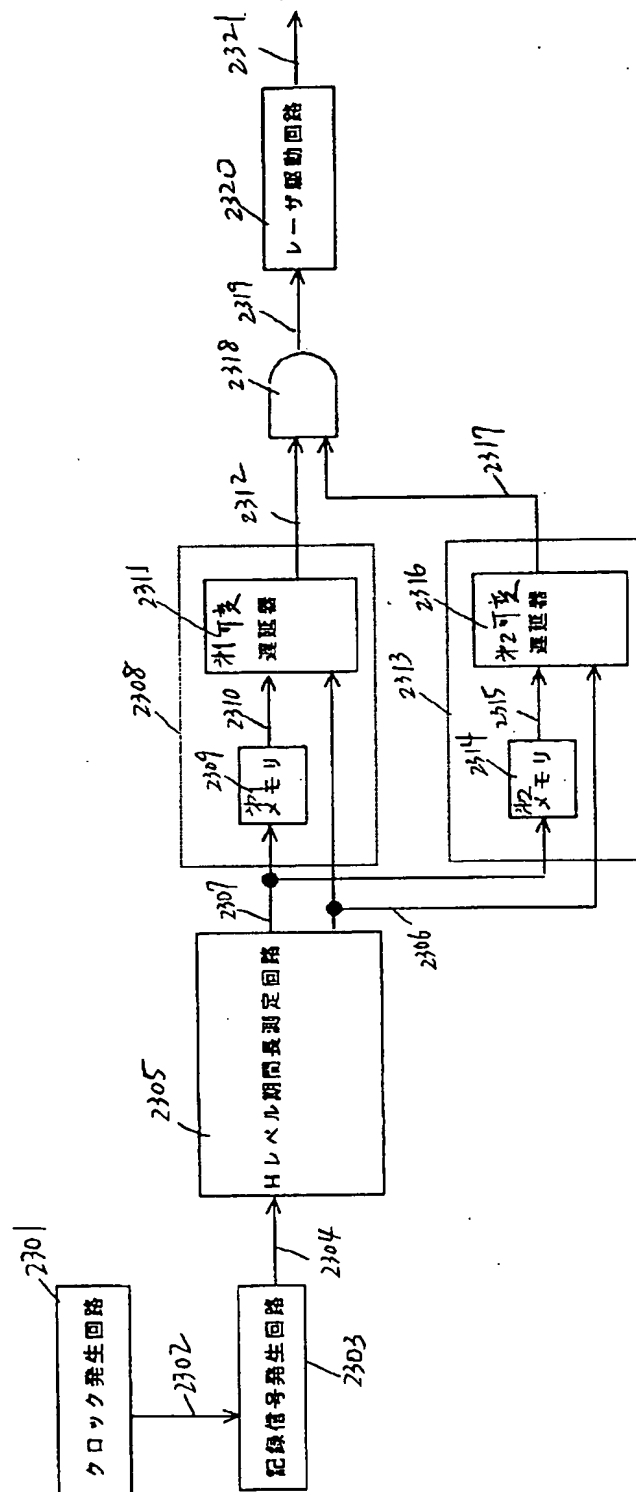
【図 21】



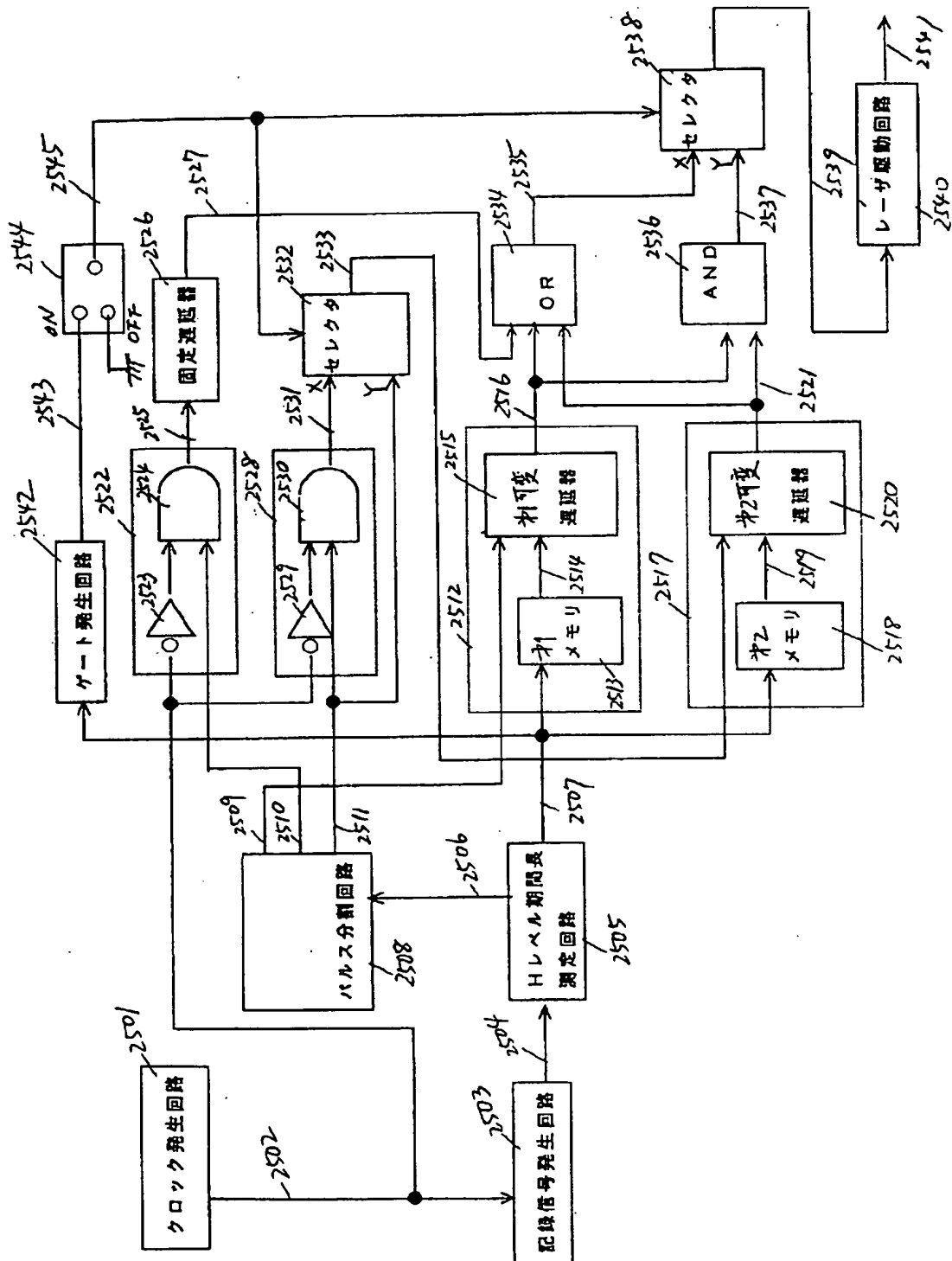
【図 20】



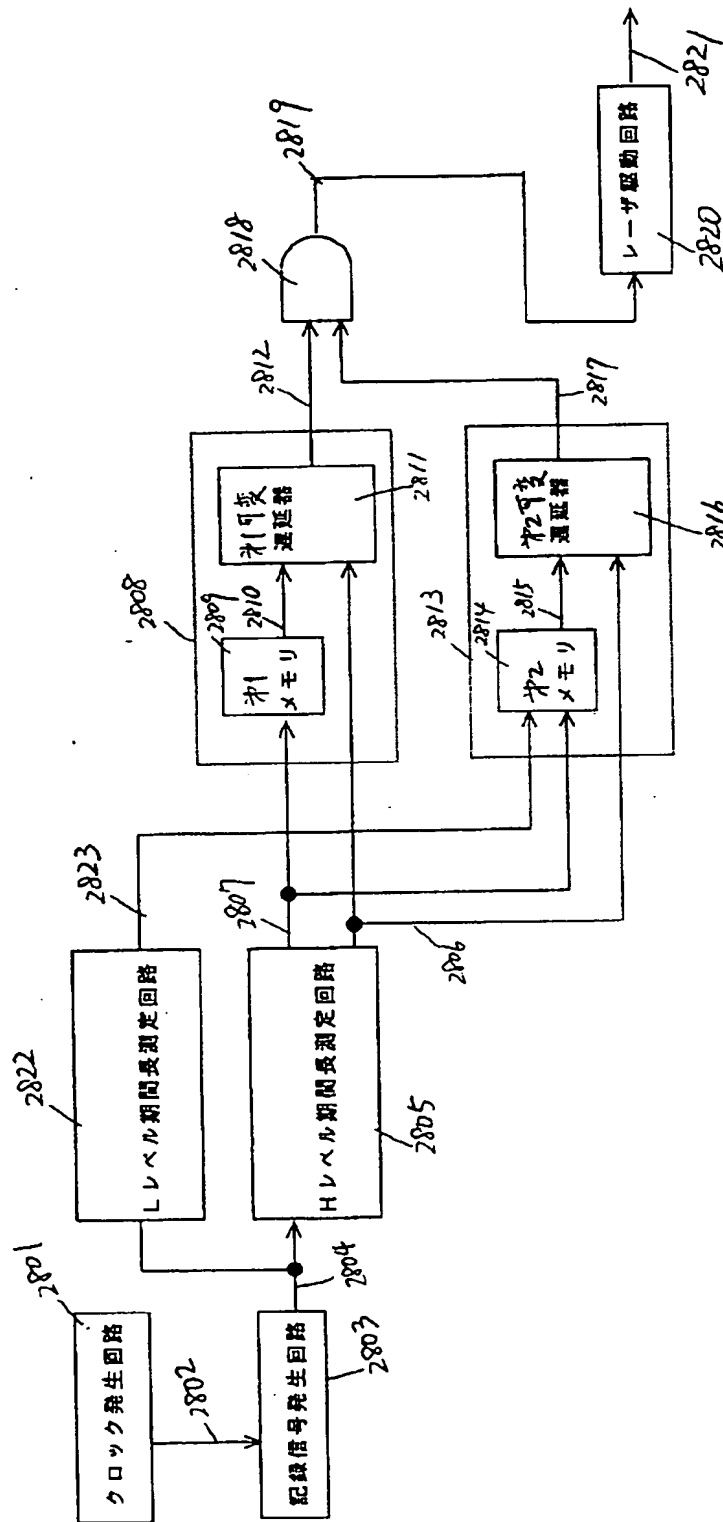
【図 23】



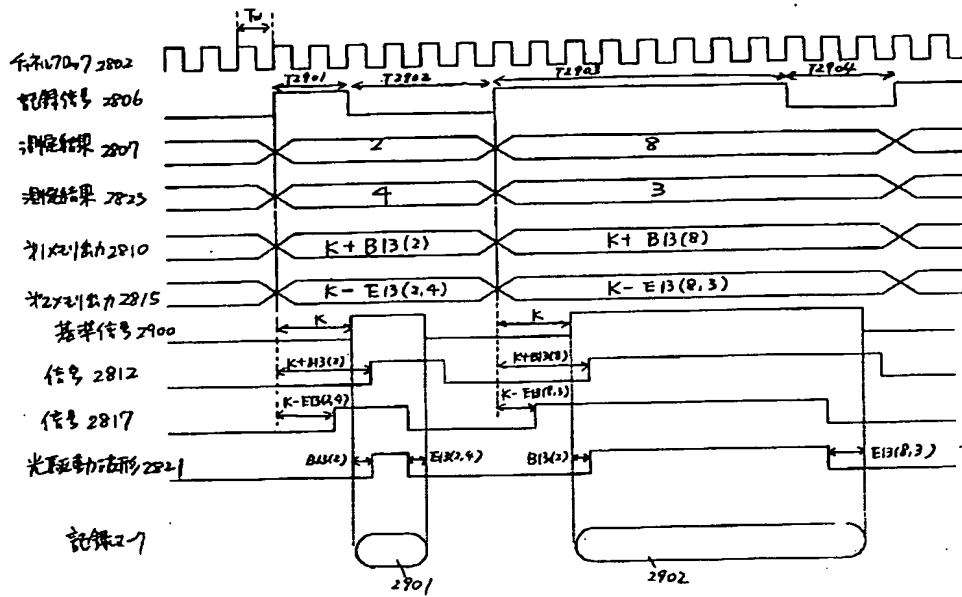
【図 25】



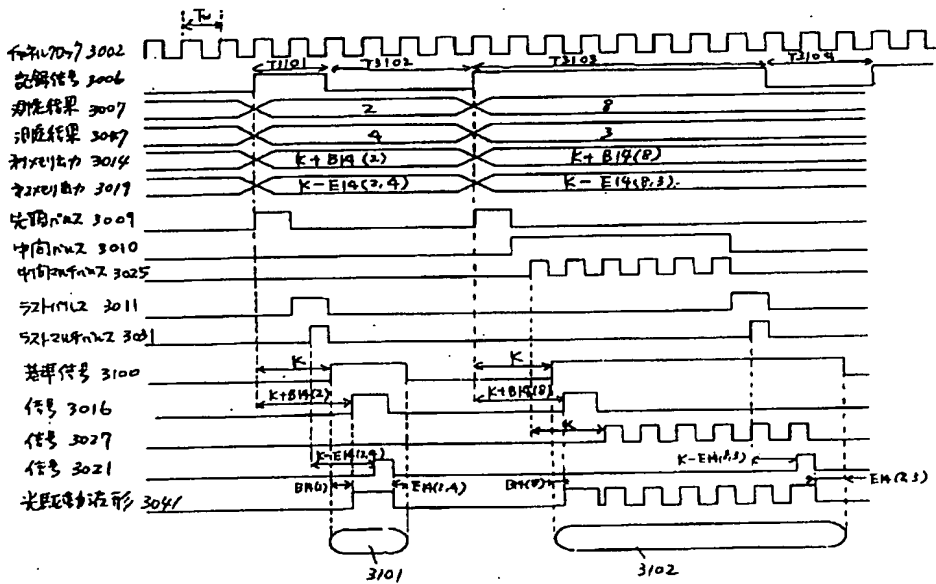
【図 28】



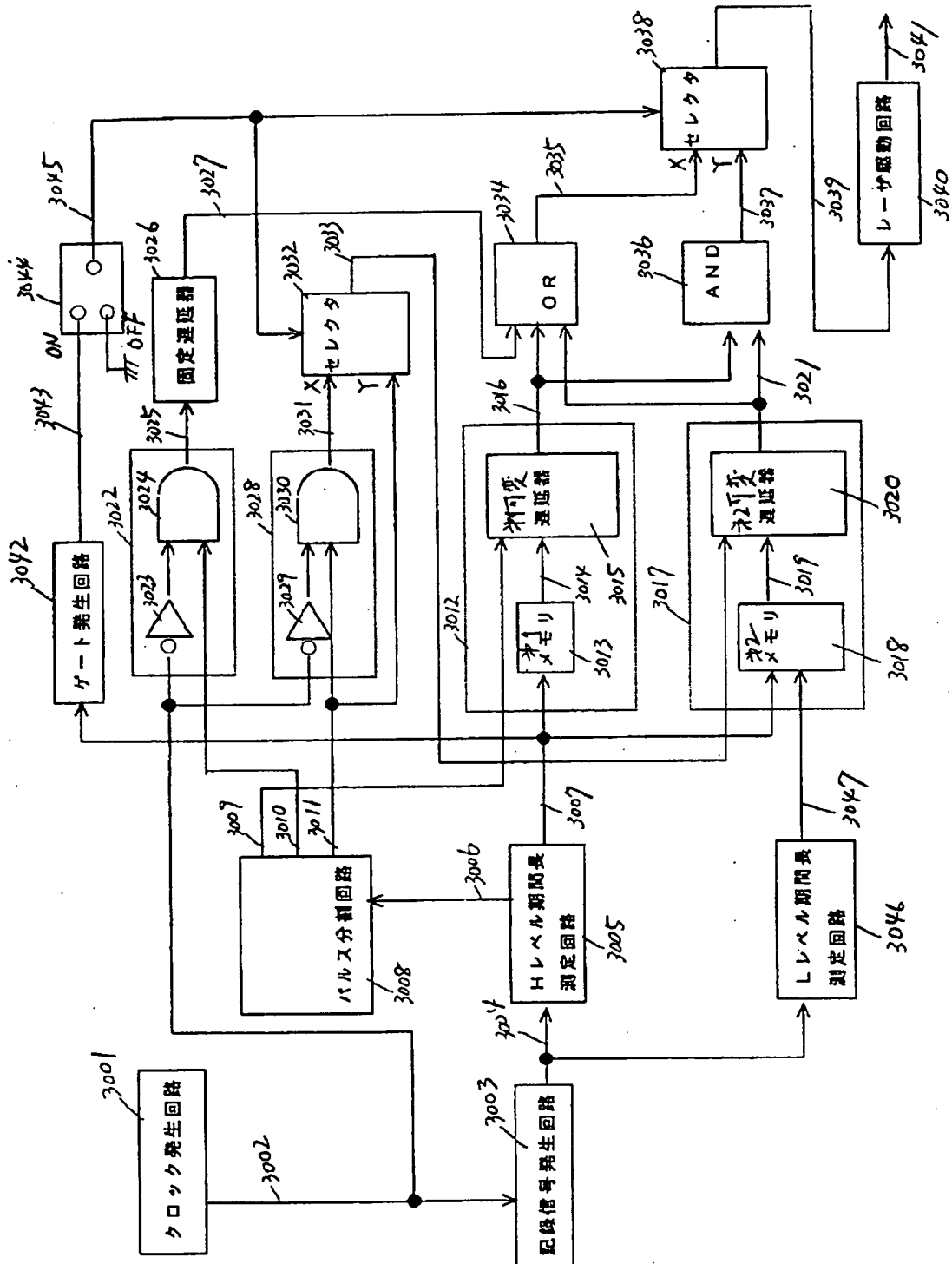
【図 29】



【図 31】

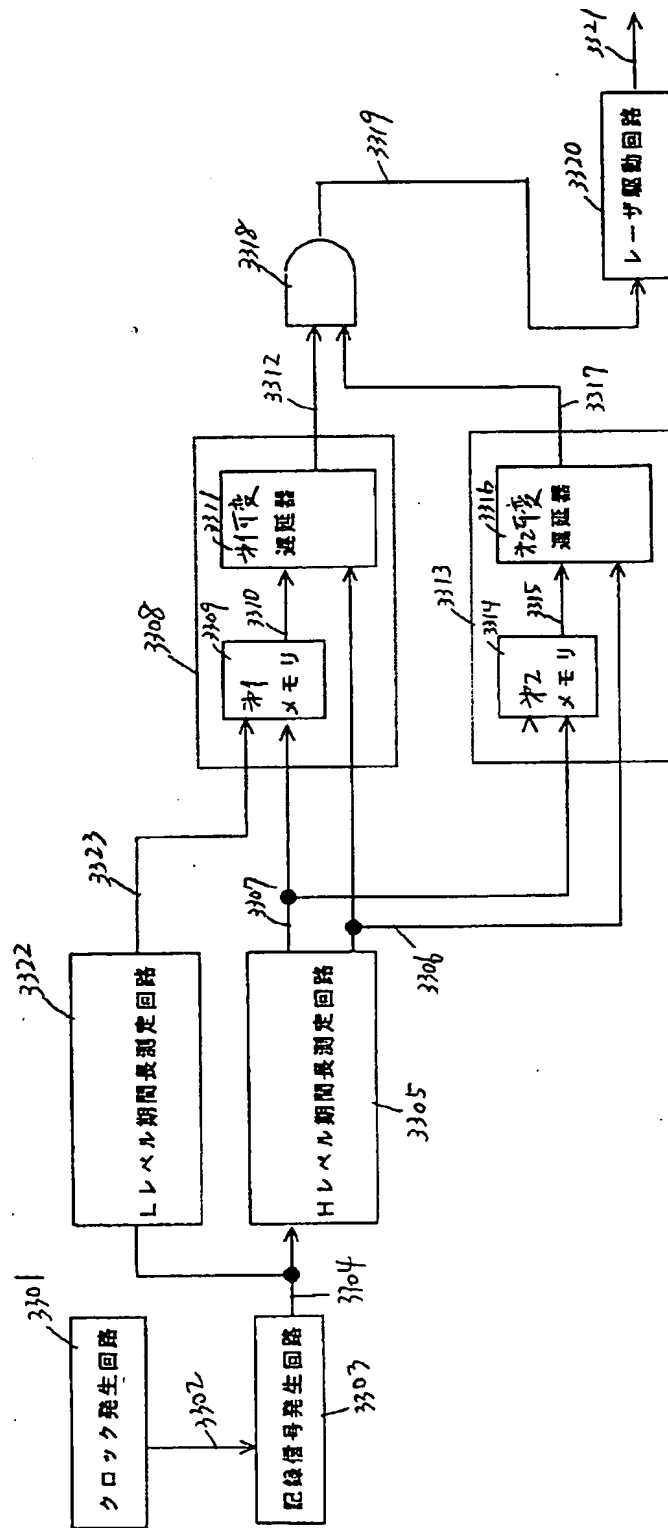


【図 30】

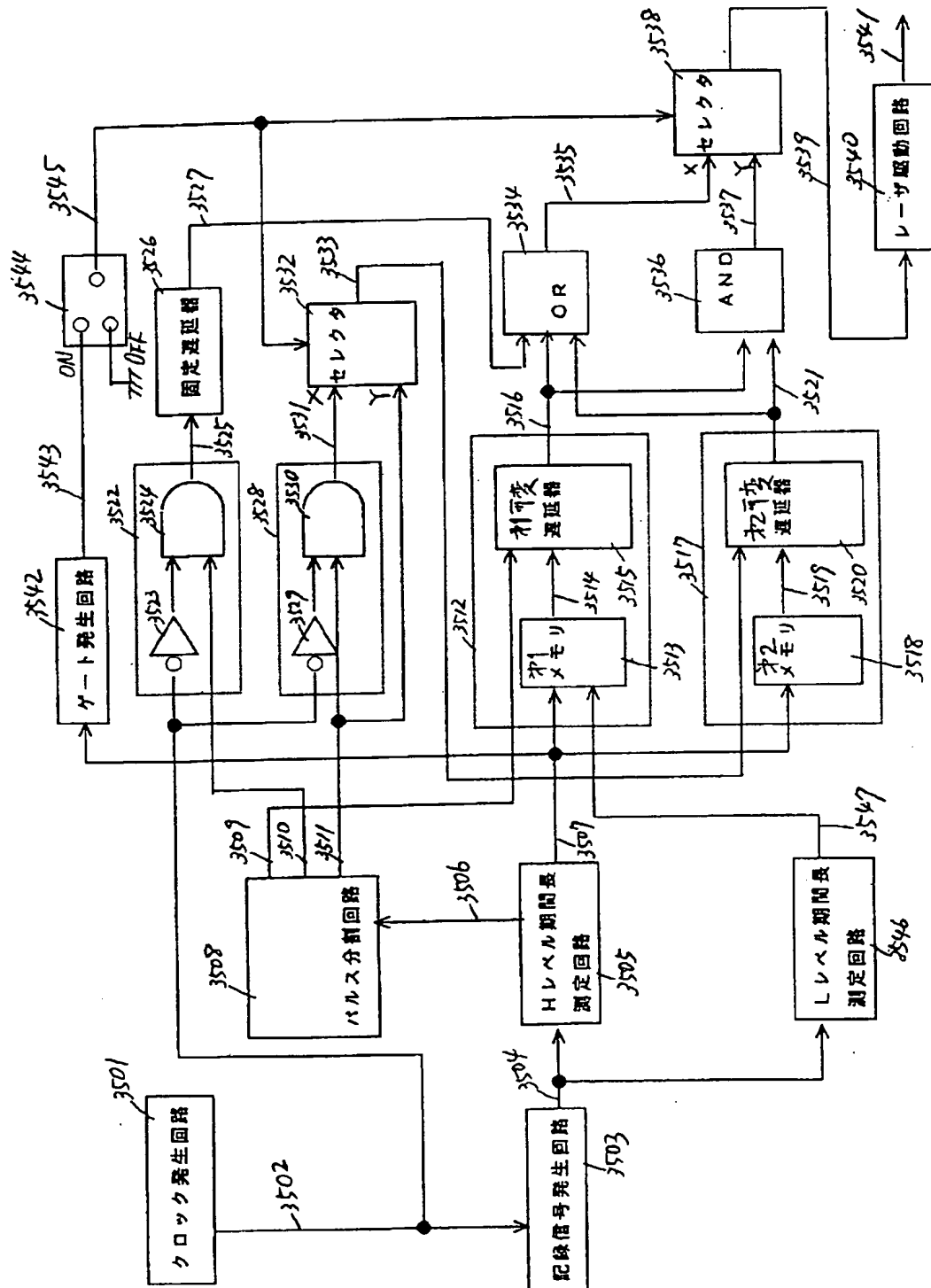


[illegible][illegible]

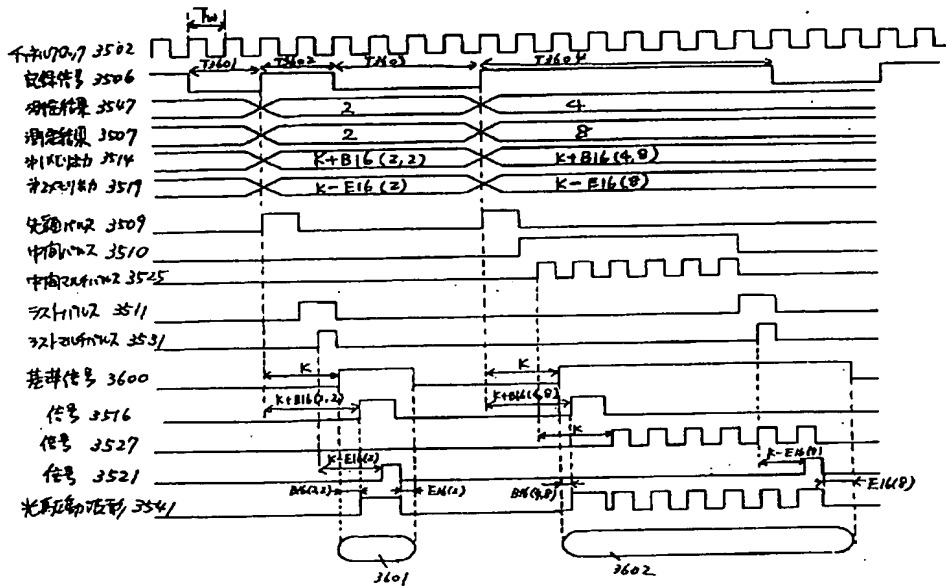
【図 3 3】



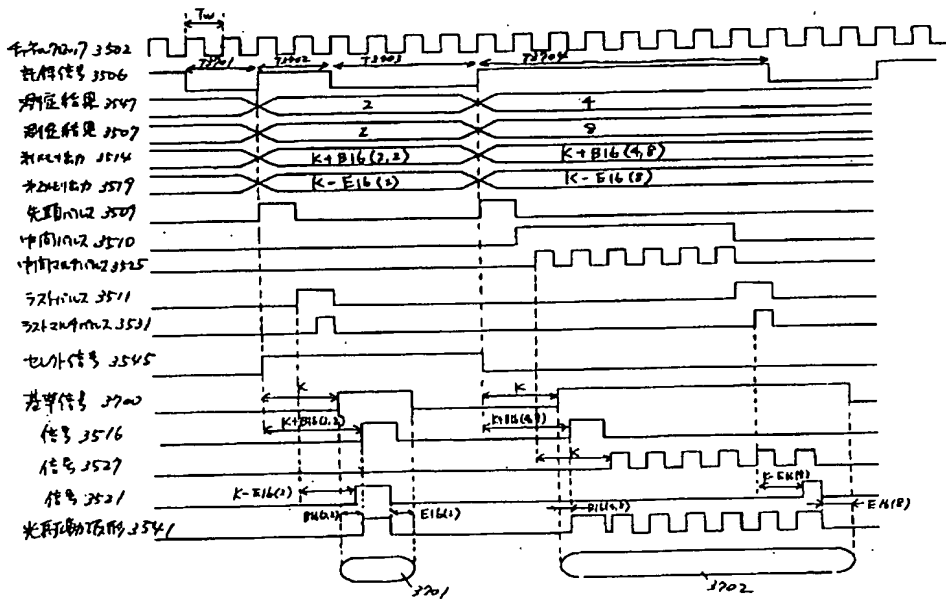
【图 3 5】



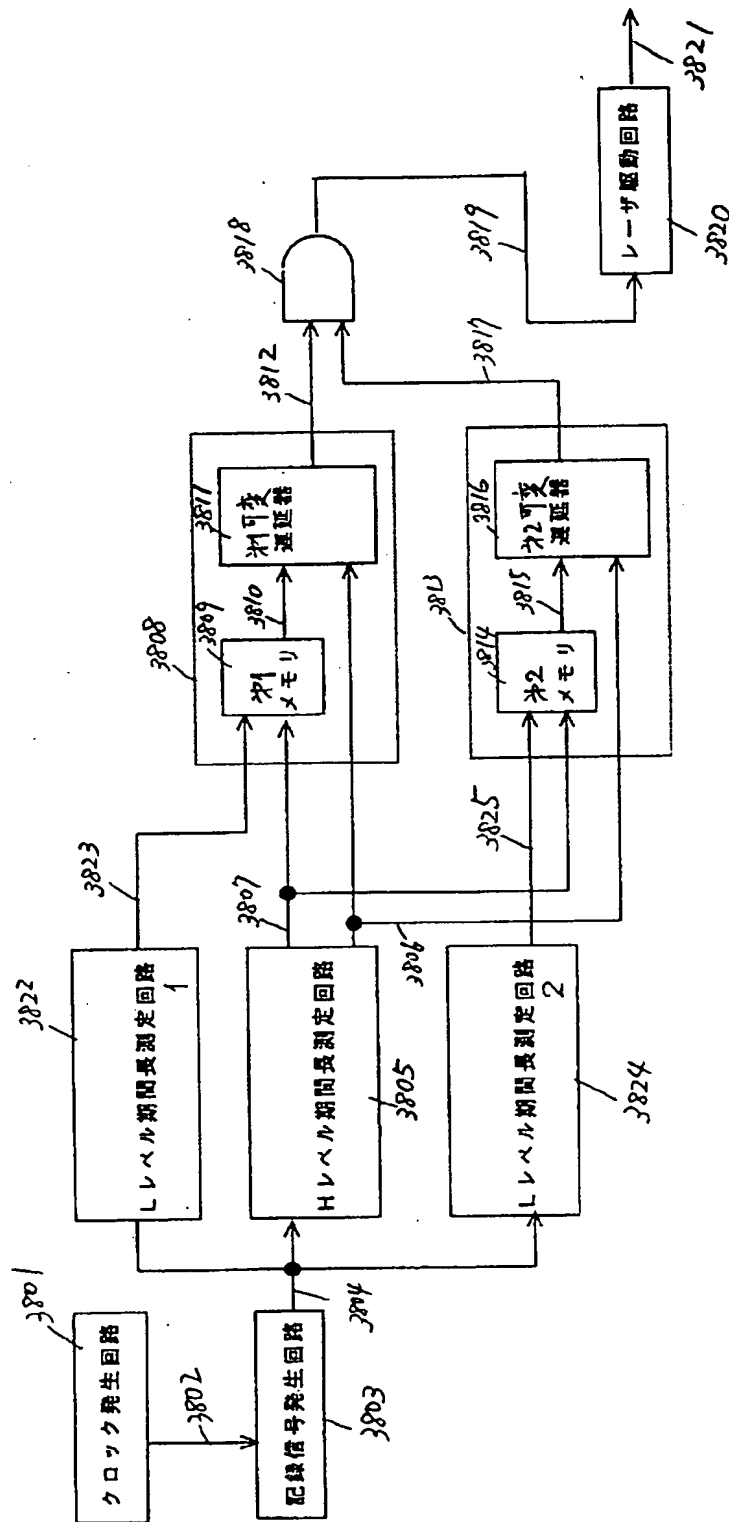
【図 3 6】



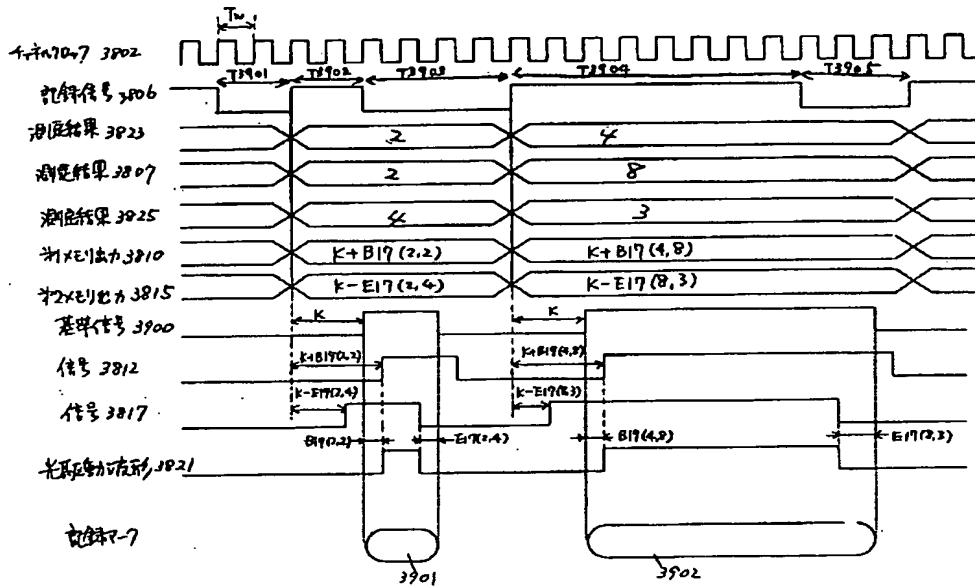
【図 3 7】



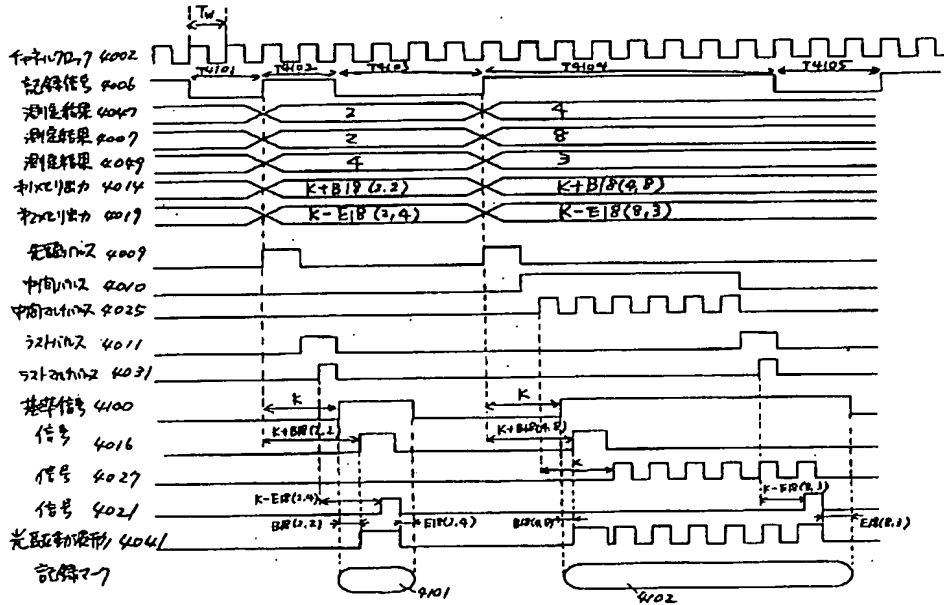
【図 38】



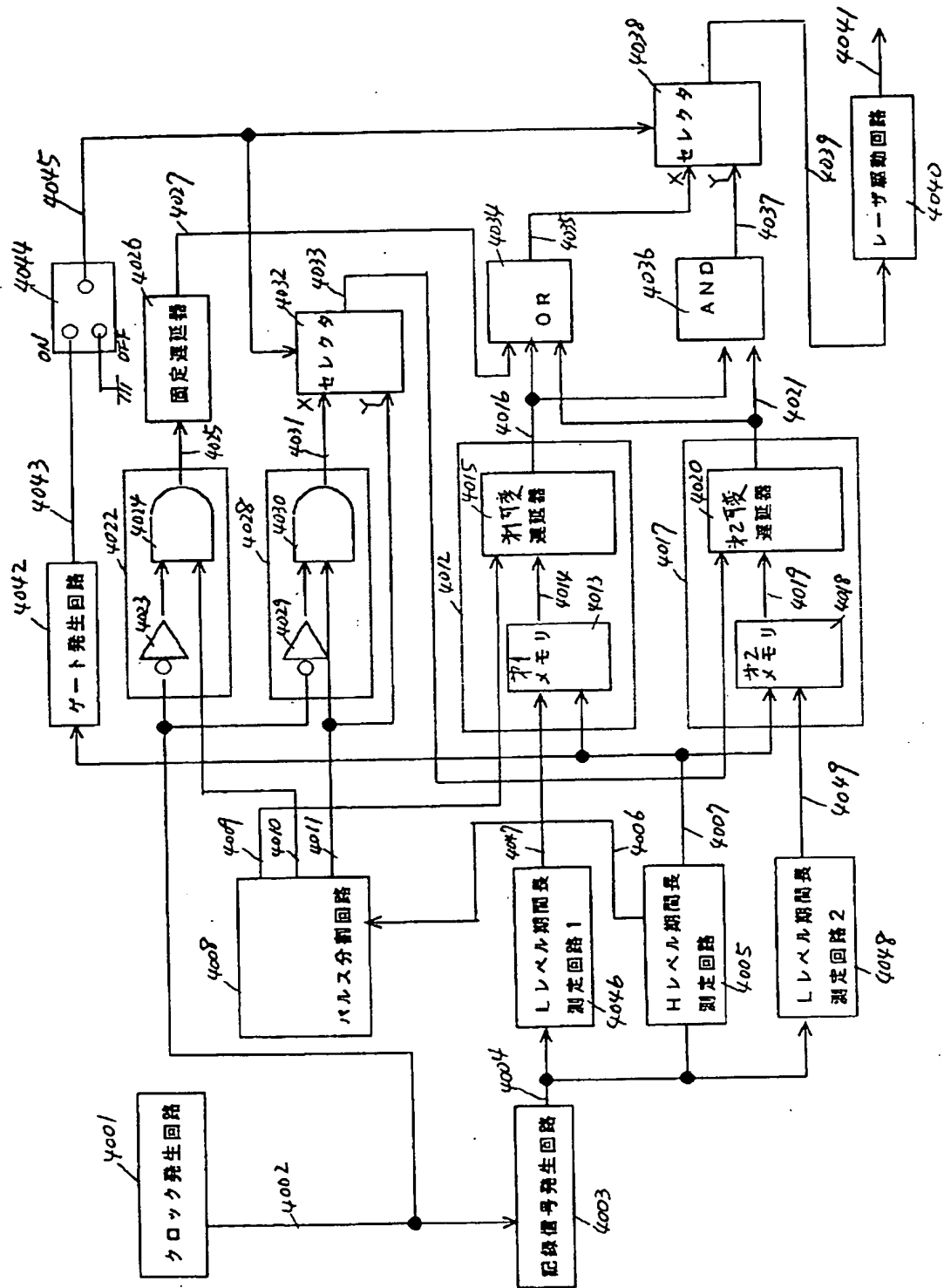
【図 3 9】



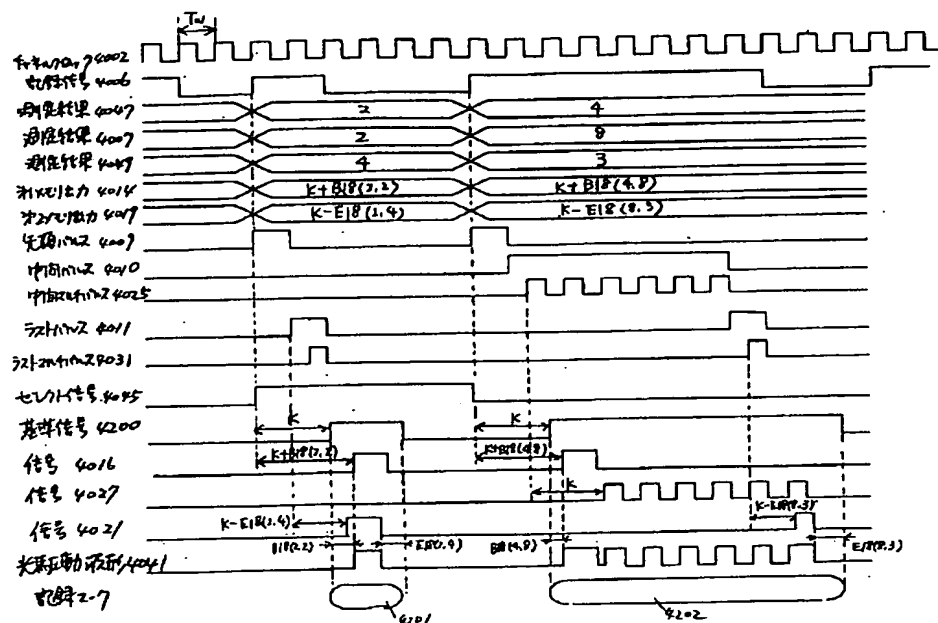
【図 4 1】



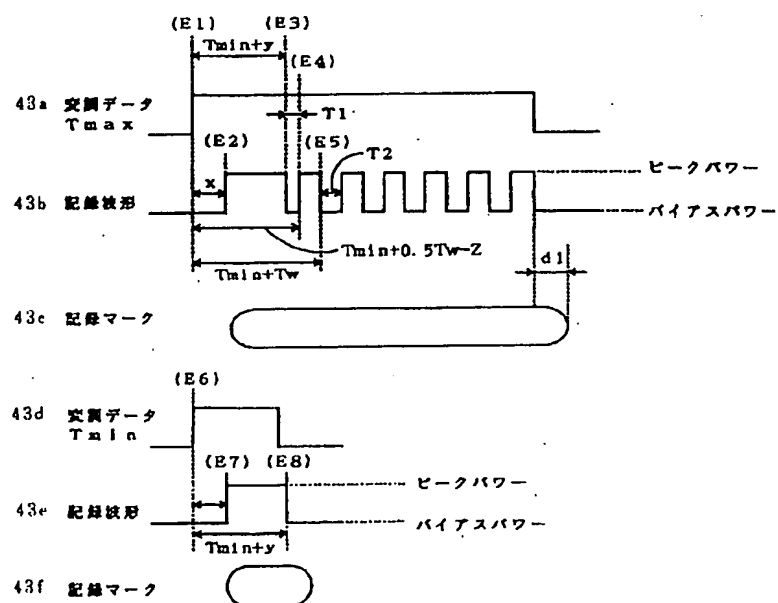
【図 40】



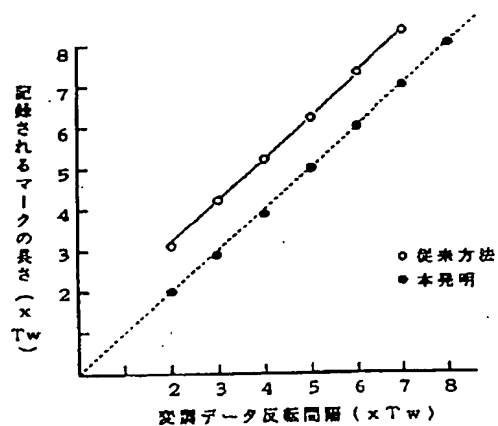
【图 4 2】



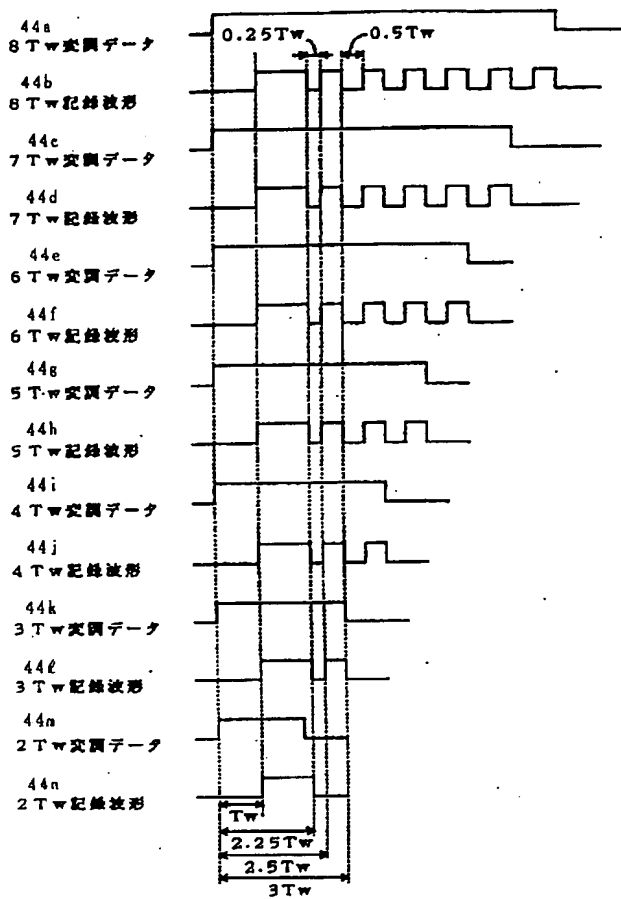
【図 4 3】



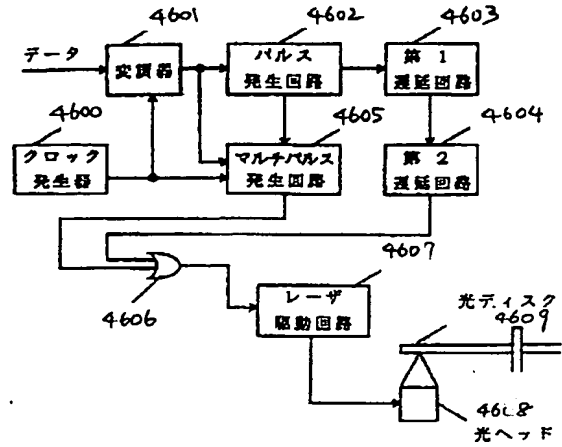
【図 4 5】



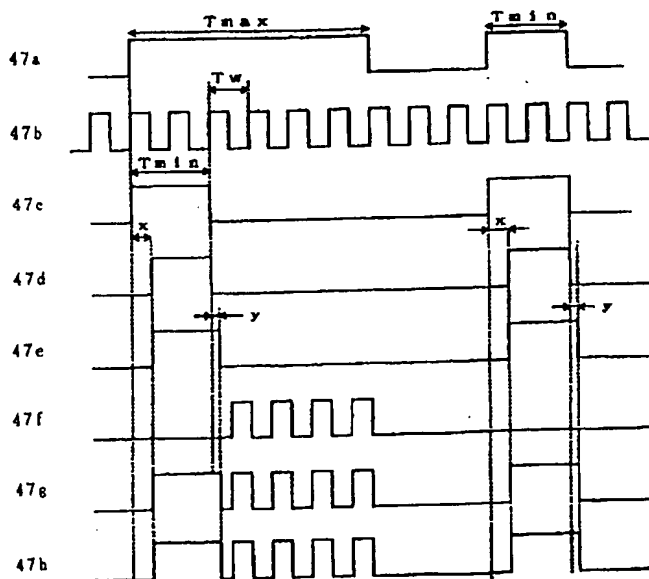
【図 4 4】



【図 4 6】



【図 4 7】



【手続補正書】

【提出日】平成 6 年 3 月 2 9 日

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 0

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項 2 0】変調データの立ち上がりと第 n 番目 (n

は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{\min}) / T_w$) の後続パルスの立ち上がりとの間隔を $\{T_{\min} + n T_w - 0.5 T_w - z \ (0 \leq z < 0.5 T_w)\}$ とし、
前記変調データの立ち上がりと第 n 番目 (n は整数、 $1 \leq n \leq (T - T_{\min}) / T_w$) の後続パルスの立ち下がりとの間隔を $\{T_{\min} + n T_w\}$ と、することを特徴とする請求項 1 9 記載の光学情報の記録方法。